Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

# МАРИСКЕВИЧ ДАНИЛО ТАРАСОВИЧ

УДК 546+548.736.4

# ДИСЕРТАЦІЯ СИСТЕМИ {Zr,Hf}–Al–*M* (*M* = Si, Ge, Sn, Sb): ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК

10 Природничі науки 102 Хімія

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

\_\_\_\_\_ Д. Т. Марискевич

Науковий керівник: Гладишевський Роман Євгенович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор

#### АНОТАЦІЯ

Марискевич Д. Т. Системи {Zr,Hf}–Al–M (M = Si, Ge, Sn, Sb): фазові рівноваги та кристалічна структура сполук. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 "Хімія" галузі знань 10 "Природничі науки". – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2023.

Дисертаційна робота присвячена експериментальному дослідженню хімічної взаємодії компонентів у потрійних системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, встановленню фазових рівноваг та побудові ізотермічних перерізів діаграм стану при 600°С, синтезу та визначенню кристалічної структури сполук, які в них утворюються, і виведенню їхніх кристалохімічних закономірностей.

Дослідженню передував огляд та аналіз літературних відомостей про компоненти вибраних систем, діаграми стану подвійних систем  $\{Zr,Hf\}$ –  $\{Al,Si,Ge,Sn,Sb\}$  i  $Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$  та потрійних систем  $\{Ti,Zr,Hf\}$ –Al- $\{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi\}$ ,  $\{Ti,Zr,Hf\}$ –Ga- $\{Si,Ge,Sn,Sb\}$  i  $\{Nb,Ta\}$ –Al- $\{Si,Ge,Sn,Sb\}$ , a також про кристалічні структури сполук, що в них утворюються. Зроблено відповідні висновки і висунуто припущення про характер взаємодії компонентів у системах {Zr,Hf}–Al-{Si,Ge,Sn,Sb}.

Методом електродугового сплавляння з подальшим гомогенізуючим відпалом при 600°С синтезовано 61 двокомпонентний і 357 трикомпонентних сплавів систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}. Вихідними компонентами слугували компактні прості речовини високої чистоти. Фазовий склад зразків визначено за допомогою рентгенівської дифракції і спектроскопії. Масиви рентгенівських дифракційних даних отримано на порошкових дифрактометрах ДРОН-2.0М (проміння Fe Ka) та STOE Stadi P (проміння Cu Ka<sub>1</sub>), а локальний рентгеноспектральний аналіз проведено на растровому електронному мікроскопі РЕММА-102-02, оснащеному енергодисперсійним рентгенівським спектрометром ЕДАР, та на скануючому електронному мікроскопі Tescan Vega 3 LMU, оснащеному двома детекторами (вторинних електронів і зворотно розсіяних електронів) та енергодисперсійним рентгенівським аналізатором Oxford Instruments Aztec ONE з детектором X-Max<sup>N</sup>20. На основі результатів фазового аналізу, методом триангуляції побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°C. Кристалічну структуру тернарних фаз визначено рентгенівськими дифракційними методами порошку (дифрактометри ДРОН-2.0M і STOE Stadi P) і монокристалу (дифрактометр Rigaku AFC7, детектор Mercury CCD, проміння Мо  $K\alpha$ ).

За результатами експериментальних досліджень встановлено фазові рівноваги та вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С у повних концентраційних інтервалах. Підтверджено існування при 600°С 56 бінарних сполук, встановлено існування 29 тернарних сполук, 22 з яких – відкрито вперше. Для всіх синтезованих тернарних сполук визначено параметри кристалічних структур.

У системах {Zr,Hf}–Al–Si (600°С) встановлено утворення твердих розчинів заміщення різної протяжності на основі бінарних силіцидів. Розчинність алюмінію (в ат.%) становить у: Zr<sub>2</sub>Si – 9, Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> – 15, Zr<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> – 7,5, Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> – 6, ZrSi – 9,5, ZrSi<sub>2</sub> – 12, Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> – 13,5, Hf<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> – 7, Hf<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> – 5,5, HfSi – 2,5 i HfSi<sub>2</sub> – 8. Між ізоструктурними бінарними сполуками Hf<sub>2</sub>Al i Hf<sub>2</sub>Si (структурний тип CuAl<sub>2</sub>, символ Пірсона *tl*12, просторова група *I*4/*mcm*) утворюється неперервний ряд твердих розчинів Hf<sub>2</sub>Al<sub>1-0</sub>Si<sub>0-1</sub> (a = 6,775(3)-6,553(2), c = 5,3969(2)-5,186(2) Å). Інші бінарні сполуки не розчиняють третій компонент. У системах {Zr,Hf}–Al–Si встановлено існування п'яти тернарних алюмосиліцидів постійних складів: ZrAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub> (TiAl<sub>3</sub>, *tl*8, *I*4/*mmm*, a = 3,91422(15), c = 8,9753(3) Å), ZrAl<sub>0,33</sub>Si<sub>1,67</sub> (ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, *tl*32, *I*4<sub>1</sub>/*amd*, a = 3,7095(2), c = 29,345(3) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,44</sub>Si<sub>0,56</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tl*32, *I*4/*mcm*, a = 11,0454(4), c = 5,3942(2) Å), HfAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub> (TiAl<sub>3</sub>, *tI*8, *I*4/*mmm*, a = 3,89413(14), c = 8,9386(3) Å) та Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,56</sub>Si<sub>0,44</sub> (Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, *hP*16, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, a = 8,0321(3), c = 5,6247(2) Å).

У системах {Zr,Hf}–Al–Ge (600°C) встановлено утворення твердих розчинів заміщення на основі бінарних германідів  $ZrGe_2$ ,  $Zr_5Ge_3$ ,  $HfGe_2$ ,  $Hf_3Ge_2$  та  $Hf_5Ge_3$ , які

розчиняють 4, 10, 9, 2,5 та 5 ат.% Al, відповідно. Між ізоструктурними бінарними сполуками Hf<sub>2</sub>Al i Hf<sub>2</sub>Ge (CuAl<sub>2</sub>, tI12, I4/mcm) утворюється неперервний ряд твердих розчинів Hf<sub>2</sub>Al<sub>1-0</sub>Ge<sub>0-1</sub> (a = 6,775(3)-6,596(2), c = 5,3969(2)-5,291(2) Å). Інші бінарні сполуки не розчиняють третій компонент. {Zr,Hf}–Al–Ge У встановлено існування дев'яти системах тернарних складів: алюмогерманідів постійних ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub> (TiAl<sub>3</sub>, *tI*8, I4/mmm, a = 3,92395(11), c = 9,0476(4) Å), ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> (ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, tI32, I4<sub>1</sub>/amd, a = 3,8013(2), c = 29,893(3) Å),  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  ( $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}, t/84, 14/mmm$ , a = 10,3679(7), c = 14,8529(11) Å), Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, hP18, P6<sub>3</sub>/mcm, a = 8,104(3), c = 5,654(2) Å),  $Zr_5Al_{2,70}Ge_{0.30}$  (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I*4/*mcm*, a = 11,0145(7), c = 5,3921(4) Å), HfAl<sub>2.40</sub>Ge<sub>0.60</sub> (TiAl<sub>3</sub>, *tI*8, *I*4/*mmm*, a = 3,9021(2), c = 8,9549(8) Å),  $Hf_{11}Al_{3,50}Ge_{6,50}$  (Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>63,66</sub>, *tI*84, *I*4/*mmm*, a = 10,1764(8), c = 14,1729(13) Å), Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, *hP*18, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, a = 8,0641(3), c = 5,5874(2) Å) ta Hf<sub>5</sub>Al<sub>2 56</sub>Si<sub>0.44</sub>  $(Mn_5Si_3, hP16, P6_3/mcm, a = 8,0880(3), c = 5,6511(2) Å).$ 

У системах {Zr,Hf}–Al–Sn (600°С) встановлено утворення твердих розчинів заміщення на основі бінарних станідів Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> та Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> – 11,1 та 2,5 ат.% Al, відповідно, і твердий розчин включення на основі Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> протяжністю до 11,1 ат.% Al. Інші бінарні сполуки не розчиняють третій компонент. У системах {Zr,Hf}–Al–Sn встановлено існування при 600°С шести тернарних алюмостанідів постійного та змінного складів: ZrAl<sub>2,68</sub>Sn<sub>0,32</sub> (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*, *a* = 3,98855(18), c = 9,0848(4) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,71</sub>Sn<sub>0,29</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 11,0530(9), c = 5,4071(5) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>Sn<sub>1,32-2,60</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 11,1005(9)-11,1829(12), c = 5,4537(5)-5,5449(6) Å), HfAl<sub>2,64</sub>Sn<sub>0,36</sub> (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*, *a* = 3,95450(2), c = 8,94451(12) Å), Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Sn<sub>0,30</sub> (Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, *hP*16, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 8,0910(4), c = 5,6515(4) Å) та Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,33-0,78</sub>Sn<sub>1,67-2,22</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 10,9627(8)-11,0291(9), c = 5,4138(4)-5,4913(5) Å).

У системах {Zr,Hf}–Al–Sb (600°С) встановлено утворення твердих розчинів заміщення різної протяжності на основі бінарних антимонідів  $Zr_5Sb_4$ ,  $Zr_5Sb_3$  та Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> протяжністю 11,1, 2,5 та 3 ат.% Al, відповідно. Інші бінарні сполуки не розчиняють третій компонент. У системах {Zr,Hf}–Al–Sb встановлено існування

при 600°С дев'яти тернарних алюмоантимонідів постійного та змінного складів: ZrAl<sub>2,65</sub>Sb<sub>0,35</sub> (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*, *a* = 3,9142(2), *c* = 8,9753(4) Å), Zr<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> (Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>, *tP*6, *P*-4*m*2, *a* = 3,9826(2), *c* = 8,7144(5) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,55</sub>Sb<sub>0,45</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 11,0120(9), *c* = 5,3913(5) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,55-0,65</sub>Sb<sub>1,45-2,35</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 10,9810(9)-11,0731(12), *c* = 5,4153(5)-5,4482(6) Å), HfAl<sub>2,67</sub>Sb<sub>0,33</sub> (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*, *a* = 3,94191(9), *c* = 8,9078(2) Å), Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> (Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>, *tP*6, *P*-4*m*2, *a* = 3,9021(2), *c* = 8,6510(5) Å), Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> (Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, *hP*18, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 8,0934(5), *c* = 5,6560(5) Å) Ta Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,52-0,74</sub>Sb<sub>1,48-2,26</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 10,8908(8)-10,9344(9), *c* = 5,5114(4)-5,5403(5) Å).

На основі результатів експериментальних досліджень встановлено особливості взаємодії компонентів у системах {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}, здійснено порівняльний аналіз систем між собою та зі спорідненими потрійними системами та встановлено кристалохімічні закономірності тернарних сполук. Спостерігається спорідненість систем з тим самим d-елементом (Zr чи Hf), а також попарна спорідненість систем з Zr та Hf і однакового *p*-елемента 14 (Si, Ge, Sn) чи 15 (Sb) групи періодичної системи. Найменшою кількістю тернарних сполук (2) характеризується система Hf-Al-Si, а найбільшою (по 5) - системи Zr-Al-Ge i Hf–Al–Sb. При переході від систем з Si до систем з Ge спостерігається ускладнення характеру взаємодії компонентів, що проявляється у збільшенні загальної кількості тернарних сполук від 5 у системах {Zr,Hf}-Al-Si до 9 у системах {Zr,Hf}-Al-Ge. При переході до систем зі Sn кількість тернарних сполук зменшується до 6, а заміна Sn на Sb приводить до збільшення кількості тернарних інтерметалідів до 9. Кристалічні структури тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} належать до семи структурних типів; для більшості з них простежується тенденція до впорядкування атомів різних хімічних елементів.

Структурні типи, що реалізуються у системах  $\{Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$  на ізоконцентратах 25 ат.% Zr і Hf при 600°C, належать до кубічних найщільніших упаковок атомів, які є впорядкованими похідними структурного типу Cu (*cF*4, *Fm*-3*m*) і побудовані з щільноупакованих шарів атомів виключно у кубічній

укладці – ZrAl<sub>3</sub> (t/16, 14/mmm), TiAl<sub>3</sub> (t/8, 14/mmm) і UCuAl<sub>2</sub> (t/8, 14/mmm). Розрахована компактність структур (співвідношення V<sub>атомів</sub>/V<sub>комірки</sub>) для бінарних і тернарних сполук є більшою, ніж компактність структури Al. Найбільше значення компактності (79,5 %) має тернарна сполука ZrAl<sub>2.65</sub>Sb<sub>0.35</sub>. Новий структурний тип  $ZrAl_{0.23}Ge_{1.77}$  (*tI32*, *I4*<sub>1</sub>/*amd*) характеризується частковим впорядкуванням атомів Al і Ge, а також позиційним невпорядкуванням атомів Ge, яке було змодельовано розщепленням однієї кристалографічної позиції. Він належить до серії лінійних неоднорідних структур, побудованих зрощенням фрагментів структурних типів AlB<sub>2</sub> та CaF<sub>2</sub>. Новий структурний тип  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  (*t*/84, *I*4/*mmm*) є тетрарним варіантом структурного типу  $Ho_{11}Ge_{10}$ , i характеризується частковим впорядкуванням атомів Al і Ge. Структура побудована укладкою тригональних призм і тетрагональних антипризм, центрованими атомами *р*-елементів. Кристалічні структури фаз з великим вмістом Zr чи Hf побудовані з колон многогранників: октаедрів у структурах  $Hf_5(Al_{1-x}M_x)_3$  (M = Si, Ge, Sn, Sb; структурний тип Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, hP16,  $P6_3/mcm$ ) i  $T_5AlM_3$  (T = Zr, Hf; M = Ge, Sn, Sb; структурний тип Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> hP18, P6<sub>3</sub>/mcm) та тетрагональних антипризм i тетраедрів у структурах  $Zr_5(Al_{1-x}M_x)_3$  (M = Si, Ge, Sn, Sb) і Hf<sub>5</sub>(Al\_{1-x}M\_x)\_3 (M = Sn, Sb) (структурний тип Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I*4/*mcm*). Збільшення вмісту Zr чи Hf у сполуках вмісту *р*-елементів) змінює координаційне (зменшення оточення атомів *р*-елементів: від кубооктаедричного (25 ат.% Zr(Hf)) тригонально-ДО призматичного і тетраедричного (33,3 ат.% Zr(Hf)), тригонально-призматичного і тетрагонально-антипризматичного (52,4 ат.% Zr(Hf)), тригонально-призматичного і октаедричного (55,5 ат.% Zr(Hf)) і тетрагонально-антипризматичного та ікосаедричного (62,5 ат.% Zr(Hf)). Залежно від співвідношення компонентів у Zr,Hf-Al-Si,Ge,Sn,Sbсистемах можна цілеспрямовано змінювати координаційне оточення атомів і вимірність будови структури від тривимірної (кубічні найщільніші упаковки) до одновимірної (структури з колонами многогранників). Керування анізотропією структури має вплив на оптимізацію фізичних властивостей.

6

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше визначено фазові рівноваги та побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С у повних концентраційних інтервалах; встановлено області гомогенності тернарних сполук і межі твердих розчинів на основі бінарних сполук; знайдено два неперервні ряди твердих розчинів між бінарними сполуками, 21 обмежений твердий розчин заміщення і один твердий розчин включення на основі бінарних інтерметалідів. Встановлено існування при 600°С 29 тернарних сполук (5 силіцидів, 9 германідів, 6 станідів і 9 антимонідів), 22 з яких – нові. Для всіх тернарних сполук визначено параметри кристалічних структур; рентгенівськими дифракційними методами монокристалу та порошку розшифровано два нові структурні типи –  $ZrAl_{0.23}Ge_{1.77}$  і  $Zr_{11}Al_{3.34}Ge_{6.66}$ . На основі результатів експериментальних досліджень встановлено особливості взаємодії компонентів у потрійних системах {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}, здійснено їхній порівняльний аналіз між собою та із спорідненими; виведено кристалохімічні закономірності тернарних сполук; встановлено взаємозв'язок між хімічним складом і кристалічною структурою тернарних фаз у досліджених системах.

*Ключові слова:* цирконій, гафній, алюміній, силіцій, ґерманій, олово, стибій, рентгенівська дифракція, рентгенівська спектроскопія, фазові рівноваги, діаграма стану, твердий розчин, інтерметалічна сполука, кристалічна структура, координаційний поліедр.

#### **SUMMARY**

*Maryskevych D. T.* Systems  $\{Zr,Hf\}$ -Al-*M* (*M* = Si, Ge, Sn, Sb): phase equilibria and crystal structures of the compounds. – Qualifying scientific work on manuscript rights.

Thesis for the scientific degree of Doctor of Philosophy in the specialty 102 Chemistry of the field of knowledge 10 Natural Sciences. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2023.

The dissertation is devoted to an experimental investigation of the chemical interaction of the components in the ternary systems {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, establishment of the phase equilibria and construction of the isothermal sections at 600°C of the phase diagrams, synthesis and determination of the crystal structures of the compounds that form in these systems. Based on the observations, crystal-chemical regularities are derived.

Before undertaking the experimental work, literature data on related chemical systems, phase diagrams of the binary systems  $\{Zr,Hf\}-\{Al,Si,Ge,Sn,Sb\}$  and Al- $\{Si,Ge,Sn,Sb\}$ , and the ternary systems  $\{Ti, Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi\}$ ,  $\{Ti,Zr,Hf\}-Ga-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$ , and  $\{Nb,Ta\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$ , as well as on the crystal structures of compounds forming in these systems, were reviewed and analyzed. Conclusions were drawn, and assumptions about the interaction of the components in the  $\{Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$  systems were made.

61 two-component and 357 three-component alloys of the systems {Zr,Hf}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb} were synthesized by arc melting, followed by homogenizing annealing at 600°C. Compact elemental substances of high purity served as starting components. The phase compositions of the samples were determined using X-ray diffraction and spectroscopy. X-ray diffraction patterns were obtained on powder diffractometers DRON-2.0M (radiation Fe  $K\alpha$ ) and STOE Stadi P (radiation Cu  $K\alpha_1$ ), and local X-ray spectral analysis was performed on a raster electron microscope REMMA-102-02 equipped with an energy-dispersive X-ray spectrometer EDAR, and on a scanning electron microscope Tescan Vega 3 LMU equipped with two detectors (secondary electrons and back-scattered electrons), and an energy-dispersive X-ray analyzer Oxford Instruments Aztec ONE with the detector X-Max<sup>N</sup>20. Based on the results of the phase analysis, the isothermal sections of the phase diagrams of the ternary systems  $\{Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$  at 600°C were constructed by the triangulation method. The crystal structures of the ternary phases were determined by X-ray powder (diffractometers DRON-2.0M and STOE Stadi P) and single-crystal (diffractometer Rigaku AFC7, detector Mercury CCD, radiation Mo  $K\alpha$ ) diffraction.

Based on the experimental investigations, the phase equilibria were established, and the isothermal sections of the phase diagrams of the ternary systems {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} at 600°C were constructed in the whole concentration region, for the first time. The existence of 56 binary compounds at 600°C was confirmed, and 29 ternary compounds were observed, 22 of which were discovered for the first time. Crystallographic parameters were determined for all of the ternary compounds.

In the systems {Zr,Hf}–Al–Si (600°C) the formation of solid solutions of the substitution type based on the binary silicides was established, with the following extensions (at.% Al):  $Zr_2Si = 9$ ,  $Zr_5Si_3 = 15$ ,  $Zr_3Si_2 = 7.5$ ,  $Zr_5Si_4 = 6$ , ZrSi = 9.5,  $ZrSi_2 = 12$ ,  $Hf_5Si_3 = 13.5$ ,  $Hf_3Si_2 = 7$ ,  $Hf_5Si_4 = 5.5$ , HfSi = 2.5, and  $HfSi_2 = 8$ . A continuous solid solution  $Hf_2Al_{1-0}Si_{0-1}$  (a = 6.775(3)-6.553(2), c = 5.3969(2)-5.186(2) Å) forms between the isostructural binary compounds  $Hf_2Al$  and  $Hf_2Si$  (structure type CuAl<sub>2</sub>, Pearson symbol tI12, space group I4/mcm). The other binary compounds do not dissolve significant amounts of the third component. The existence of five ternary alumosilicides with approximately constant compositions was established in the systems { $Zr,Hf}-Al-Si$ :  $ZrAl_{2.55}Si_{0.45}$  (TiAl<sub>3</sub>, tI8, I4/mmm, a = 3.91422(15), c = 8.9753(3) Å),  $ZrAl_{0.33}Si_{1.67}$  ( $ZrAl_{0.23}Ge_{1.77}$ , tI32,  $I4_1/amd$ , a = 3.7095(2), c = 29.345(3) Å),  $Zr_5Al_{2.44}Si_{0.56}$  (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, tI32, I4/mcm, a = 11.0454(4), c = 5.3942(2) Å), HfAl<sub>2.55</sub>Si<sub>0.45</sub> (TiAl<sub>3</sub>, tI8, I4/mmm, a = 3.89413(14), c = 8.9386(3) Å), and Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.56</sub>Si<sub>0.44</sub> (Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, hP16,  $P6_3/mcm$ , a = 8.0321(3), c = 5.6247(2) Å).

In the systems {Zr,Hf}–Al–Ge (600°C) the formation of solid solutions of the substitution type based on the binary germanides  $ZrGe_2$ ,  $Zr_5Ge_3$ , HfGe<sub>2</sub>, Hf<sub>3</sub>Ge<sub>2</sub>, and

Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub>, which dissolve 4, 10, 9, 2.5, and 5 at.% Al, respectively, was established and a continuous solid solution Hf<sub>2</sub>Al<sub>1-0</sub>Ge<sub>0-1</sub> (6.775(3)-6.596(2), c = 5.3969(2)-5.291(2) Å) was observed between the isostructural binary compounds Hf<sub>2</sub>Al and Hf<sub>2</sub>Ge (CuAl<sub>2</sub>, *tI*12, 4/*mcm*). The other binary compounds do not dissolve the third component. The existence of nine ternary alumogermanides with point compositions was established in the systems {Zr,Hf}-Al-Ge: ZrAl<sub>2.52</sub>Ge<sub>0.48</sub> (TiAl<sub>3</sub>, *tI*8, *I*4/*mmm*, *a* = 3.92395(11), *c* = 9.0476(4) Å), ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub> (ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub>, *tI*32, *I*4<sub>1</sub>/*amd*, *a* = 3.8013(2), *c* = 29.893(3) Å), Zr<sub>11</sub>Al<sub>3.34</sub>Ge<sub>6.66</sub> (Zr<sub>11</sub>Al<sub>3.34</sub>Ge<sub>6.66</sub>, *tI*84, *I*4/*mmm*, *a* = 10.3679(7), *c* = 14.8529(11) Å), Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, *hP*18, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 8.104(3), *c* = 5.654(2) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.70</sub>Ge<sub>0.30</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I*4/*mcm*, *a* = 11.0145(7), *c* = 5.3921(4) Å), HfAl<sub>2.40</sub>Ge<sub>0.60</sub> (TiAl<sub>3</sub>, *tI*8, *I*4/*mmm*, *a* = 10.1764(8), *c* = 14.1729(13) Å), Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, *hP*18, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 8.0641(3), *c* = 5.6511(2) Å).

In the systems {Zr,Hf}-Al-Sn (600°C) the formation of solid solutions of the substitution type based on the binary stannides  $Zr_5Sn_4$  and  $Zr_5Sn_3 - 11.1$  and 2.5 at.% Al, respectively, and a solid solution of the inclusion type based on Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> ( up to 11.1 at.% Al) was established. Six ternary alumogermanides with constant or variable compositions were observed at 600°C:  $ZrAl_{2.68}Sn_{0.32}$  (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*, *a* = 3.98855(18), c = 9.0848(4) Å),  $Zr_5Al_{2.71}Sn_{0.29}$  (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 11.0530(9), c = 5.4071(5) Å),  $Zr_5Al_{1.68-0.40}Sn_{1.32-2.60}$  (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 11.1005(9)-11.1829(12), c = 5.4537(5)-5.5449(6) Å), HfAl<sub>2.64</sub>Sn<sub>0.36</sub> (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*, *a* = 3.95450(2), c = 8.94451(12) Å), Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.70</sub>Sn<sub>0.30</sub> (Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, *hP*16, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 10.9627(8)-11.0291(9), c = 5.4138(4)-5.4913(5) Å).

In the systems {Zr,Hf}–Al–Sb (600°C) solid solutions of the substitution type based on the binary antimonides  $Zr_5Sb_4$ ,  $Zr_5Sb_3$ , and  $Hf_5Sb_3$ , which dissolve 11.1, 2.5, and 3 at.% Al, respectively, were defined. The other binary compounds do not dissolve the third component. The existence of nine ternary alumoantimonides with constant or variable compositions was established at 600°C:  $ZrAl_{2.65}Sb_{0.35}$  (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*,

a = 3.9142(2), c = 8.9753(4) Å), Zr<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> (Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>, *tP*6, *P*-4*m*2, *a* = 3.9826(2), c = 8.7144(5) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.55</sub>Sb<sub>0.45</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 11.0120(9), c = 5.3913(5) Å), Zr<sub>5</sub>Al<sub>1.55-0.65</sub>Sb<sub>1.45-2.35</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 10.9810(9)-11.0731(12), c = 5.4153(5)-5.4482(6) Å), HfAl<sub>2.67</sub>Sb<sub>0.33</sub> (UCuAl<sub>2</sub>, *tI*8, *I4/mmm*, a = 3.94191(9), c = 8.9078(2) Å), Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> (Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>, *tP*6, *P*-4*m*2, *a* = 3.9021(2), c = 8.6510(5) Å), Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> (Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, *hP*18, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 8.3572(3), c = 5.6914(2) Å), Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.49</sub>Sb<sub>0.51</sub> (Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, *hP*16, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 8.0934(5), *c* = 5.6560(5) Å), and Hf<sub>5</sub>Al<sub>1.52-0.74</sub>Sb<sub>1.48-2.26</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tI*32, *I4/mcm*, *a* = 10.8908(8)-10.9344(9), *c* = 5.5114(4)-5.5403(5) Å).

Based on the experimental investigations, peculiarities of the interaction of the components in the systems {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} were pointed out. A comparative analysis of these and related ternary systems was carried out, and crystal-chemical regularities of the ternary compounds were deduced. Similarities were observed for systems with the same *d*-element (Zr or Hf), as well as between systems with Zr or Hf and the same *p*-element of group 14 (Si, Ge, Sn) or 15 (Sb) of the periodic system. The smallest number of ternary compounds (2) was found in the system Hf-Al-Si, and the largest number of ternary compounds (5 in each system) in the systems Zr-Al-Ge and Hf-Al-Sb. When moving from the systems with Si to the systems with Ge, the character of the interaction of the components becomes more complex, which is reflected in an increase of the total number of ternary compounds from 5 in the systems {Zr,Hf}-Al-Si to 9 in the systems {Zr,Hf}-Al-Ge. When moving to the systems with Sn, the number of ternary compounds decreases to 6, but the replacement of Sn by Sb leads to an increase to 9. The crystal structures of the ternary compounds of the systems {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} belong to seven structure types; for most of them, a tendency to ordering of atoms of different chemical elements was observed.

The structure types that form at 25 at.% Zr or Hf in the systems {Zr,Hf}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb} at 600°C are ordered derivatives of the structure type Cu (cF4, Fm-3m), and are built from close-packed atomic layers exclusively in cubic stacking – ZrAl<sub>3</sub> (tI16, I4/mmm), TiAl<sub>3</sub> (tI8, I4/mmm), and UCuAl<sub>2</sub> (tI8, I4/mmm). The compactness calculated for these structures (relation  $V_{\text{atoms}}/V_{\text{cell}}$ ) for the binary and ternary compounds is larger than for the structure of elementary Al. The largest value of compactness (79.5 %) was found for the ternary compound ZrAl<sub>2.65</sub>Sb<sub>0.35</sub>. The new structure type ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub> (*tI*32,  $I4_1/amd$ ) is characterized by partial ordering of the Al and Ge atoms, as well as positional disorder of Ge atoms, modeled by splitting one crystallographic position. It belongs to a series of linear intergrowth structures composed of fragments characteristic of the basic structure types AlB<sub>2</sub> and CaF<sub>2</sub>. The new structure type  $Zr_{11}Al_{3.34}Ge_{6.66}$  (*t1*84, I4/mmm) is a quaternary variant of the structure type Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub> and is characterized by partial ordering of the Al and Ge atoms. The structure can be seen as a stacking of trigonal prisms and square antiprisms centered by atoms of the *p*-elements. The crystal structures of the phases with high Zr or Hf content are built from columns of polyhedra: octahedra in the structures Hf<sub>5</sub>(Al<sub>1-x</sub> $M_x$ )<sub>3</sub> (M = Si, Ge, Sn, Sb; structure type Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, hP16,  $P6_3/mcm$ ) and  $T_5AlM_3$  (T = Zr, Hf; M = Ge, Sn, Sb; structure type Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> hP18, P6<sub>3</sub>/mcm), and square antiprisms and tetrahedra in the structures of  $Zr_5(Al_{1-x}M_x)_3$  (M = Si, Ge, Sn, Sb) and Hf<sub>5</sub>(Al<sub>1-x</sub> $M_x$ )<sub>3</sub> (M = Sn, Sb) (structure type Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, tI32, I4/mcm). Increasing the Zr or Hf content in the compounds (decrease of p-elements content) changes the coordination environments of the *p*-element atoms: from cuboctahedral (25 at.% Zr(Hf)) to trigonal-prismatic and tetrahedral (33.3 at.% Zr(Hf)), trigonal-prismatic and squareantiprismatic (52.4 at.% Zr(Hf)), trigonal-prismatic and octahedral (55.5 at.% Zr(Hf)), and square-antiprismatic and icosahedral (62.5 at.% Zr(Hf)). Depending on the ratio of the components in the {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} systems, it is possible to purposefully change the coordination environment of atoms and the dimensionality of the structure from three-dimensional (cubic close-packing) to one-dimensional (structures with columns of polyhedra). Managing the anisotropy of the structure has an influence on the optimization of physical properties.

The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that for the first time the phase equilibria were determined and isothermal sections of the phase diagrams of the systems {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} at 600°C were constructed in the whole concentration range; the homogeneity ranges of the ternary compounds and solid solutions based on binary compounds were established; two continuous solid solutions between binary compounds, 21 limited solid solutions of the substitution type and one

solid solution of the inclusion type based on binary intermetallics were found. The existence of 29 ternary compounds (5 silicides, 9 germanides, 6 stannides, and 9 antimonides) at 600°C was established, 22 of which are new. For all of the ternary compounds the crystal structures were determined and, by means of X-ray singe-crystal and powder diffraction, two new structure types,  $ZrAl_{0.23}Ge_{1.77}$  and  $Zr_{11}Al_{3.34}Ge_{6.66}$ , were determined. Based on the results of the experimental investigations, peculiarities of the interaction of the components in the ternary systems {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} were emphasized, and crystal-chemical regularities of the ternary compounds were deduced. Relationships between the chemical composition and the crystal structure of the ternary phases in the studied systems were established.

*Keywords:* zirconium, hafnium, aluminum, silicon, germanium, tin, antimony, X-ray diffraction, X-ray spectroscopy, phase equilibria, phase diagram, solid solution, intermetallic compound, crystal structure, coordination polyhedron.

## СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

# Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

- Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Structural evolution in the systems TAl<sub>3-x</sub>Ge<sub>x</sub> (T = Zr, Hf). *Solid State Phenom.* 2019, 289, 71–76. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.289.71
- Maryskevych, D.; Tokaychuk; Ya., Prots, Yu.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>. *Chem. Met. Alloys* 2019, *12* (1/2), 39–43. https://doi.org/10.30970/cma12.0393
- Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub>. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020, 61, 63–70. https://doi.org/10.30970/vch.6101.063
- Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. The ternary system Zr–Al–Sn: isothermal section of the phase diagram at 600°C and crystal structures of the compounds. *Chem. Met. Alloys* 2022, *15* (*1/2*), 1–7. https://doi.org/10.30970/cma15.0421
- Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. The structure type ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub>. *Phys. Chem. Solid State* 2023, *24* (3), 448–452. https://doi.org/10.15330/pcss.24.3.448-452

#### Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

- 1. **Maryskevych, D.**; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Structural evolution in the systems  $TAl_{3-x}Ge_x$  (T = Zr, Hf). Progr. Abstr. 21 International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Vienna, Austria, March 25–29, 2018; p. 24.
- Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Кристалічна структура сполуки HfAl<sub>2,7</sub>Ge<sub>0,3</sub>. Зб. тез. допов. І Міжнародної (XI Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", м. Вінниця, Україна, 27–29 березня, 2018; с. 103.
- 3. **Марискевич,** Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Тернарні алюмогерманіди ZrAl<sub>2,5</sub>Ge<sub>0,5</sub> і HfAl<sub>2,4</sub>Ge<sub>0,6</sub>. Тези допов. Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2018", м. Харків, Україна, 23–25 квітня, 2018; с. 35–36.
- Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,7</sub>Ge<sub>0,3</sub>. Зб. наук. праць XVII Наукової конференції "Львівські хімічні читання – 2019", м. Львів, Україна, 2–5 червня, 2019; с. НЗ9.
- Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Prots, Yu.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of the compound Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>. Coll. Abstr. XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine, September 22–26, 2019; p. 106.
- Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Аксельруд, Л.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>. Зб. наук. праць XVIII Наукової конференції "Львівські хімічні читання – 2021", м. Львів, Україна, 31 травня – 2 червня, 2021; с. H30.
- Maryskevych, D. T.; Tokaychuk, Ya. O.; Gladyshevskii, R. E. Crystal structure of the new ternary compound Zr<sub>5</sub>Al<sub>0.41</sub>Sn<sub>2.59</sub>. Зб. тез. допов. V Міжнародної (XV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", Вінниця, Україна, 22–24 березня, 2022; с. 51.
- 8. Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Тернарні сполуки системи Zr–Al–Sn (600°С). Матер. VI Всеукраїнської наукової конференції

"Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи", м. Житомир, Україна, 5 жовтня, 2022; с. 87–88.

 Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of the ternary compounds HfAl<sub>2.67</sub>Sb<sub>0.33</sub> and Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>. Coll. Abstr. XV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine, September 25–27, 2023; p. 91.

# **3MICT**

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	. 19
ВСТУП	. 20
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	. 26
1.1. Характеристика компонентів потрійних	
систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}	. 26
1.2. Подвійні системи	. 28
1.2.1. Системи {Zr,Hf}-A1	. 28
1.2.2. Системи {Zr,Hf}-Si	. 31
1.2.3. Системи {Zr,Hf}-Ge	. 33
1.2.4. Системи {Zr,Hf}-Sn	. 36
1.2.5. Системи {Zr,Hf}-Sb	. 38
1.2.6. Системи Al-{Si,Ge,Sn,Sb}	. 39
1.3. Потрійні системи	. 42
1.3.1. Системи {Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi}	. 43
1.3.2. Системи {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb}	. 49
1.3.3. Системи {Nb,Ta}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}	. 54
1.4. Висновки з огляду літератури. Обґрунтування	
вибору об'єктів дослідження	. 57
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ	. 63
2.1. Синтез зразків	. 63
2.1.1. Вихідні матеріали	. 63
2.1.2. Синтез та контроль складу сплавів	. 63
2.1.3. Термічна обробка сплавів	. 64
2.2. Рентгенівські методи дослідження	. 64
2.2.1. Рентгенівський дифракційний фазовий аналіз	. 64
2.2.2. Локальний енергодисперсійний рентгенівський спектральний аналіз	. 65
2.2.3. Рентгеноструктурний аналіз методом монокристалу	. 66
2.2.4. Рентгеноструктурний аналіз методом порошку	. 67
2.3. Кристалохімічний аналіз структур	. 69
РОЗДІЛ З РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	. 70
3.1. Фазові рівноваги в потрійних системах	. 70
3.1.1. Бінарні сполуки систем {Zr,Hf}-Al, {Zr,Hf}-{Si,Ge,Sn,Sb}	
Ta $\{Zr,Hf\}$ -Sb	. 70

3.1.2. Системи {Zr,Hf}-Al-Si 71
3.1.3. Системи {Zr,Hf}-Al-Ge 75
3.1.4. Системи {Zr,Hf}-Al-Sn 79
3.1.5. Системи {Zr,Hf}-Al-Sb
3.2. Кристалічні структури тернарних фаз
3.2.1. Сполуки $TAl_{3-x}M_x$ ( $T = Zr$ , Hf; $M = Si$ , Ge, Sn, Sb) з структурами типів
TiAl <sub>3</sub> i UCuAl <sub>2</sub>
3.2.2. Новий структурний тип ZrAl <sub>0,23</sub> Ge <sub>1,77</sub>
3.2.3. Сполуки $T_2$ AlSb <sub>3</sub> ( $T = Zr$ , Hf) з структурою типу $Zr_2$ CuSb <sub>3</sub> 100
3.2.4. Новий структурний тип Zr <sub>11</sub> Al <sub>3,34</sub> Ge <sub>6,66</sub> 104
3.2.5. Фази $T_5$ Al $M_3$ ( $T = Zr$ , Hf; $M =$ Ge, Sn, Sb)
з структурою типу Hf5CuSn3109
3.2.6. Сполуки $Hf_5Al_{3-x}M_x$ ( $M = Si$ , Ge, Sn, Sb) з структурою типу $Mn_5Si_3$ 113
3.2.7. Сполуки $Zr_5Al_{3-x}M_x$ ( $M = Si$ , Ge, Sn, Sb) i $Hf_5Al_{3-x}M_x$ ( $M = Sn$ , Sb)
з структурою типу Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub> 117
РОЗДІЛ 4 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
4.1. Особливості взаємодії компонентів у системах
$\{Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$ 130
4.2. Кристалохімічні закономірності тернарних фаз систем $(7, 110)$ A1 ( $(3, 6, 5, 5)$ )
${Zr,HI}-AI-{SI,Ge,Sn,Sb}$
4.2.1. Наищільніші упаковки атомів
4.2.2. Представники серій лінійних неоднорідних структур
4.2.3. Впорядкування атомів у структурах сполук $Zr_{11}AI_{3,34}Ge_{6,66}$ 1
$HI_{11}AI_{3,50}OC_{6,50}$
4.2.4. Гернарні фази Новотного
4.2.5. Гетрагонально-антипризматична координація атомів $AI/M$
у структурах тернарних сполук 15(Ац,и)3
$C\Pi I C O V D I V O D I C T A U I V T WEDET 120$
υπηγοκ δεικογείς ι απεία μπεγεμι
додаток1/4

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ат.% – атомний відсоток;

ВТМ – висококотемпературна модифікація;

КЗП – коефіцієнт заповнення позиції;

КЧ – координаційне число;

Літ. – література;

мас.% – масовий відсоток;

НРТР – неперервний ряд твердих розчинів;

НТМ – низькотемпературна модифікація;

ПГ – просторова група;

ПСТ – правильна система точок;

СТ – структурний тип;

стаб. – стабілізована сполука;

СП – символ Пірсона;

*а*, *b*, *c*,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  – параметри елементарної комірки;

*B*<sub>ізо</sub> – ізотропний параметр зміщення атомів;

L – область рідкого стану;

M-p-елемент;

*t*<sub>кип.</sub> – температура кипіння;

 $t_{\text{топ.}}$  – температура топлення;

*V*-об'єм елементарної комірки;

x, y, z – координати атомів;

Z-кількість формульних одиниць в елементарній комірці;

 $\delta$  – міжатомна віддаль;

×- знак переносу хімічної формули;

... – дані відсутні.

#### ВСТУП

Обгрунтування вибору теми дослідження та її актуальність. Сучасні наукові дослідження в галузі хімії спрямовані насамперед на синтез нових сполук для розробки функціональних матеріалів з покращеними хімічними, фізичними, механічними властивостями. Важливе місце серед таких сполук займають інтерметалічні сполуки, а створені на основі них матеріали – конструкційні, термоелектричні та інші – здатні функціонувати в різних умовах, проявляючи при цьому унікальні властивості.

Алюміній теплопровідністю характеризується високою та електропровідністю і є основою великого різноманіття конструкційних матеріалів. Їх, завдяки малій густині, добрим ливарним властивостям, високій міцності та корозійній стійкості використовують у багатьох галузях промисловості, зокрема авіабудівній, автомобіле-, та аерокосмічній, будівельній судно-TOIIIO. Експлуатаційні характеристики сплавів на основі алюмінію покращуюють, зокрема легуванням іншими металами, чи інтерметалічними сполуками.

Цирконій і гафній часто застосовують як легуючі і модифікуючі композиційні добавки до різних металів і сплавів для підвищення їхньої міцності, твердості, жаростійкості та корозійної стійкості. Завдяки малому поперечному перетину захоплення нейтронів і високій стійкості проти корозії сплави на основі цирконію та гафнію використовують як конструкційні матеріали в атомній техніці, зокрема для сворення стрижнів ядерних реакторів. Фізико-хімічні властивості цирконію та гафнію, як наприклад міцність, твердість і жаростійкість, зумовлюють використання їхніх сплавів для створення деталей турбореактивних двигунів з покращеними експлуатаційними характеристиками для літальних апаратів і ракет.

Неорганічні сполуки силіцію та ґерманію широко використовуюють у радіоелектронній та ядерній техніці, зокрема для виготовлення мікроелектронних приладів, завдяки їхнім напівпровідниковим властивостям. Крім того, їх часто використовують як легуючі добавки для підвищення експлуатаційних характеристик конструкційних матеріалів, зокрема для підвищення стійкості до корозії. Олово та стибій також володіють високою корозійною стійкістю і їх широко використовують в різних галузях промисловості, в основному, як легуючі добавки для підвищення техніко-експлуатаційних характеристик матеріалів і для створення нових термоелектричних, термометричних і напівпровідникових матеріалів.

Основою створення новітніх матеріалів є встановлення взаємозв'язку між хімічним складом речовини та її будовою на атомному рівні. Тому фундаментальні дослідження взаємодії компонентів у металічних системах, встановлення фазових рівноваг, побудова діаграм стану, прецизійне визначення параметрів кристалічної структури сполук і їхніх кристалохімічних закономірностей сьогодні є актуальними.

Встановлення фазових рівноваг, областей гомогенності і кристалічної структури інтерметалічних сполук у потрійних системах  $\{Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$  дозволить з'ясувати особливості хімічної взаємодії компонентів у цих системах, умови утворення та існування фаз і закономірності їхньої кристалічної будови, що буде використано для прогнозування взаємодії в інших металічних системах за участю перехідних *d*-металів і *p*-елементів 13-15 груп періодичної системи елементів, а також для синтезу нових сполук з метою розробки функціональних матеріалів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, ґрантами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка у відповідності з науковотематичними програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема за держбюджнтними темами: "Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення", номер державної реєстрації 0118U003609, "Синтез сполук і кристалохімічний інтерметалічних нових алгоритм створення високоефективних матеріалів", номер державної реєстрації 0121U109766, "Нові інтерметаліди: синтез, хімічний і структурний тюнінг для забезпечення високої енергоефективності", номер державної реєстрації 0121U107937. Здобувач пов'язані з виконував експериментальні дослідження, синтезом зразків,

рентгенофазовим, рентгеноспектральним і рентгеноструктурним аналізами, побудовою ізотермічних перерізів діаграм стану, пошуком нових сполук і твердих розчинів, визначенням їхніх областей гомогенності і кристалічних структур. Частину експериментальних досліджень було здійснено здобувачем в Університеті Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) під час наукового стажування в рамках програми Польського національного агентства з питань академічного обміну NAWA.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановлення особливостей хімічної взаємодії компонентів у потрійних системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, побудова ізотермічних перерізів діаграм стану систем при 600°С, визначення кристалічної структури тернарних сполук і виведення їхніх кристалохімічних закономірностей. Для досягнення мети необхідно було:

- здійснити огляд літературних відомостей за темою роботи;
- синтезувати сплави у системах {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}, провести їхній фазовий і структурний аналізи;
- встановити межі розчинності третього компонента у бінарних сполуках та області гомогенності тернарних сполук;
- побудувати ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С;
- визначити параметри кристалічної структури синтезованих сполук; здійснити їхній кристалохімічний аналіз;
- проаналізувати закономірності утворення тернарних сполук у досліджених системах; вивести загальні кристалохімічні закономірності.

*Об'єкт дослідження*: взаємодія компонентів у потрійних системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}.

Предмет дослідження: фазові рівноваги у системах Zr–Al–Si, Hf–Al–Si, Zr–Al–Ge, Hf–Al–Ge, Zr–Al–Sn, Hf–Al–Sn, Zr–Al–Sb і Hf–Al–Sb при 600°C, кристалічні структури тернарних сполук і твердих розчинів.

Методи синтезу та дослідження: електродугове сплавляння і гомогенізуючий відпал, рентгенівський фазовий аналіз, рентгенівський

структурний аналіз методами монокристалу та порошку, скануюча електронна мікроскопія та локальний енергодисперсійний рентгенівський спектральний аналіз, комп'ютерна обробка результатів експерименту, кристалохімічний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено фазові рівноваги та побудовано ізотермічні перерізи (600°С) діаграм стану систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} у повних концентраційних інтервалах. Встановлено області гомогенності тернарних сполук і межі твердих розчинів на основі бінарних сполук; знайдено два неперервні ряди твердих розчинів між бінарними сполуками, 21 обмежений твердий розчин заміщення і однин твердий розчин включення на основі бінарних інтерметалідів. Встановлено утворення 29 тернарних сполук (5 силіцидів, 9 германідів, 6 станідів і 9 антимонідів), 22 з яких – нові. Для всіх тернарних сполук визначено параметри кристалічних структур. Рентгенівськими дифракційними методами монокристалу та порошку розшифровано два нові структурні типи – ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> і Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub>.

На основі результатів експериментальних досліджень встановлено особливості взаємодії компонентів у потрійних системах {Zr,Hf}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb}, здійснено їхній порівняльний аналіз між собою та із спорідненими, виведено кристалохімічні закономірності тернарних сполук *d*- і двох *p*-елементів, встановлено взаємозв'язок між хімічним складом і кристалічною структурою тернарних фаз у досліджених системах.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані експериментальні відомості про характер взаємодії компонентів у потрійних системах  $\{Zr,Hf\}-Al \{Si,Ge,Sn,Sb\}$  і кристалічні структури сполук, що утворюються в цих системах, є важливими для неорганічної хімії, кристалохімії і матеріалознавства. На основі одержаних результатів можна прогнозувати взаємодію компонентів у ще не досліджених системах за участю перехідних *d*-металів з алюмінієм та *p*-елементами 14 і 15 груп періодичної системи елементів і здійснювати ідентифікацію фаз під час розробки матеріалів. Ізотермічні перерізи діаграм стану і кристалохімічні особливості структур тернарних сполук використовують під час викладання фахових навчальних дисциплін для бакалаврів і магістрів хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Побудовані ізотермічні перерізи діаграм стану будуть внесені в базу даних ASM Alloy Phase Diagram Database, США, Швейцарія, Японія. Кристалографічні параметри та масиви дифракційних даних тернарних сполук поповнили бази даних Pearson's Crystal Data, США, Швейцарія (8 сполук) і Міжнародного центру дифракційних даних ІСDD, США (9 сполук).

Особистий внесок здобувача. Формулювання та обґрунтування мети та завдань досліджень здійснено разом з науковим керівником акад. НАН України, проф. Гладишевським Р.Є. Здобувач самостійно, згідно з рекомендаціями наукового керівника, виконав пошук та аналіз літературних відомостей за темою роботи, експериментальну частину дослідження – синтез і термічну обробку сплавів систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, їхній фазовий аналіз, побудову ізотермічних перерізів діаграм стану, визначення параметрів кристалічних структур сполук, а також аналіз одержаних результатів. Визначення та уточнення кристалічних структур окремих тернарних фаз проведено спільно з пр.н.сп. Аксельрудом Л.Г., ст.н.сп. Токайчуком Я.О. і н.сп. Процем Ю.М. Обговорення результатів досліджень і формулювання висновків дисертаційної роботи здійснено з науковим керівником акад. НАН України, проф. Гладишевським Р.Є.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були представлені на науковому семінарі кафедри неорганічної хімії, Звітних наукових конференціях Львівського університету (м. Львів, 2020, 2021, 2022, 2023) та на дев'яти міжнародних та українських наукових конференціях: International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (Vienna, Austria, 2018), Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання" (м. Харків, 2018), Міжнародних наукових конференціях студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення" (м. Вінниця, 2018, 2022), Наукових конференціях "Львівські хімічні читання" (м. Львів, 2019, 2021), International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, 2019, 2023), VI Всеукраїнській наукової конференції "Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи" (м. Житомир, 2022).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей у фахових виданнях, у т.ч. 2 у міжнародних виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus, та тези 9 доповідей на конференціях, з них 5 – на міжнародних.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації українською та англійською мовами, вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних у роботі літературних джерел і додатку. Дисертація викладена на 177 сторінках (з них 4 сторінки додатку), містить 49 таблиць та 78 рисунків. Список використаних літературних джерел нараховує 155 найменувань.

#### **РОЗДІЛ 1**

#### ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Першим кроком дослідження потрійних систем  $\{Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$ був огляд та аналіз літературних відомостей. У розділі зібрано інформацію про компоненти, подвійні системи, що лімітують досліджувані потрійні системи, та найбільш споріднені потрійні системи, а також кристалографічні характеристики сполук, що в них утворюються. Для цього було використано наукові бази даних, ASM Alloy Phase Diagram Database [1], Pauling File [2], Binary Alloy Phase Diagrams [3], Pearson's Crystal Data [4], Handbook of Inorganic Substances [5], а також оригінальні статті. У випадку схожості відомостей в різних джерелах перевагу надавали вперше опублікованим та прецизійніше визначеним параметрам.

# 1.1. Характеристика компонентів потрійних систем

### {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} [6, 7]

У цьому розділі приведено основні характеристики простих речовин, які використовували для синтезу сплавів. Значення радіусів та електронегативностей для Zr, Hf, Al, Si, Ge, Sn та Sb подано у табл. 1.1.

Цирконій (Zr) – блискучий метал сріблясто-сірого кольору.  $t_{\text{топ.}} = 1852^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{\text{кип.}} = 4377^{\circ}\text{C}$ . Густина – 6,506 г/см<sup>3</sup> (при 20°С). Існує дві температурні алотропні модифікації цирконію: НТМ Zr (CT Mg, CП *hP*2, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mmc*, a = 3,23, c = 5,14 Å) [8] і BTM Zr (CT W, CП *cI*2, ПГ *Im-3m*, a = 3,59 Å) [9]; температура фазового переходу НТМ Zr  $\leftrightarrow$  BTM Zr становить 863°C. При 600°C стабільною є модифікація зі структурою типу Mg.

Гафній (Hf) – блискучий метал сріблясто-сірого кольору.  $t_{\text{топ.}} = 2230^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{\text{кип.}} = 5197^{\circ}\text{C}$ . Густина – 13,310 г/см<sup>3</sup> (при 20°С). Існує дві температурні алотропні модифікації цирконію: НТМ Hf (СТ Mg, СП *hP*2, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mmc*, a = 3,32, c = 5,46 Å) [10] і ВТМ Hf (СТ W, СП *cI*2, ПГ *Im-3m*, a = 3,50 Å) [11]; температура

фазового переходу HTM Hf ↔ BTM Hf становить 1743°С. При 600°С стабільною є модифікація зі структурою типу Mg.

#### Таблиця 1.1

		Електро-				
Елемент	металічний	атомний	ковалентний	йонний	негативність (за Полінгом)	
Zr	1,60	1,60	1,45	1,09 (Zr <sup>2+</sup> ) 0,80 (Zr <sup>4+</sup> )	1,33	
Hf	1,58	1,56	1,44	0,81 (Hf <sup>4+</sup> )	1,30	
Al	1,43	1,43	1,18	0,50 (Al <sup>4+</sup> )	1,61	
Si	1,32	1,32	1,11	2,71 (Si <sup>1-</sup> ) 0,41 (Si <sup>4+</sup> )	1,90	
Ge	1,37	1,37	1,22	0,93 (Ge <sup>2+</sup> ) 0,53 (Ge <sup>4+</sup> )	2,01	
Sn	1,55	1,62	1,41	1,12 (Sn <sup>2+</sup> ) 0,71 (Sn <sup>4+</sup> )	1,96	
Sb	1,59	1,59	1,40	$2,45 (Sb^{3-}) \\0,89 (Sb^{3+}) \\0,62 (Sb^{5+})$	2,05	

Радіуси та електронегативності компонентів систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}

Алюміній (Al) – сріблясто-білий метал.  $t_{\text{топ.}} = 660^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{\text{кип.}} = 2467^{\circ}\text{C}$ . Густина – 2,698 г/см<sup>3</sup> (при 20°С). Кристалічна структура Al належить до структурного типу Cu (СП *cF*4, ПГ *Fm*-3*m*, *a* = 4,0501 Å) [12].

Кремній (Si) – темно-сіра крихка речовина.  $t_{\text{топ.}} = 1414^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{\text{кип.}} = 2355^{\circ}\text{C}$ . Густина – 2,329 г/см<sup>3</sup> (при 20°С). Стабільною є модифікація з кубічною гранецентрованою ґраткою (СТ С (алмаз), СП *сF*8, ПГ *Fd*-3*m*, *a* = 5,431 Å) [13].

**Ґерманій (Ge)** – речовина сіро-білого кольору з металічним блиском.  $t_{\text{топ.}} - 938^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{\text{кип.}} - 2830^{\circ}\text{C}$ . Кристалічна структура Ge належить до структурного типу C (алмаз) (СП *cF*8, ПГ *Fd*-3*m*, *a* = 5,658 Å) [13].

Олово (Sn) – сріблясто-білий метал.  $t_{\text{топ.}} = 232^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{\text{кип.}} = 2270^{\circ}\text{C}$ . Густина – 5,750 г/см<sup>3</sup> (при 20°С). Для олова характерні дві стабільні температурні алотропні

модифікації: HTM Sn (CT C (алмаз), CП *cF*8, ПГ *Fd*-3*m*, , a = 6,489 Å) [14] та BTM Sn з власним типом структури (CП *tI*4, ПГ *I*4<sub>1</sub>/*amd*, a = 5,84, c = 3,15 Å) [15]; температура фазового переходу HTM Sn ↔ BTM Sn становить 13°C.

Стибій (Sb) — речовина сіро-білого кольору з металічним блиском. Густина — 6,691 г/см<sup>3</sup> (при 20°С).  $t_{\text{топ.}} = 630^{\circ}$ С;  $t_{\text{кип.}} = 1635^{\circ}$ С. Стабільною є модифікація зі СТ Аs (СП *hR*6, ПГ *R-3m*, *a* = 4,3084, *c* = 11,274 Å) [16].

#### 1.2. Подвійні системи

#### 1.2.1. Системи {Zr,Hf}-Al

Діаграма стану системи Zr–Al (рис. 1.1) характеризується існуванням 10 сполук постійного складу [17, 18]. Сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>4</sub>, ZrAl<sub>2</sub> і ZrAl<sub>3</sub> утворюються безпосередньо з розплаву при 1530, 1645 і 1580°С, відповідно. Сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>, Zr<sub>3</sub>Al<sub>2</sub> і Zr<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> утворюються в результаті перитектичних реакцій при 1395, 1480 і 1595°С, відповідно. Сполуки Zr<sub>3</sub>Al, Zr<sub>2</sub>Al, Zr<sub>4</sub>Al<sub>3</sub> і ZrAl утворюються за перитектоїдними реакціями при 988, 1250 1023 і 1275°С, відповідно. Сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub> та Zr<sub>5</sub>Al<sub>4</sub> існують в обмеженому температурному інтервалі: 1000-1395°С та 1003-1530°С, відповідно. Для Zr<sub>2</sub>Al у літературі повідомлено два типи структури [19, 20], а також існування стабілізованої домішками фази Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub> [21] зі структурою типу Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Кристалографічні характеристики бінарних сполук системи Zr–Al наведено у табл. 1.2.

У системі Zr–Al відбуваються три евтектичні перетворення:

 $L \leftrightarrow Zr(BTM) + Zr_5Al_3$  (1350°C, 70 at.% Zr),

 $L \leftrightarrow Zr_5Al_4 + Zr_2Al_3$  (1485°C, 52 at.% Zr),

 $L \leftrightarrow ZrAl_2 + ZrAl_3$  (1490°C, 27 at.% Zr).

У Zr розчиняється значна кількість Al: 11,5 ат.% у Zr(HTM) при 940°С і 26 ат.% у Zr(BTM) при 1350°С. При 600°С розчинність Al в Zr(HTM) становить 1,3 ат.%. Zr не розчиняється у Al.

Система Hf-Al (рис. 1.2) характеризується утворенням семи сполук постійного складу [17]. Сполуки Hf<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>, HfAl, HfAl<sub>2</sub>, i HfAl<sub>3</sub> утворюються

безпосередньо з розплаву при 1590, 1800, 1650 і 1590°С, відповідно. Алюмінід Hf<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> утворюється в результаті перитектичної реакції при 1640°С, а Hf<sub>2</sub>Al і Hf<sub>4</sub>Al<sub>3</sub> – в результаті перитектоїдних реакцій при 1150 і 1430°С, відповідно. Сполука HfAl<sub>3</sub> існує у двох поліморфних модифікаціях. Крім того, існують відомості про сполуку Hf<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>, яка утворюється при стабілізації домішками [22].



Рис. 1.1. Діаграма стану системи Zr-Al.



Рис. 1.2. Діаграма стану системи Hf-Al.

## Таблиця 1.2

Кристалографічні характеристики сполук систем Zr-Al та Hf-Al

0	СТ	СП	ΠΓ	Парам	п.		
Сполука				а	b	С	JI1T.
Zr <sub>3</sub> Al	Cu <sub>3</sub> Au	cP4	Pm-3m	4,3917	_	_	[23]
	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,854	_	5,501	[19]
$Zr_2AI$	Co <sub>1,75</sub> Ge	hP6	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mmc</i>	4,882	_	5,918	[20]
Zr <sub>5</sub> Al <sub>3</sub> (BTM)	$W_5Si_3$	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,049	_	5,396	[17]
Zr <sub>5</sub> Al <sub>3</sub> (стаб.)	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,184	_	5,702	[21]
Zr <sub>3</sub> Al <sub>2</sub>	$Zr_3Al_2$	<i>tP</i> 20	P4 <sub>2</sub> /mnm	7,630	_	6,998	[24]
Zr <sub>4</sub> Al <sub>3</sub>	$Zr_4Al_3$	hP7	P6/mmm	5,433	_	5,390	[25]
Zr <sub>5</sub> Al <sub>4</sub>	Ti <sub>5</sub> Ga <sub>4</sub>	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,447	_	5,810	[26]
ZrAl	TlI	<i>oS</i> 8	Стст	3,353	10,866	4,266	[18]
Zr <sub>2</sub> Al <sub>3</sub>	$Zr_2Al_3$	oF40	Fdd2	5,572	9,598	13,879	[20]
ZrAl <sub>2</sub>	MgZn <sub>2</sub>	<i>hP</i> 12	P6 <sub>3</sub> /mmc	5,2824	_	8,7482	[27]
ZrAl <sub>3</sub>	ZrAl <sub>3</sub>	<i>tI</i> 16	I4/mmm	4,005		17,285	[28]
Hf <sub>2</sub> Al	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,776	_	5,372	[19]
Hf <sub>5</sub> Al <sub>3</sub> (стаб.)	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,052	_	5,690	[22]
$Hf_3Al_2$	$Zr_3Al_2$	<i>tP</i> 20	P4 <sub>2</sub> /mnm	7,535	_	6,906	[29]
Hf <sub>4</sub> Al <sub>3</sub>	$Zr_4Al_3$	hP7	P6/mmm	5,343	_	5,422	[20]
HfAl	TlI	<i>oS</i> 8	Стст	3,253	10,831	4,282	[30]
Hf <sub>2</sub> Al <sub>3</sub>	$Zr_2Al_3$	oF40	Fdd2	9,529	13,763	5,522	[31]
HfAl <sub>2</sub>	MgZn <sub>2</sub>	<i>hP</i> 12	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mmc</i>	5,288		8,739	[17]
HfAl <sub>3</sub> (BTM)	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,893		8,925	[20]
HfAl <sub>3</sub> (HTM)	ZrAl <sub>3</sub>	<i>tI</i> 16	I4/mmm	3,9849	_	17,1443	[20]

У системі Hf–Al відбуваються чотири евтектичні перетворення:

 $L \leftrightarrow Hf(BTM) + Hf_3Al_2$  (1530°C, 63 at.% Hf),

- $L \leftrightarrow Hf_3Al_2 + HfAl (1550^{\circ}C, 56 \text{ at.}\% \text{ Hf}),$
- $L \leftrightarrow Hf_2Al_3 + HfAl_2$  (1495°C, 37 at.% Hf),
- $L \leftrightarrow HfAl_2 + HfAl_3$  (1540°C, 28 at.% Hf).

У Нf розчиняється велика кількість Al: 30,5 aт.% у Hf(HTM) при 1450°С, і 33 aт.% у Hf(BTM) при 1450°С. При 600°С розчинність Al в Hf(HTM) становить 5,1 aт.%. Hf не розчиняється в Al.

Кристалографічні характеристики бінарних сполук системи Hf–Al наведено у табл. 1.2.

#### 1.2.2. Системи {Zr,Hf}-Si

Система Zr–Si характеризується існуванням семи бінарних сполук постійного складу (рис. 1.3) [32]. Сполука Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> утворюється безпосередньо з розплаву при 2250°С. Сполуки Zr<sub>3</sub>Si, Zr<sub>2</sub>Si, Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, Zr<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>, ZrSi(BTM) та ZrSi<sub>2</sub> утворюються за перитектичними реакціями при 1650, 1925, 2180, 2215, 2210 та 1620°С, відповідно. Для сполук Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> і ZrSi характерний температурний поліморфізм з фазовими переходами Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>(HTM)  $\leftrightarrow$  Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>(BTM) при 1860°С та ZrSi(HTM)  $\leftrightarrow$  ZrSi(BTM) при 1460°С. Сполука Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> існує в обмеженому температурному інтервалі 1745-2180°С. У системі відбуваються два евтектичні перетворення:

 $L \leftrightarrow Zr(BTM) + Zr_3Si (1570^{\circ}C, 91 \text{ at.}\% Zr),$ 

 $L \leftrightarrow ZrSi_2 + Si (1370^{\circ}C, 10 \text{ at.}\% Zr).$ 



Рис. 1.3. Діаграма стану системи Zr-Si.

У Zr розчиняється невелика кількість Si: 0,5 ат.% у Zr(HTM) при 863°С і 1 ат.% у Zr(BTM) при 1570°С. Zr не розчиняється у Si.

У системі Hf–Si (рис. 1.4) утворюється п'ять сполук постійного складу [33]. Сполука Hf<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> утворюється з розплаву при 2480°С. Сполуки Hf<sub>2</sub>Si, Hf<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>, HfSi та HfSi<sub>2</sub> утворюються в результаті перитектичних реакцій при 2083, 2320, 2142 та 1543°С, відповідно. Також у літературі є відомості про існування сполуки Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> [34]. Раніше вважалось, що ця сполука існує лише за умови її стабілізації атомами карбону, нітрогену та оксигену [35,36], однак пізніше було встановлено, що сполука Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> є окремою бінарною сполукою [37].

У системі Hf-Si відбуваються два евтектичні перетворення:

 $L \leftrightarrow Hf(BTM) + Hf_2Si (1831^{\circ}C, 88 \text{ at.}\% \text{ Hf}),$ 

 $L \leftrightarrow HfSi_2 + Si (1330^{\circ}C, 9 \text{ at.}\% \text{ Hf}).$ 

У Нf розчиняється невелика кількість Si: 1,5 ат.% у Hf(HTM) при 1770°С і 1 ат.% у Hf(BTM) при 1831°С. Hf не розчиняється у Si.

Кристалографічні характеристики бінарних сполук систем Zr–Si і Hf–Si наведено в табл. 1.3.



Рис. 1.4. Діаграма стану системи Hf-Si.

33

Сполука	СТ	СП	ПГ	Парам	п:_		
				а	b	С	JI1T.
Zr <sub>3</sub> Si	Ti <sub>3</sub> P	<i>tP</i> 32	$P4_2/n$	11,01	_	5,45	[38]
Zr <sub>2</sub> Si	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,581	_	5,372	[32]
Zr <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	7,886	_	5,558	[32]
Zr <sub>3</sub> Si <sub>2</sub>	$U_3Si_2$	<i>tP</i> 10	P4/mbm	7,087	_	3,7060	[39]
Zr <sub>5</sub> Si <sub>4</sub>	Zr <sub>5</sub> Si <sub>4</sub>	<i>tP</i> 36	P41212	7,1225	_	1,3000	[40]
ZrSi(HTM)	FeB	oP8	Pnma	6,995	3,786	5,296	[41]
ZrSi(BTM)	TlI	<i>oS</i> 8	Стст	3,764	9,917	3,748	[42]
ZrSi <sub>2</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,72	14,61	3,67	[43]
Hf <sub>2</sub> Si	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,553	_	5,186	[44]
Hf <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	7,844	_	5,492	[34]
Hf <sub>3</sub> Si <sub>2</sub>	U <sub>3</sub> Si <sub>2</sub>	<i>tP</i> 10	P4/mbm	6,988	_	3,675	[34]
Hf <sub>5</sub> Si <sub>4</sub>	Zr <sub>5</sub> Si <sub>4</sub>	<i>tP</i> 36	P41212	7,039	_	12,83	[34]
HfSi	FeB	oP8	Pnma	6,889	3,772	5,223	[34]
HfSi <sub>2</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,672	14,57	3,641	[34]

Кристалографічні характеристики сполук систем Zr-Si та Hf-Si

## 1.2.3. Системи {Zr,Hf}-Ge

Згідно з діаграмою стану системи Zr–Ge (рис. 1.5), у ній існує п'ять сполук постійного складу [45]. Сполука Zr<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> утворюється безпосередньо з розплаву при 2330°C, тоді як сполуки Zr<sub>3</sub>Ge, ZrGe та ZrGe<sub>2</sub> – за перитектичними реакціями при 1587, 2240 та 1522°C, відповідно. Спосіб і температура утворення сполуки Zr<sub>5</sub>Ge<sub>4</sub> не встановлені.

Система Zr-Ge характеризується наявністю двох евтектичних перетворень:

 $L \leftrightarrow Zr(BTM) + Zr_3Ge (1537^{\circ}C, 90 \text{ at.}\% Zr),$ 

 $L \leftrightarrow ZrGe_2 + Ge (934^{\circ}C, 2 \text{ at.}\% Zr).$ 

У Zr розчиняється невелика кількість Ge: 1,5 ат.% у Zr(HTM) при 896°С і 1,5 ат.% у Zr(BTM) при 1537°С. Zr не розчиняється у Ge.

На діаграмі стану системи Hf–Ge (рис. 1.6) відображено сім бінарних сполук постійного складу [46]. Сполука Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> утворюється безпосередньо з розплаву при 2200°С. Решта сполук, Hf<sub>3</sub>Ge, Hf<sub>2</sub>Ge, Hf<sub>3</sub>Ge<sub>2</sub>, Hf<sub>5</sub>Ge<sub>4</sub>, HfGe i HfGe<sub>2</sub>, утворюються за перитектичними реакціями при температурах 1960, 2026, 2160, 2140, 2100 і 1744°С, відповідно. Раніше важалося, що сполука Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> є стабільною лише в присутності в ній домішкових атомів карбону [47] чи атомів карбону та оксигену [48]. Додатково, у літературі є інформація про існування сполуки приблизного складу Hf<sub>6</sub>Ge<sub>5</sub> [46], а у праці [49] повідомлено, що ця сполука має еквіатомний склад HfGe. Попри згадки про її існування ще в низці праць [48,50], на сьогодні її кристалічна структура залишається не встановленою.

У системі Hf-Ge відбуваються два евтектичні перетворення:

 $L \leftrightarrow Hf(BTM) + Hf_3Ge (1775^{\circ}C, 89 \text{ at.}\% \text{ Zr}),$ 

 $L \leftrightarrow HfGe_2 + Ge (930^{\circ}C, 2 \text{ at.}\% \text{ Hf}).$ 

У Нf розчиняється невелика кiлькiсть Ge: 1 aт.% у Hf(HTM) при 1745°C i 1,5 aт.% у Hf(BTM) при 1775°C. Hf не розчиняється у Ge.



Рис. 1.5. Діаграма стану системи Zr-Ge.

Кристалографічні характеристики бінарних сполук систем Zr–Ge і Hf–Ge наведено в табл. 1.4.



Рис. 1.6. Діаграма стану системи Hf-Ge.

Таблиця 1.4

Сполука	СТ	СП	ПГ	Парам	п.		
				а	b	С	J11T.
Zr <sub>3</sub> Ge	Ti <sub>3</sub> P	<i>tP</i> 32	$P4_2/n$	11,08	_	5,48	[38]
Zr <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	7,99	_	5,54	[45]
Zr <sub>5</sub> Ge <sub>4</sub>	Zr <sub>5</sub> Si <sub>4</sub>	<i>tP</i> 36	P41212	7,24	_	13,16	[46]
ZrGe	FeB	oP8	Pnma	7,075	3,904	5,396	[51]
ZrGe <sub>2</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,76	14,97	3,79	[45]
Hf <sub>3</sub> Ge	Ti <sub>3</sub> P	<i>tP</i> 32	$P4_2/n$	10,901	_	5,410	[52]
Hf <sub>2</sub> Ge	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,577	_	5,274	[52]
Hf <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	7,938	_	5,549	[52]
Hf <sub>3</sub> Ge <sub>2</sub>	$U_3Si_2$	<i>tP</i> 10	P4/mbm	7,06	_	3,72	[46]
Hf <sub>5</sub> Ge <sub>4</sub>	Sm <sub>5</sub> Ge <sub>4</sub>	oP36	Pnma	6,995	13,389	7,077	[52]
HfGe	FeB	oP8	Pnma	7,066	3,905	5,355	[53]
HfGe <sub>2</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,791	14,863	3,754	[52]

Кристалографічні характеристики сполук систем Zr-Ge та Hf-Ge

#### 1.2.4. Системи {Zr,Hf}-Sn

Система Zr–Sn (рис. 1.7) характеризується існуванням трьох сполук [54]. Сполука змінного складу, позначена на діаграмі стану як Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3,2</sub>, утворюється безпосередньо з розплаву при 1983°С, сполука постійного складу ZrSn<sub>2</sub> – у результаті перитектичної реакції при 1143°С, а Zr<sub>3,2</sub>Sn<sub>0,8</sub> – у результаті перитектоїдної реакції при 1333°С. При температурах, нижчих за 1500°С фаза Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3,2</sub> розпадається на дві сполуки постійного складу – Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> і Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub>.



Рис. 1.7. Діаграма стану системи Zr-Sn.

У системі Zr-Sn відбувається два евтектичні перетворення:

 $L \leftrightarrow Zr(BTM) + Hf_5Sn_{3,2}$  (1593°C, 82 at.% Zr),

 $L \leftrightarrow ZrSn_2 + Sn(BTM)$  (230°C, < 1 at.% Zr).

Система Zr–Sn характеризується значною розчинністю Sn в Zr: 7 ат.% у Zr(HTM) при 983°C і 16 ат.% у Zr(BTM) при 1593°C. При 600°C розчинність Sn в Zr(HTM) становить 1,9 ат.%. Zr не розчиняється у Sn.

У системі Hf–Sn (рис. 1.8) утворюється чотири сполуки постійного складу [55]. Сполука Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> утворюється з розплаву при 1900°С, а HfSn<sub>2</sub> – за перитектичною реакцією при 1530°С. У літературі відсутні відомості про способи утворення та температурні інтервали існування бінарних станідів HfSn та Hf<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub>.
У системі Hf-Sn відбуваються два евтектичні перетворення:

 $L \leftrightarrow Hf(BTM) + Hf_5Sn_3 (1725^{\circ}C, 80 \text{ at.}\% \text{ Hf}),$ 

 $L \leftrightarrow HfSn_2 + Sn(BTM)$  (230°C, 1 at.% Hf).



Рис. 1.8. Діаграма стану системи Hf-Sn.

Кристалографічні характеристики бінарних сполук систем Zr–Sn і Hf–Sn наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Сполука	СТ	СП	пг	Парам	Піт		
			111	а	b	С	
Zr <sub>3,2</sub> Sn <sub>0,8</sub>	Cr <sub>3</sub> Si	cP8	Pm-3n	5,625	—	_	[54]
Zr <sub>5</sub> Sn <sub>3</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,4576	_	5,7797	[56]
Zr <sub>5</sub> Sn <sub>4</sub>	Ti <sub>5</sub> Ga <sub>4</sub>	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,5036	—	5,820	[57]
ZrSn <sub>2</sub>	TiSi <sub>2</sub>	oF24	Fddd	9,573	5,644	9,927	[58]
Hf <sub>5</sub> Sn <sub>3</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,385	—	5,723	[59]
$\mathrm{Hf}_5\mathrm{Sn}_4$	Ti <sub>5</sub> Ga <sub>4</sub>	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,695	_	5,875	[60]
HfSn	FeSi	cP8	<i>P</i> 2 <sub>1</sub> 3	5,594	—	_	[61]
HfSn <sub>2</sub>	CrSi <sub>2</sub>	hP9	P6 <sub>2</sub> 22	5,47	_	7,60	[62]

Кристалографічні характеристики сполук систем Zr-Sn та Hf-Sn

#### 1.2.5. Системи {Zr,Hf}-Sb

Діаграма стану системи Zr–Sb (рис. 1.9) побудована частково і на ній відображено чотири бінарні сполуки. Антимонід Zr<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> утворюється з розплаву при 1900°С. Способи утворення та температурні межі існування решти сполук не відомі. Крім того, у літературі є відомості про існування та кристалічну структуру сполук Zr<sub>7</sub>Sb<sub>4</sub>, Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub>, ZrSb (HTM i BTM), Zr<sub>2</sub>Sb<sub>3</sub>, Zr<sub>11</sub>Sb<sub>18</sub> і поліморфної модифікації ZrSb<sub>2</sub> (BTM).

У системі Zr-Sb відбувається одне евтектичне перетворення:

 $L \leftrightarrow Zr(BTM) + Zr_3Sb (1430^{\circ}C, 83 \text{ at.}\% Zr).$ 

Система Zr–Sb характеризується значною розчинністю Sb в Zr: 1,5 ат.% у Zr(HTM) при 875°C і 17,5 ат.% у Zr(BTM) при 1430°C. Zr не розчиняється у Sb.



Рис. 1.9. Діаграма стану системи Zr-Sb.

Діаграма стану системи Hf–Sb не побудована. У літературі є відомості про існування п'яти бінарних сполук: Hf<sub>3</sub>Sb, Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub>, HfSb, Hf<sub>5</sub>Sb<sub>9</sub> та HfSb<sub>2</sub>. Для HfSb та HfSb<sub>2</sub> характерний температурний поліморфізм.

Кристалографічні характеристики бінарних сполук систем Zr–Sb і Hf–Sb приведено у табл. 1.6.

## Таблиця 1.6

Кристалографічні характеристики сполук систем Zr-Sb та Hf-Sb

C	CT	СП	пр	Парам	п:_		
Сполука	CI	CII	111	а	b	С	JIII.
Zr <sub>3</sub> Sb	Ni <sub>3</sub> P	<i>tI</i> 32	<i>I</i> -4	11,35	_	5,67	[38]
Zr <sub>2</sub> Sb(HTM)	La <sub>2</sub> Sb	<i>tI</i> 12	I4/mmm	4,1172	_	15,771	[63]
Zr <sub>2</sub> Sb(BTM)		tP*	<i>P</i> 4	6,497	_	7,871	[64]
7 61		D44		8,4905	11,1557	11,1217	[(5]
Zr <sub>7</sub> Sb <sub>4</sub>	$(HI_{0,86}I_{10,14})_7SD_4$	<i>mP</i> 44	$\Gamma Z_1/C$	β	3°	[65]	
Zr <sub>5</sub> Sb <sub>3</sub> (HTM)	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,465	_	5,806	[66]
Zr <sub>5</sub> Sb <sub>3</sub> (BTM)	Y <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	oP32	Pnma	7,465	8,801	10,865	[67]
Zr <sub>5</sub> Sb <sub>4</sub>	Ti <sub>5</sub> Ga <sub>4</sub>	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,603	_	5,912	[68]
ZrSb(HTM)	ZrSb	<i>oS</i> 24	Стст	3,827	10,426	14,007	[69]
ZrSb(BTM)	FeSi	cP8	<i>P</i> 2 <sub>1</sub> 3	5,6358	_	_	[63]
Zr <sub>2</sub> Sb <sub>3</sub>		tP*		9,567	_	5,294	[63]
$Zr_{11}Sb_{18}$	$Zr_{11}Sb_{18}$	<i>tI</i> 116	I-42d	6,7694	_	6,0073	[70]
ZrSb <sub>2</sub> (HTM)	PbCl <sub>2</sub>	oP12	Pnma	7,393	3,9870	9,581	[63]
ZrSb <sub>2</sub> (BTM)	TiAs <sub>2</sub>	oP24	Pnnm	14,98	9,94	3,86	[71]
Hf <sub>3</sub> Sb	Ni <sub>3</sub> P	<i>tI</i> 32	<i>I</i> -4	11,23	_	5,65	[72]
Hf <sub>5</sub> Sb <sub>3</sub>	Y <sub>5</sub> Bi <sub>3</sub>	oP32	Pnma	7,4075	8,718	10,736	[73]
HfSb(HTM)	ZrSb	<i>oS</i> 24	Стст	3,779	10,338	13,842	[74]
HfSb(BTM)	FeSi	cP8	<i>P</i> 2 <sub>1</sub> 3	5,59	_	_	[75]
Hf <sub>5</sub> Sb <sub>9</sub>	Hf <sub>5</sub> Sb <sub>9</sub>	<i>tP</i> 28	<i>P</i> 4/ <i>n</i>	8,7483	_	8,6646	[76]
HfSb <sub>2</sub> (HTM)	TiAs <sub>2</sub>	oP24	Pnnm	14,96	9,86	3,85	[71]
HfSb <sub>2</sub> (BTM)	UAs <sub>2</sub>	tP6	P4/nmm	3,916	_	8,678	[77]

# 1.2.6. Системи Al-{Si,Ge,Sn,Sb}

Система Al–Si (рис. 1.10) характеризується відсутністю бінарних сполук і незначною розчинністю Si в Al: 2 ат.% при 577°С. Al не розчиняється у Si. У системі відбувається одне евтектичне перетворення:

L  $\leftrightarrow$  Al + Si при 12,2 ат.% Si та 577°C.



Рис. 1.10. Діаграма стану системи Al-Si.

Діаграма стану системи Al–Ge (рис. 1.11) характеризується відсутністю бінарних сполук, а також незначною розчинністю Ge в Al: 2 ат.% та Al в Ge: 1,8 ат.% при 420°C. У літературі також є відомості про існування матастабільних бінарних фаз Al<sub>6</sub>Ge<sub>5</sub>, Al<sub>2,7</sub>Ge<sub>0,3</sub> і AlGe, кристалографічні характеристики яких приведено у таблиці 1.7. У системі відбувається одне евтектичне перетворення:

L  $\leftrightarrow$  Al + Ge при 28,2 ат.% Ge та 420°C.



Рис. 1.11. Діаграма стану системи Al-Ge.

Діаграма стуну системи Al–Sn (рис. 1.12) характеризується відсутністю бінарних сполук і незначною розчинністю Al в Sn: 1,5 ат.% при 220°C, тоді як Sn в Al не розчиняється. У літературі є відомості про існування метастабільної фази Al<sub>0,5</sub>Sn<sub>0,5</sub> [78], її кристалографічні характеристики подано у таблиці 1.7. У системі відбувається одне евтектичне перетворення:

L  $\leftrightarrow$  Al + Sn(BTM) при 97,6 ат.% Sn та 220°C.



Рис. 1.12. Діаграма стану системи Al-Sn.

Таблиця 1.7

Сполука	СТ	СП	ПГ	Парам	Піт		
	CI	CII	111	а	b	С	
Al <sub>6</sub> Ge <sub>5</sub>	$Zn_{5,38}Sb_5$	hR66	<i>R</i> -3 <i>c</i>	11,45	—	11,67	[79]
Al <sub>2,7</sub> Ge <sub>0,3</sub>	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,13	_	4,92	[80]
110	AlGe	taa DQ	$D^{2}/c$	6,7305	5,8173	8,0427	г <b>0</b> 11
AIGe		MP 8	$PZ_1/C$	β	= 147,853	0	[01]
Al <sub>0,5</sub> Sn <sub>0,5</sub>	$Hg_{0,1}Sn_{0,9}$	hP1	P6/mmm	3,181	_	2,980	[78]
AlSb(hp1)	ZnTe	<i>oS</i> 8	Стст	5,036	5,397	4,818	[82]
AlSb(hp2)	TlF	oF8	Fmmm	5,391	5,142	5,894	[83]
AlSb	ZnS	cF8	<i>F</i> -43 <i>m</i>	6,091	_	_	[84]

Кристалографічні характеристики сполук системи Al-{Ge,Sn,Sb}

У системі Al–Sb (рис. 1.13) існує одна стабільна бінарна сполука AlSb зі CT ZnS. Вона утворюється безпосередньо з розплаву при 1058°С. Слід зазначити, що у літературі є відомості про існування двох високотискових модифікацій цієї сполуки (hp1 i hp2). Кристалографічні характеристики бінарних сполук системи Al–Sb приведено у табл. 1.7. У системі відбуваються два евтектичні перетворення:

L  $\leftrightarrow$  Al + AlSb при 0,4 ат.% Al та 657°C,

L  $\leftrightarrow$  Sb + AlSb при 98,5 ат.% Sn та 627°C.



Рис. 1.13. Діаграма стану системи Al-Sb.

#### 1.3. Потрійні системи

У цьому розділі приведено відомості про фазові рівноваги і кристалічну структуру тернарних фаз систем {Ti,Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, а також споріднених до них систем {Ti,Zr,Hf}–Al–{Pb,Bi} (ізовалентна заміна *p*-елементів 14 і 15 груп періодичної системи елементів), {Ti,Zr,Hf}–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb} (ізовалентна заміна *p*-елементів 13 групи періодичної системи елементів) та {Nb,Ta}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} (заміна *d*-елементів 4 групи на *d*-елементи 5 групи періодичної системи елементів).

#### 1.3.1. Системи {Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi}

З-поміж потрійних систем {Ti,Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi} лише для систем Ti–Al–Si та Zr–Al–Si побудовані ізотермічні перерізи діаграм стану у повному концентраційному інтервалі. Системи Ti–Al–{Ge,Sn,Sb} досліджені в обмеженому концентраційному інтервалі. Решту систем досліджували лише на предмет утворення тернарних сполук окремих складів. Відомостей про діаграми стану систем Ti–Al–Bi, Zr–Al–{Ge,Sn,Sb,Bi} і Hf–Al–{Si,Ge,Sn,Sb,Bi} у літературі немає.

Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Ti–Al–Si побудовано у повних концентраційних інтервалах при 700 та 1200°С (рис. 1.14) [85]. Вони характеризуються незначною розчинністю Al в бінарних силіцидах титану, тоді як бінаний алюмінід TiAl<sub>3</sub> розчиняє до 15 ат.% Si. Знайдено дві тернарні сполуки змінного складу: (Ti<sub>0,82-0,87</sub>Al<sub>0,18-0,13</sub>)(Al<sub>0,12-0,50</sub>Si<sub>0,88-1,50</sub>) зі CT Zr<sub>0,75</sub>AlSi<sub>1,25</sub> і TiAl<sub>0,3-0,6</sub>Si<sub>1,7-1,4</sub> зі CT ZrSi<sub>2</sub>. Відомо, що тернарна фаза (Ti<sub>0,82-0,87</sub>Al<sub>0,18-0,13</sub>)×  $\times$ (Al<sub>0,12-0,50</sub>Si<sub>0,88-1,50</sub>) існує нижче 900°С. Для фази зі структурою типу Zr<sub>0,75</sub>AlSi<sub>1,25</sub> також повідомлено склад TiAl<sub>0,24</sub>Si<sub>1,76</sub> при 900°С [86]. Додатково, у праці [87] повідомлено про утворення фази Ti<sub>5</sub>Al<sub>x</sub>Si<sub>3</sub>.



Рис. 1.14. Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Ті-Al-Si при 700 і 1200°С.

Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Zr–Al–Si побудовано у повних концентраційних інтервалах при 700 та 1200°С (рис. 1.15) [88]. Повідомлено про існування трьох тернарних сполук: ZrAl<sub>2,7-2,4</sub>Si<sub>0,3-0,6</sub> [89,90], Zr<sub>0,75</sub>AlSi<sub>1,25</sub> [90] і ZrAl<sub>0,20-0,25</sub>Si<sub>0,80-0,75</sub> [89]. При 700°С утворюються протяжні тверді розчини заміщення на основі бінарних сполук ZrSi<sub>2</sub>, ZrSi та Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>, а при 1200°С на основі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>. Також при 1200°С між ізоструктурними сполуками Zr<sub>2</sub>Al i Zr<sub>2</sub>Si (CT CuAl<sub>2</sub>) утворюється НРТР.



Рис. 1.15. Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Zr-Al-Si при 700 і 1200°С.

Систему Hf–Al–Si досліджували лише на предмет утворення окремих тернарних сполук і твердих розчинів на основі бінарних фаз. Встановлено існування двох тернарних сполук,  $Hf_5Al_{2,55-1,5}Si_{0,45-1,5}$  та  $HfAl_{0,5}Si_{0,5}$ , HPTP  $Hf_2Al_{1-0}Si_{0-1}$  і твердих розчинів заміщення на основі бінарних сполук  $HfAl_3$ ,  $Hf_3Si_2$  і  $HfSi_2$  при 1200°C.

Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Ті–Al–Ge при 400, 520 та 1000°C представлені на рис. 1.16 [91]. На основі бінарних сполук TiAl<sub>3</sub> та TiGe<sub>2</sub> утворюються тверді розчини заміщення, протяжністю до 13 ат.% Ge i 4 ат.% Al, відповідно. При 400 і 520°C існує три тернарні сполуки: TiAl<sub>3</sub>Ge, TiAl<sub>0,27-0,39</sub>Ge<sub>1,73-1,61</sub> і TiAl<sub>0,41-0,64</sub>Ge<sub>1,59-1,36</sub>. На ізотермічному перерізі діаграми стану при 1000°C тернарні сполуки відсутні.

Про діаграму стану чи кристалічні структури тернарних сполук у системі Zr–Al–Ge відомості відсутні, а у системі Hf–Al–Ge знайдено тернарну сполуку HfAl<sub>0,33</sub>Ge<sub>1,67</sub> [92].



Рис. 1.16. Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Ti–Al–Ge при 400°С (*a*), 520°С (*б*) і 1000°С (*в*).

Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti–Al–Sn побудовано при 900°C в області 33,3-100 ат.% Ті [93] (рис. 1.17). Повідомлено про існування і кристалічну структуру однієї тернарної сполуки, Ti<sub>5</sub>AlSn<sub>2</sub> [94]. Встановлено утворення твердих

розчинів заміщення на основі бінарних сполук  $Ti_6Sn_5$  і  $Ti_5Sn_3$  та НРТР між ізоструктрурними бінарними сполуками  $Ti_3Sn$  та  $Ti_3Al$  (CT Mg<sub>3</sub>Cd).

У системах {Zr,Hf}–Al–Sn повідомлено про існування та кристалічну структуру тернарних фаз Zr<sub>5</sub>AlSn<sub>3</sub> [95], Zr<sub>5</sub>AlSn<sub>2</sub> та Hf<sub>5</sub>AlSn<sub>2</sub> [94].



Рис. 1.17. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti–Al–Sn при 900°С.

У системах {Ti,Zr,Hf}–Al–Pb повідомлено про існування ізоструктурних тернарних сполук  $T_5$ AlPb<sub>2</sub> (T = Ti, Zr, Hf) [94].

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Ti–Al–Sb побудовано при 1100°C в багатій на Ti області (> 50 ат.%) (рис. 1.18) [96]. Повідомлено про існування однієї тернарної сполуки змінного складу Ti<sub>5</sub>(Al,Sb)<sub>3</sub>, однак область гомогенності для неї не встановлено. У системі Zr–Al–Sb повідомлено про існування тернарних фаз Zr<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> [97] та Zr<sub>5</sub>Al<sub>0,8</sub>Sb<sub>2,2</sub> [98], а у системі Hf–Al–Sb – тернарних сполук Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,56-0,86</sub>Sb<sub>1,44-2,14</sub> та Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,30</sub>Sb<sub>0,70</sub> [99].

У літературі відсутні відомості про діаграми стану чи кристалічні структури тернарних фаз ситем {Ti,Zr,Hf}–Al–Bi.

Кристалографічні характеристики тернарних фаз систем {Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Pb,Sb} наведено в табл. 1.8.



Рис. 1.18. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ті–Al–Sb при 1100°С.

Таблиця 1.8

# Кристалографічні характеристики тернарних фаз

систем {Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Pb,Sb}

Споти	СТ	СП	пг	Парам	Піт		
Сполука	CI	CII	111	а	b	С	
1	2	3	4	5	6	7	8
TiAl <sub>2,4</sub> Si <sub>0,6</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,78	_	8,52	[85]
Ti <sub>0,87</sub> Al <sub>0,63</sub> Si <sub>1,5</sub>	Zr <sub>0,75</sub> AlSi <sub>1,25</sub>	<i>tI</i> 24	$I4_1/amd$	3,57	—	27,15	[85]
TiAl <sub>0,24</sub> Si <sub>1,76</sub>	Zr <sub>0,75</sub> AlSi <sub>1,25</sub>	<i>tI</i> 24	$I4_1/amd$	3,5788	—	27,132	[86]
TiAl <sub>0,5</sub> Si <sub>1,5</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,18	13,52	3,618	[85]
Ti <sub>5</sub> Al <sub>x</sub> Si <sub>3</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	7,6281	—	5,271 <sup>1</sup>	[87]
ZrAl <sub>2,7-2,4</sub> Si <sub>0,3-0,6</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,904- 3,920	_	9,008- 8,938	[89, 90]
Zr <sub>0,75</sub> AlSi <sub>1,25</sub>	Zr <sub>0,75</sub> AlSi <sub>1,25</sub>	<i>tI</i> 24	$I4_1/amd$	3,71	_	29,35	[90]
ZrAl <sub>0,2</sub> Si <sub>0,8</sub>	TlI	oS8	Стст	3,762	9,912	3,754	[89]
$Zr_5Al_{2,4}Si_{0,6}$	Mr Si	hD16	D6 /m om	8,146	—	5,671	[88]
$Zr_5Al_{1,5}Si_{1,5}$	11115313	<i>nr</i> 10	F 03/MCM	8,076	_	5,664	[100]
Zr <sub>2,1</sub> Al <sub>0,3</sub> Si <sub>0,6</sub>	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,665	_	5,397	[19]

(виділено тверді розчини на основі бінарних сполук)

Закінчення таблиці 1.8

1	2	3	4	5	6	7	8
HfAl <sub>2,55</sub> Si <sub>0,45</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	5,508		8,939	[100]
HfAl <sub>0,3</sub> Si <sub>1,7</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,711		3,667	[100]
HfAl <sub>0,5</sub> Si <sub>0,5</sub>	TlI	oS8	Стст	3,714	9,89	3,754	[89]
$Hf_3Al_{0,5}Si_{1,5}$	$U_3Si_2$	<i>tP</i> 10	P4/mbm	7,072		3,636	[100]
$Hf_{5}Al_{1,5}Si_{1,5}$	$Mn_5Si_3$	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	7,957	_	5,559	[100]
$Hf_{1,95}Al_{0,9}Si_{0,15}$	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,587	—	5,198	[19]
TiAl <sub>3</sub> Ge	TiAl <sub>3</sub> Ge	<i>tP</i> 10	P4/nmm	3,8713	_	10,8830	[91]
TiAl <sub>2,7</sub> Ge <sub>0,3</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,8390		8,6305	[91]
TiAl <sub>0,41</sub> Ge <sub>1,59</sub>	ScCo <sub>0,25</sub> Si <sub>1,75</sub>	oS12	Стст	3,6912	14,0550	3,6990	[91]
TiAl <sub>0,29</sub> Ge <sub>1,71</sub>	TiAl <sub>0,29</sub> Ge <sub>1,71</sub>	<i>tI</i> 24	$I4_1/amd$	3,6959	ĺ	28,345	[91]
TiAl <sub>0,13</sub> Ge <sub>1,87</sub>	TiSi <sub>2</sub>	oF24	Fddd	5,031	8,615	8,804	[91]
Ti <sub>1,07</sub> Al <sub>0,89</sub> Ge <sub>0,04</sub>	CuAu	tP2	P4/mmm	2,8087	_	4,0398	[91]
Ti <sub>6</sub> Al <sub>0,27</sub> Ge <sub>4,73</sub>	$V_6Si_5$	<i>oI</i> 44	Ibam	7,9470	16,9323	5,2336	[91]
Ti <sub>5</sub> Al <sub>0,76</sub> Ge <sub>2,24</sub>	$Mn_5Si_3$	<i>hP</i> 16	$P6_3/mcm$	7,5886		5,2390	[91]
HfAl <sub>0,33</sub> Ge <sub>1,67</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,7935	14,879	3,7558	[92]
Ti <sub>5</sub> AlSn <sub>2</sub>	W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,549	_	5,242	[94]
Zr <sub>5</sub> AlSn <sub>3</sub>	Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub>	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,655	_	5,871	[95]
Zr <sub>5</sub> AlSn <sub>2</sub>	W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,181	_	5,538	[94]
Hf <sub>5</sub> AlSn <sub>2</sub>	$W_5Si_3$	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,014	_	5,542	[94]
Ti <sub>5</sub> AlPb <sub>2</sub>	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,659	_	5,318	[94]
Zr <sub>5</sub> AlPb <sub>2</sub>	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,209		5,524	[94]
Hf <sub>5</sub> AlPb <sub>2</sub>	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,045	_	5,543	[94]
$Ti_5Al_{1,3}Sb_{1,7}$	W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,346	_	5,152	[96]
Zr <sub>5</sub> AlSb <sub>3</sub>	Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub>	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,5802		5,8465	[97]
$Zr_5Al_{0,8}Sb_{2,2}$	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,100		5,553	[98]
Zr <sub>5</sub> Al <sub>0-2,61</sub> Sb <sub>3-0,39</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	P6 <sub>3</sub> /mcm	8,378 <sup>2</sup>	—	5,730 <sup>2</sup>	[101]
Hf <sub>5</sub> Al <sub>2,30</sub> Sb <sub>0,70</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	P6 <sub>3</sub> /mcm	8,1442	_	5,6566	[99]
$ \begin{array}{c} Hf_{5}Al_{1,560,86}\times \\ \times Sb_{1,442,14} \end{array} $	W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,8955 <sup>3</sup>	_	5,5101 <sup>3</sup>	[99]

Примітки: <sup>1</sup> в літературі не вказаний склад, для якого визначені параметри комірки; <sup>2</sup> для складу  $Zr_5Al_{1,5}Sb_{1,5}$ ; <sup>3</sup> для складу  $Hf_5Al_{1,56}Sb_{1,44}$ .

#### 1.3.2. Системи {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb}

Серед систем {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb} лише для систем Hf-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb} побудовані діаграми стану в повних концентраційних інтервалах, {Ti,Zr,Hf}-Ga-Si – в часткових інтервалах.

Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ті–Gа–Si побудовано в області 33,3-100 ат.% Ті при 800°С (рис. 1.19*a*) [102]. Встановлено існування однієї тернарної сполуки, ТіGa<sub>0,68-0,20</sub>Si<sub>1,32-1,80</sub>, та твердого розчину заміщення на основі бінарної сполуки Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Крім того, у працях [103-105] приведено ізотермічний переріз діаграми стану в області 62,5-100 ат.% Ті при 1350°С (рис. 1.19*б*).



Рис. 1.19. Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Ті–Ga–Si: в області 33,3-100 ат.% Ті при 800°С (*a*) та в області 62,5-100 ат.% Ті при 1350°С (б).

Ізотермічний переріз діаграми стану системи Zr–Ga–Si побудовано при 800°C в області 33,3-100 ат.% Zr (рис. 1.20) [102]. Встановлено утворення твердих розчинів заміщення різної протяжності на основі бінарних сполук Zr<sub>3</sub>Ga<sub>2</sub>, Zr<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub>, Zr<sub>2</sub>Ga, ZrSi<sub>2</sub>, ZrSi, Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>, Zr<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>, Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> і Zr<sub>2</sub>Si. У системі знайдено одну тернарну сполуку змінного складу, ZrGa<sub>0,90-0,66</sub>Si<sub>0,10-0,34</sub>. У праці [106] повідомлено, що ця тернарна сполука є частиною твердого розчину на основі високотемпературної модифікації бінарної сполуки ZrGa (CT TII). Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf–Ga–Si побудовано в повному концентраційному інтервалі при 600°С (рис. 1.21) [107]. У системі утворюється одна тернарна сполука постійного складу HfGa<sub>0,33</sub>Si<sub>0,67</sub> [108]. Особливістю системи є утворення HPTP на основі бінарних сполук Hf<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub> i Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>) та Hf<sub>2</sub>Ga i Hf<sub>2</sub>Si (CT CuAl<sub>2</sub>).



Рис. 1.20. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Zr-Ga-Si при 800°С.



Рис. 1.21. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf-Ga-Si при 600°С.

Усистемі Ті–Gа–Ge відомо про існування та кристалічну структуру тернарних фаз ТіGa<sub>0,5</sub>Ge<sub>1,5</sub> та Ті<sub>5</sub>Ga<sub>1,5</sub>Ge<sub>1,5</sub> [109]. Друга фаза, мабуть, є частиною твердого розчину заміщення на основі бінарної сполуки Ті<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub>.

У системі Zr–Ga–Ge повідомлено про існування тернарних фаз ZrGa<sub>2,75</sub>Ge<sub>0,25</sub> [109], Zr<sub>0,75</sub>Ga<sub>0,9</sub>Ge<sub>1,35</sub> [109], ZrGa<sub>0,5</sub>Ge<sub>1,5</sub> [18] і ZrGa<sub>0,1</sub>Ge<sub>0,9</sub> [5]. Zr<sub>0,75</sub>Ga<sub>0,9</sub>Ge<sub>1,35</sub> і ZrGa<sub>0,5</sub>Ge<sub>1,5</sub>, мабуть, належать до області гомогенності однієї фази.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Hf–Ga–Ge побудовано при 600°C в повному концентраційному інтервалі (рис. 1.22) [110]. У системі утворюється одна тернарна сполука змінного складу HfGa<sub>0,82-0,67</sub>Ge<sub>1,18-1,33</sub>. Між ізоструктурними бінарними сполуками Hf<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub> і Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>) та Hf<sub>2</sub>Ga і Hf<sub>2</sub>Ge (CT CuAl<sub>2</sub>) утворюються HPTP [110,111].



Рис. 1.22. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf-Ga-Ge при 600°С.

У системі Zr–Ga–Sn відомо про існування двох тернарних фаз з визначеними кристалічними структурами  $Zr_5Ga_{0,52}Sn_{2,48}$  [112] і  $Zr_5GaSn_3$  [95]. Фаза  $Zr_5Ga_{0,52}Sn_{2,48}$  є індивідуальною тернарною сполукою, тоді як природу фази складу  $Zr_5GaSn_3$  не встановлено.

Система Hf-Ga-Sn досліджена в повному концентраційному інтервалі при 600°С (рис. 1.23) [113]. У системі утворюється одна тернарна сполука змінного

складу  $Hf_5Ga_{1,24-0,52}Sn_{1,76-2,48}$ . На основі бінарних сполук HfGa (CT ThIn) та  $Hf_5Ga_3$  (CT  $Mn_5Si_3$ ) утворюються тверді розчини заміщення, а на основі бінарної сполуки  $Hf_5Sn_3$  (CT  $Mn_5Si_3$ ) утворюється твердий розчин включення  $Hf_5Ga_xSn_3$  (x = 0-1) [114].

Для системи Ti–Ga–Sb є повідомлено про утворення тернарної сполуки Ti<sub>5</sub>GaSb<sub>2</sub> [98], а також твердого розчину заміщення на основі бінарного галіду Ti<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub> зі структурою типу Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> [101].

У системі Zr–Ga–Sb знайдено тернарну сполуку Zr<sub>5</sub>Ga<sub>0,8</sub>Sb<sub>2,2</sub> при 400°С [98], а також встановлено утворення НРТР Zr<sub>5</sub>Ga<sub>0-3</sub>Sb<sub>3-0</sub> при 1000°С [101].



Рис. 1.23. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf-Ga-Sn при 600°С.

Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf–Ga–Sb побудований при 600°C (рис. 1.24) [115]. У системі утворюються чотири тернарні сполуки: Hf<sub>2</sub>GaSb<sub>3</sub>, HfGa<sub>0,1</sub>Sb<sub>0,9</sub>, Hf<sub>5</sub>GaSb<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>Ga<sub>1,84-0,72</sub>Sb<sub>1,16-2,28</sub>. На основі бінарних сполук HfGa (CT ThIn), Hf<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>) та Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> (CT Y<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>) утворюються тверді розчини заміщення різної протяжності.

Кристалографічні характеристики тернарних фаз систем {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb} наведено в табл. 1.9.



Рис. 1.24. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf-Ga-Sb при 600°С.

Таблиця 1.9

# Кристалографічні характеристики тернарних сполук систем {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb}

(виділено тверді розчини на основі бінарних сполук)

Casaaa	СТ СП		пг	Парам	πίπ			
Сполука	CI	CII	111	а	b	С	] JIIT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
$TiGa_{0,68-0,20} \times \\ \times Si_{1,32-1,80}$	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,5841	13,606 <sup>1</sup>	3,584 <sup>1</sup>	[102]	
Ti <sub>5</sub> Ga <sub>0-1,90</sub> × ×Si <sub>3-1,10</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	hP16	P6 <sub>3</sub> /mcm	7,505 <sup>2</sup>	_	5,1942 <sup>2</sup>	[105]	
ZrGa <sub>0,90-0,66</sub> × ×Si <sub>0,10-0,34</sub>	TlI	oS8	Стст	3,908 <sup>3</sup>	10,197 <sup>3</sup>	3,824 <sup>3</sup>	[102]	
HfGa <sub>0,33</sub> Si <sub>0,67</sub>	TlI	oS8	Стст	3,7338	9,889	3,7441	[108]	
TiGa <sub>0,5</sub> Ge <sub>1,5</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,69	14,09	3,67	[109]	
Ti <sub>5</sub> Ga <sub>1,5</sub> Ge <sub>1,5</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	P6 <sub>3</sub> /mcm	7,5	—	5,2	[109]	
ZrGa <sub>2,75</sub> Ge <sub>0,25</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,89	_	9,1	[109]	
Zr <sub>0,75</sub> Ga <sub>0,9</sub> Ge <sub>1,35</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,82	14,98	3,79	[109]	
ZrGa <sub>0,5</sub> Ge <sub>1,5</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,804	14,975	3,765	[18]	
ZrGa <sub>0,1</sub> Ge <sub>0,9</sub>	TlI	oS8	Стст	3,83	10,12	3,83	[38]	

n ·	• •	1 (	1
Закінчення	таюлиш	1.4	J
	тасынці	<b>I</b> • >	^

1	2	3	4	5	6	7	8
HfGa <sub>0,82-0,67</sub> × ×Ge <sub>1,18-1,33</sub>	ZrSi <sub>2</sub>	oS12	Стст	3,80714	14,6270 <sup>4</sup>	3,7850 <sup>4</sup>	[110]
Zr <sub>5</sub> GaSn <sub>3</sub>	Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub>	<i>hP</i> 18	$P6_3/mcm$	8,6599		5,8794	[95]
$Zr_5Ga_{0,52}Sn_{2,48}$	Nb <sub>5</sub> Sn <sub>2</sub> Si	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,1656	_	5,5545	[112]
$Hf_{3}Ga_{1,97}Sn_{1,03}$	Hf <sub>3</sub> Ga <sub>2</sub> Sn	oP24	Pbcm	9,337	8,692	5,665	[116]
Hf <sub>5</sub> GaSn <sub>3</sub>	Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub>	<i>hP</i> 18	P6 <sub>3</sub> /mcm	8,5564	—	5,7859	[114]
$ \begin{array}{c} Hf_{5}Ga_{1,24\text{-}0,52}\times\\ \times Sn_{1,76\text{-}2,48} \end{array} $	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,00425	_	5.55987 <sup>5</sup>	[113]
Ti <sub>5</sub> Ga <sub>3-1,5</sub> Sb <sub>0-1,5</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	P6 <sub>3</sub> /mcm	7,7836	_	5,3456	[101]
Ti <sub>5</sub> GaSb <sub>2</sub>	$W_5Si_3$	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,642		5,327	[98]
$Zr_5Ga_{0,8}Sb_{2,2}$	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,073	_	5,541	[98]
$Zr_5Ga_{0-3}Sb_{3-0}$	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	P6 <sub>3</sub> /mcm	8,2487		5,6967	[101]
Hf <sub>2</sub> GaSb <sub>3</sub>	Zr <sub>2</sub> CuSb <sub>3</sub>	tP6	<i>P</i> -4 <i>m</i> 2	3,89841	_	8,62650	[117]
HfGa <sub>0,1</sub> Sb <sub>0,9</sub>	FeSi	cP8	<i>P</i> 2 <sub>1</sub> 3	5,5752	_	_	[115]
Hf <sub>5</sub> GaSb <sub>3</sub>	Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub>	<i>hP</i> 18	P6 <sub>3</sub> /mcm	8,4747	-	5,7190	[115]
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,849728	_	5,50154 <sup>8</sup>	[115]

Примітки: <sup>1</sup>для складу TiGa<sub>0,3</sub>Si<sub>1,7</sub>; <sup>2</sup>для складуTi<sub>5</sub>Ga<sub>1,25</sub>Si<sub>1,75</sub>; <sup>3</sup>для складу ZrGa<sub>0,8</sub>Si<sub>0,2</sub>; <sup>4</sup>для складу HfGa<sub>0,67</sub>Ge<sub>1,33</sub>; <sup>5</sup>для складу Hf<sub>5</sub>Ga<sub>0,60</sub>Sn<sub>2,40</sub>; <sup>6</sup>для складу Ti<sub>5</sub>Ga<sub>1,5</sub>Sb<sub>1,5</sub>; <sup>7</sup>для складу Zr<sub>5</sub>Ga<sub>1,5</sub>Sb<sub>1,5</sub>; <sup>8</sup>для складу Hf<sub>5</sub>Ga<sub>1,5</sub>Sb<sub>1,5</sub>.

# 1.3.3. Системи {Nb,Ta}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}

Серед систем {Nb,Ta}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} лише для систем Nb–Al–Si та Ta–Al–Si побудовані ізотермічні перерізи діаграм стану при 1400°С. Системи Nb–Al–{Ge,Sn,Sb} досліджували на предмет утворення тернарних сполук і твердих розчинів на основі бінарних сполук. У літературі відсутні відомості про взаємодію компонентів у системах Ta–Al–{Ge,Sn,Sb}.

У потрійній системі Nb–Al–Si при 1400°С (рис. 1.25) [118] встановлено існування двох тернарних сполук: NbAl<sub>0,6</sub>Si<sub>1,4</sub> [119] і Nb<sub>5</sub>Al<sub>1,5</sub>Si<sub>1,5</sub> [118].



Рис. 1.25. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Nb-Al-Si при 1400°С.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Ta–Al–Si побудовано при 1400°C в повному концентраційному інтервалі (рис. 1.26) [120]. Встановлено утворення твердих розчинів на основі трьох бінарних сполук: TaSi<sub>2</sub> (CT CrSi<sub>2</sub>), Ta<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (CT Cr<sub>5</sub>B<sub>3</sub>) і Ta<sub>2</sub>Si (CT CuAl<sub>2</sub>) протяжністю 21, 17 і 10 ат.% Al, відповідно. Тернарних сполук не знайдено.



Рис. 1.26. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Та-Al-Si при 1400°С.

У системі Nb–Al–Ge повідомлено про існування і кристалічну структуру тернарної фази сполуки Nb<sub>3</sub>Al<sub>0,5</sub>Ge<sub>0,5</sub> [121].

У системі Nb–Al–Sn встановлено утворення НРТР між ізоструктурними бінарними сполуками Nb<sub>3</sub>Al та Nb<sub>3</sub>Sn (CT Cr<sub>3</sub>Si) [122] і тернарної сполуки сполуки Nb<sub>5</sub>AlSn<sub>2</sub> [94]. НРТР зі структурою типу Cr<sub>3</sub>Si також утворюється між ізоструктурними бінарними сполуками Nb<sub>3</sub>Al та Nb<sub>3</sub>Sb у системі Nb–Al–Sb [101].

Кристалографічні характеристики тернарних фаз систем {Nb,Ta}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb} наведено в табл. 1.10.

Таблиця 1.10

# Кристалографічні характеристики тернарних сполук

систем {Nb,Ta}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}

Споти	СТ СП		пг	Парам	Πίπ		
Сполука	CI	CII	111	а	b	С	JIII.
NbAl <sub>0-0,28</sub> Si <sub>2-1,72</sub>	CrSi <sub>2</sub>	hP9	P6 <sub>2</sub> 22	<b>4,</b> 81 <sup>1</sup>	_	6,64 <sup>1</sup>	[119]
NbAl <sub>0,6</sub> Si <sub>1,4</sub>	TiSi <sub>2</sub>	oF24	Fddd	8,403	4,901	8,794	[119]
Nb <sub>5</sub> Al <sub>1,5</sub> Si <sub>1,5</sub>	W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,160	_	5,081	[118]
Nb <sub>3</sub> Al <sub>1-0,5</sub> Si <sub>0-0,5</sub>	Cr <sub>3</sub> Si	cP8	Pm-3n	5,17 <sup>2</sup>	_	_	[123]
TaAl <sub>0-0,9</sub> Si <sub>2-1,1</sub>	CrSi <sub>2</sub>	hP9	P6 <sub>2</sub> 22	4,810 <sup>3</sup>	_	6,648 <sup>3</sup>	[120]
Ta <sub>5</sub> Al <sub>0-1,41</sub> Si <sub>3-1,59</sub>	Cr <sub>5</sub> B <sub>3</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	6,563 <sup>4</sup>	_	11,991 <sup>4</sup>	[120]
Ta <sub>2</sub> Al <sub>0-0,3</sub> Si <sub>1-0,7</sub>	CuAl <sub>2</sub>	<i>tI</i> 12	I4/mcm	6,190 <sup>5</sup>	_	5,058 <sup>5</sup>	[120]
Nb <sub>3</sub> Al <sub>0,5</sub> Ge <sub>0,5</sub>	Cr <sub>3</sub> Si	cP8	Pm-3n	5,173	_	_	[121]
Nb <sub>5</sub> AlSn <sub>2</sub>	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	<i>tI</i> 32	I4/mcm	10,629	_	5,216	[94]
Nb <sub>3</sub> Al <sub>0-1</sub> Sn <sub>1-0</sub>	Cr <sub>3</sub> Si	cP8	Pm-3n	5,255 <sup>6</sup>	_	_	[122]
Nb <sub>3</sub> Al <sub>1-0</sub> Sb <sub>0-1</sub>	Cr <sub>3</sub> Si	cP8	Pm-3n	5,223 <sup>7</sup>	_	_	[101]
	склалу М	Alasii	- <sup>2</sup> лпя	склалу	Nb2Alo5Sio	с <sup>3</sup> лпя (	склалу

(виділено тверді розчини на основі бінарних сполук)

Примітки: <sup>1</sup>для складу NbAl<sub>0,3</sub>Si<sub>1,7</sub>; <sup>2</sup>для складу Nb<sub>3</sub>Al<sub>0,5</sub>Si<sub>0,5</sub>; <sup>3</sup>для складу TaAl<sub>0,9</sub>Si<sub>1,1</sub>; <sup>4</sup>для складу Ta<sub>5</sub>Al<sub>1,59</sub>Si<sub>1,41</sub>; <sup>5</sup>Ta<sub>2</sub>Al<sub>0,3</sub>Si<sub>0,7</sub>; <sup>6</sup>для складу Nb<sub>3</sub>Al<sub>0,5</sub>Sn<sub>0,5</sub>; <sup>7</sup>для складу Nb<sub>3</sub>Al<sub>0,5</sub>Sb<sub>0,5</sub>.

# 1.4. Висновки з огляду літератури. Обґрунтування вибору об'єктів дослідження

Компоненти потрійних систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} відрізняються за фізико-хімічними властивостями (температури топлення і кипіння, густина речовин, розміри, електронегативність атомів), що, очевидно, матиме вплив на їхню взаємодію. Цирконій і гафній є *d*-металами 4 групи періодичної системи елементів і характеризуються однаковою будовою зовнішнього електронного рівня (4d<sup>2</sup>5s<sup>2</sup> і 5d<sup>2</sup>6s<sup>2</sup>, відповідно), що, мабуть, проявиться у подібності діаграм стану систем за участю Zr i Hf та однаковими парами *p*-елементів. Si, Ge i Sn є р-елементами 14 групи і, відповідно, також характеризуються однаковою будовою зовнішнього електронного рівня ( $3s^23p^2$ ,  $4s^24p^2$  і  $5s^25p^2$ , відповідно), однак електронегативністю, відрізняються за розмірами атомів, густиною, температурами топлення і кипіння. Таким чином, дослідження різних потрійних систем за участю цих компонентів дасть можливість прослідкувати зміну характеру взаємодії компонентів при переході від Si (металоїд) до Sn (метал). Заміна Sn на Sb у потрійних системах уможливить аналіз зміни характеру фазових рівноваг у відповідних потрійних системах при переході від *p*-елемента 14 групи (Sn) до *p*-елемента 15 групи (Sb) періодичної системи елементів, тобто при зміні конфігурації зовнішнього електронного рівня третього компонента від  $5s^25p^2$  до  $5s^25p^3$ . З огляду на кристалографічні характеристики компонентів потрійних систем  $\{Zr, Hf\}$ -Al- $\{Si, Ge, Sn, Sb\}$  простежується як їхня закономірна схожість так і деякі характерні особливості. Так, при температурі 600°С кристалічні структури цирконію та гафнію належать до структурного типу Mg, алюміню – до CT Cu, кремнію та ґерманію – до СТ С(алмаз), олова – до власного типу структури, а стибію – до СТ As. Це дозволяє зробити припущення, що характер взаємодії компонентів у потрійних системах {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} з Si та Ge буде найбільш схожим між собою і в той же час буде відмінним від характеру взаємодії компонентів у системах з Sn та Sb. Системи з різними *d*-металами, очевидно, будуть попарно подібними між собою.

Подвійні системи, що обмежують досліджувані потрійні системи, вивчені досить повно. Для більшості з них побудовані діаграми стану, кристалічні структури бінарних сполук встановлені. В результаті аналізу взаємодії компонентів у подвійних системах, видно, що є суттєва відмінність діаграм стану систем з d-елементами, {Zr,Hf}-{Al,Si,Ge,Sn,Sb}, від систем, які містять лише p-елементи, Al-{Si,Ge,Sn,Sb}. Для першої групи подвійних систем характерним є утворення різної кількості бінарних сполук (від 3 у системі Zr–Sn до 10 у системі Zr–Al), тоді як серед чотирьох систем другої групи лише у системі зі Sb утворюється бінарна сполука. Така відмінність, вочевидь, призведе до відмінностей у характері взаємодії трьох компонентів.

У результаті узагальнення та систематизації літературних відомостей про кристалічні структури бінарних сполук, встановлено, що структури більшості сполук *d*-елементів з Al належать до гексагональної та тетрагональної сингоній (по вісім сполук у системах Zr–Al і Hf–Al, відповідно), структури чотирьох сполук до ромбічної та однієї сполуки – до кубічної сингоній. У системах *d*-елементів з Si, Ge, Sn та Sb структури найбільшої кількості сполук належать до ромбічної сингонії (18 сполук), а також 12 сполук – до тетрагональної, 11 сполук – до гексагональної, чотирьох сполук – до кубічної та однієї сполуки – до моноклінної сингонії. Кристалічна структура єдиної бінарної сполуки з двома *p*-елементами, AlSb, належить до кубічної сингонії. При температурі 600°C всі бінарні сполуки характеризуються постійними складами. Для деяких бінарних сполук характерний температурний поліморфізм. Це може привести до утворення тернарних фаз у досліджуваних системах при 600°C, шляхом стабілізації третім компонентом поліморфних модифікацій бінарних сполук, що існують при температурах, відмінних від температури дослідження.

У кожній з потрійних систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} серед бінарних сполук цирконію чи гафнію є пари ізостехіометричних сполук, однак ізоструктурними є лише пари сполук Hf<sub>2</sub>Al–Hf<sub>2</sub>Si і Hf<sub>2</sub>Al–Hf<sub>2</sub>Ge (CT CuAl<sub>2</sub>). Отже, очікувати утворення HPTP можна лише у системах Hf–Al–Si і Hf–Al–Ge між зазначеними сполуками. З огляду на постійний склад бінарних сполук систем

 ${Zr,Hf}-{Al,Si,Ge,Sn,Sb},$  а також взаємну розчинність *p*-елементів у подвійних системах Al-{Si,Ge,Sn,Sb}, можна спрогнозувати утворення обмежених твердих розчинів заміщення на основі бінарних сполук при сталому вмісті Zr чи Hf. Тернарні сполуки систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} характеризуватимуться постійним складом чи невеликими областями гомогенності вздовж ізоконцентрат Zr i Hf.

Аналізуючи літературні відомості про взаємодію компонентів у споріднених до досліджуваних потрійних системах, ми розглянули такі групи систем: {Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} – досліджувані у дисертаційній роботі системи і споріднені до них системи з титаном; {Ti,Zr,Hf}-Al-{Pb,Bi} – системи d-металів групи титану з алюмінієм і р-елементами 14 і 15 груп періодичної системи елементів – для визначення впливу ізовалентної заміни *p*-елементів на характер взаємодії компонентів; {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb} – системи *d*-металів підгрупи титану з галієм і *p*-елементами 14 і 15 груп – для визначення впливу ізовалентної 13 взаємодії заміни р-елементів групи характер компонентів; на  ${Nb,Ta}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}$  – для визначення впливу заміни *d*-елемента на характер взаємодії компонентів.

Із літературних відомостей про взаємодію компонентів у потрійних системах  ${Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi}$  можна зробити низку висновків. З-поміж досліджуваних у дисертаційній роботі систем, лише для системи Zr–Al–Si побудовано ізотермічний переріз діаграми стану, однак при інших температурах – 700 і 1200°С. Слід зазначити, що відповідні перерізи суттєво відрізняються між собою як за кількістю та стехіометрією тернарних сполук, протяжностями твердих розчинів на основі бінарних сполук, так і за фазовими рівновагами, що вказує на суттєвий вплив температури на характер взаємодії компонентів. Таким чином, можна констатувати, що з огляду на існування бінарних сполук з різною стехіометрією, чи кристалічною структурою при різних температурах, здійснення систематичних досліджень взаємодії компонентів у різних системах при одній температурі є необхідною умовою коректності аналізу і висновків щодо взаємодії компонентів. Загалом, у системах  ${Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}$  встановлено існування 11 тернарних сполук і 9 твердих розчинів на основі бінарних розчинів на основі бінарних розчинів на основі бінарних у системах  ${Zr,Hf}$ -Al- ${Si,Ge,Sn,Sb}$  встановлено існування 11 тернарних сполук і 9 твердих розчинів на основі бінарних сполук при різних

температурах. Для більшості цих фаз не визначено параметрів кристалічної структури, а лише встановлено структурний тип і параметри елементарної комірки. Крім того, для окремих фаз не визначено їхню природу (індивідуальні тернарні сполуки чи склади з областей твердих розчинів заміщення чи включення на основі бінарних сполук). В результаті аналізу кристалічних структур усіх тернарних фаз (22 сполуки і 16 твердих розчинів) у системах {Ti,Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi}, спостережено, що більшість з них належить до тетрагональної сингонії (22 фаз), а також до ромбічної (8 фаз) та гексагональної (8 фаз) сингоній. Найбільшою кількістю представників характеризується структурний тип  $W_5Si_3$  (п'ять сполук) і його тернарний варіант Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> (чотири сполуки).

Серед систем {Ti,Zr,Hf}–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb} ізотермічні перерізи діаграм стану побудовані в повних концентраційних інтервалах для систем Hf–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb} і в часткових – для систем {Ti,Zr}–Ga–Si. Решта систем досліджували лише на предмет утворення тернарних сполук окремих складів, або або відомості про такі системи у літературі відсутні.

На ізотермічних перерізах діаграм стану систем Hf–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С можна виділити області, подібні за характером взаємодії компонентів. Область з вмістом від 0 до 50 ат.% Hf характеризується відсутністю значної розчинності третього компонента в бінарних сполуках. В області з вмістом від 50 до 100 ат.% Hf спостерігається утворення твердих розчинів різної протяжності на основі бінарних сполук, в тому числі HPTP між ізоструктурними бінарними сполуками. Системи Hf–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb} подібні попарно. У системах Hf–Ga–{Si,Ge} утворюється по одній тернарній сполуці та по два HPTP. Кожна тернарна сполука домінує в утворенні рівноваг. У системах Hf–Ga–{Sn,Sb} подібності спостерігаються в області великого вмісту Hf. Перерізи Hf<sub>3</sub>Ga<sub>3</sub>–Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> та Hf<sub>3</sub>Ga<sub>3</sub>–Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> є квазібінарними системами з твердими розчинами заміщення значної протяжності на основі сполуки Hf<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>) та тернарними сполуками зі CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> з великими областями гомогенності вздовж ізоконцентрат 62,5 ат.% Hf. У системі Hf–Ga–Sn на основі сполуки Hf<sub>5</sub>GaSn<sub>3</sub>, а у системі Hf–Ga–Sb на основі сполуки Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> існує твердий розчин заміщення незначної протяжності, а при складі Hf<sub>5</sub>GaSb<sub>3</sub> утворюється тернарна сполука, ізоструктурна до Hf<sub>5</sub>GaSn<sub>3</sub> (CT Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>).

У системах {Ti,Zr,Hf}–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb} утворюється відносно невелика кількість сполук, максимально – чотири у системі Hf–Ga–Sb. Кристалічні структури тернарних фаз належать до ромбічної (9), тетрагональної (7), гексагональної (7) та кубічної (1) сингоній. Найчастіше реалізуються структурні типи ZrSi<sub>2</sub> (для 5 фаз), Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> (4), Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (4), TlI (3) та Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> (3). Спостерігається подібність з кристалічними структурами тернарних фаз з алюмінієм, для яких одним з найчастіше реалізованих типів структур є CT W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> i Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>.

Ряд систем {Nb,Ta}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} на сьогодні є недостатньо вивченим. Лише для систем Nb–Al–Si та Ta–Al–Si побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану при 1400°С. Інші системи досліджували на предмет утворення тернарних сполук і твердих розчинів на основі бінарних сполук. Відомостей про взаємодію компонентів у системах Ta–Al–{Ge,Sn,Sb} у літературі немає. Для систем з кремнієм спільним є утворення твердих розчинів заміщення на основі бінарних силіцидів зі CT CrSi<sub>2</sub>. Для всіх систем Nb–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} характерним є існування тернарних фаз зі CT Cr<sub>3</sub>Si – твердого розчину заміщення на основі Nb<sub>3</sub>Al у системі з Si, тернарної сполуки у системі з Ge, HPTP між відповідними ізоструктурними бінарними споуками у системах зі Sn та Sb. Загалом, кристалічні структури тернарних фаз систем {Nb,Ta}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} належать до тетрагональної та кубічної (по 4 фази), гексагональної (2) та ромбічної (1) сингоній.

У табл. 1.11 узагальнено відомості про дослідження діаграм стану потрійних систем з алюмінієм та кількість тернарних сполук, що в них утворюються.

З огляду на ступінь дослідженості споріднених потрійних систем, особливості фазових рівноваг і кристалографічні характеристики тернарних фаз, можна стверджувати, що систематичне дослідження фазових рівноваг і кристалічної структури тернарних сполук і твердих розчинів у потрійних системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при однакових умовах є актуальним і своєчасним.

Можна спрогнозувати:

- у системах буть утворюватись тверді розчини заміщення на основі бінарних сполук і тернарні сполуки як постійних, так і змінних складів вздовж ізоконцентрат *d*-елементів;
- між ізоструктурними бінарними сполуками утворюватимуться неперервні ряди твердих розчинів;
- у структурах тернарних сполук можуть утворюватись статистичні суміші атомів *p*-елементів, однак повинна проявитись тенденція до впорядкування атомів і, можливо, реалізація повністю впорядкованих тернарних структур;
- домінуватиме тетрагональна та гексагональна симетрія структур, можлива стехіометрія тернарних сполук *T*(Al<sub>1-x</sub>*M<sub>x</sub>*)<sub>3</sub>, *T*<sub>5</sub>Al*M*<sub>3</sub>, *T*<sub>5</sub>(Al<sub>1-x</sub>*M<sub>x</sub>*)<sub>3</sub>, що відповідатимуть структурним типам TiAl<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>);
- порівняння досліджених систем з іншими системами, які містять d-елемент та два p-елементи, дасть змогу виявити закономірності взаємодії компонентів і у подальшому спрогнозувати практичне застосування нових фаз.

Таблиця 1.11

	<i>d</i> -елемент								
р-елемент	Ti	Zr	Hf	Nb	Та				
Si	▲ 2	▲ 3	2	▲ 2	▲ 0				
Ge	$\Delta$ 3		1	1					
Sn	$\Delta$ 1	2	1	1					
Sb	$\Delta$ 1	2	2						

Дослідженість потрійних систем {Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}

Примітки: ▲ – ізотермічні перерізи діаграм стану побудовані в повному концентраційному інтервалі;

страни перерізи діаграм стану побудовані в частковому концентраційному інтервалі;

число – кількість тернарних сполук;

сірим кольором виділено системи {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb}.

#### **РОЗДІЛ 2**

#### МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Для дослідження взаємодії компонентів у потрійних системах {Zr,Hf}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb} застосували класичні методи, розроблені методики дослідження і обладнання, які використовують науковці кафедри неорганічної хімії. Сплави синтезували в електродуговій печі безпосереднім сплавлянням компонентів і подальшим гомогенізаційним відпалюванням. Фазові рівноваги і кристалічну структуру тернарних фаз систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} визначали за допомогою рентгенівських дифракційних методів порошку (рентгенівський фазовий і структурний аналізи) і монокристалу (структурний аналіз). Кількісний елементний склад індивідуальних фаз встановлювали методом локального рентгеноспектрального аналізу.

#### 2.1. Синтез зразків

#### 2.1.1. Вихідні матеріали

Вихідними компонентами для виготовлення сплавів для досліджень були компактні речовини з таким вмістом основного компонента: цирконій – 99,95 мас.%; гафній – 99,95 мас.%; алюміній – 99,99 мас.%; кремній – 99,999 мас.%; германій – 99,999 мас.%, олово – 99,99 мас.%; стибій – 99,97 мас.%.

#### 2.1.2. Синтез та контроль складу сплавів

Зразки масою до 1 г ситезували сплавлянням суміші вихідних компонентів (зважених з точністю до 0,001 г) в електродуговій печі, що оснащена мідним подом, який охолоджується потоком води. Експеримент проводили в атмосфері очищеного аргону при тиску 1 атм. Для додаткового очищення газової атмосфери перед сплавлянням кожної партії зразків (максимум 11) першим сплавляли пористий титан, що слугував гетером. Електричну дугу отримували між мідним подом і вольфрамовим електродом. Для досягнення однорідності сплавів, їх перевертали та повторно переплавляли. Для компенсації неконтрольованої втрати стибію під час сплавляння, його зважували у надлишку 3 мас.%.

Контроль складу забезпечували порівнянням маси вихідних компонентів з масою сплаву. Склад сплаву приймали рівним складу вихідної суміші компонентів, якщо втрати маси після сплавляння були меншими за 1 %. Крім того, склади синтезованих зразків перевіряли методом рентгенфлуоресцентної спектроскопії за допомогою аналізатора ElvaX Pro [124].

### 2.1.3. Термічна обробка сплавів

Гомогенізацію сплавів здійснювали шляхом їхнього відпалювання при температурі 600°С впродовж 1 місяця у кварцових ампулах під вакуумом. Перед запаюванням в ампули сплави загортали в танталову фольгу для запобігання контакту між ними. Термічну обробку проводили в муфельній електропечі VULCAN A-550 з автоматичним регулюванням температури з точністю  $\pm$  5°С. Запаяні в ампулах відпалені сплави загартовували у холодній воді. Температуру відпалу 600°С було обрано, опираючись на діаграми стану подвійних систем що обмежують досліджувані потрійні, а саме на температури плавлення вихідних компонентів та границь ліквідусів. Крім цього, згідно з діаграмами стану подвійних систем, при вибраній температурі відпалу існує переважна більшість бінарних сполук, а отже існує ймовірність утворення більшої кількості тернарних сполук. Гомогенність та рівноважність синтезованих зразків контролювали рентгенографічно.

#### 2.2. Рентгенівські методи дослідження

#### 2.2.1. Рентгенівський дифракційний фазовий аналіз

Основним методом для побудови ізотермічних перерізів діаграм стану потрійних систем був рентгенівський дифракційний фазовий аналіз. Цей метод заснований на фундаментальних особливостях рентгенівського проміння –

здатності проникати у речовину і дифрагувати від структурних одиниць кристалічної речовини, які повторюються періодично в просторі. Він дає можливість встановити присутність у зразках тих чи інших кристалічних фаз і визначити їхню структуру [125]. Рентгенівський дифракційний фазовий аналіз здійснювали шляхом порівняння експериментальних порошкових дифрактограм синтезованих зразків між собою, а також із розрахованими за допомогою пакету програм WinXPow [126], дифрактограмами простих речовин, бінарних і тернарних сполук досліджуваних і споріднених систем.

Досліджувані сплави подрібнювали та розтирали в порошок в агатовій ступці, наносили на кювети, які поміщали на гоніометри дифрактометрів для експозиції. Порошкові рентгенограми отримували в кроковому режимі сканування на дифрактометрах ДРОН-2.0М (проміння Fe Ka, мангановий фільтр для відсійювання  $\beta$ -відбиттів, крок сканування  $0,05^{\circ} 2\theta$ , інтервал сканування  $20^{\circ} \le 2\theta \le 100-140^{\circ}$ , геометрія Брегта-Брентано) та STOE Stadi P (проміння Cu Ka<sub>1</sub>, увігнутий Ge[111] монохроматор типу Іоганна, крок детектора  $0,015^{\circ} 2\theta$ , інтервал сканування  $6^{\circ} \le 2\theta \le 110^{\circ}$ , модифікована геометрія Гіньє).

На основі здійсненого дифракційного ретгенофазового аналізу зразків встановлено фазові рівноваги у системах, і методом триангуляції були побудовані ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}.

# 2.2.2. Локальний енергодисперсійний рентгенівський спектральний аналіз

Локальний рентгеноспектральний аналіз використовували для визначення хімічного складу фаз у сплавах систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, а також для підтвердження фазових рівноваг, визначених фазовим аналізом за допомогою рентгенівської дифракції.

Локальний рентгеноспектральний аналіз полікристалічних зразків проводили на растровому електронному мікроскопі РЕММА-102-02, оснащеному енергодисперсійним рентгенівським спектрометром ЕДАР та на скануючому електронному мікроскопі Tescan Vega 3 LMU, оснащеному двома детекторами (вторинних електронів і зворотно розсіяних електронів) та енергодисперсійним рентгенівським аналізатором Oxford Instruments Aztec ONE з детектором X-Max<sup>N</sup>20. Сплави для аналізу запаяювали у струмопровідні металічні кільця за допомогою сплаву Вуда, шліфували та полірували за допомогою шліфувального паперу з різною абразивністю, а на фінальних стадіях підготовки — з дрібнодисперсним порошком  $Cr_2O_3$ . Загальний склад сплавів отримували на плоских ділянках площею  $1 \times 1 \text{ мм}^2$ , а локальний хімічний склад індивіальних фаз – на основі усереднення 4-5 точкових складів однакових зерен.

#### 2.2.3. Рентгеноструктурний аналіз методом монокристалу

Монокристали правильної форми для прецизійного визначення кристалічної структури тернарних сполук ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> і Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> відбирали за допомогою оптичного мікроскопа з гомогенізованих зразків Zr<sub>33,3</sub>Al<sub>10</sub>Ge<sub>56,7</sub> і Zr<sub>55,6</sub>Al<sub>11,1</sub>Ge<sub>33,3</sub>, відповідно.

Дифракційні дані від монокристалів отримували при кімнатній температурі на монокристальному дифрактометрі Rigaku AFC7, оснащеному детектором Mercury CCD (проміння Мо Ка, графітовий монохроматор). Корекцію експериментальних даних на поглинання здійснювали за допомогою процедури *"multi-scan"* (кількаразове сканування вибраних брегтівських відбиттів в різних напрямах кристалу). Для обробки дифракційних даних, у тому числі корегування на поглинання, використовували програмне забезпечення d\*TREK, що керує роботою дифрактометра.

Визначення та уточнення кристалічних структур проводили за допомогою пакету програм WinCSD [127]. Кристалічні структури сполук визначали прямими методами, а координати, ізотропні та анізотропні параметри зміщення атомів уточнювали методом найменших квадратів. Одним із критеріїв достовірності моделі структури є відсутність максимумів чи мінімумів на різницевих синтезах Фур'є та значення факторів розбіжності та добротності:

$$R = \frac{\sum \|F_{a}\| - |F_{c}|}{\sum |F_{a}|} - \phi$$
актор розбіжності;  

$$wR = \left\{ \frac{\sum \left[ w \left(F_{o}^{2} - F_{c}^{2}\right)^{p} \right]}{\sum \left[ w \left(F_{o}^{2}\right)^{2} \right]^{p}} \right\}^{1/2} -$$
зважений фактор розбіжності;  

$$S = \left\{ \frac{\left[ w \left(F_{o}^{2} - F_{c}^{2}\right)^{2} \right]}{(n-p)} \right\}^{1/2} - \phi$$
актор добротності,

де  $F_o$  та  $F_c$  – спостережувані та розраховані структурні фактори; w – ваговий коефіцієнт; n – кількість відбиттів; p – кількість уточнюваних параметрів.

#### 2.2.4. Рентгеноструктурний аналіз методом порошку

Метод полягає в уточненні кристалічних структур сполук в результаті математичної обробки експериментальних масивів рентгенівських дифракційних даних від порошкових (полікристалічних) зразків, отриманих на дифрактометрах [125, 128].

Експериментальні дифрактограми отримували при кімнатній температурі на дифрактометрах ДРОН-2.0М (проміння Fe Ka, манґановий β-фільтр, крок сканування 0,05° 2 $\theta$ , інтервал сканування 20°  $\leq 2\theta \leq 100-140^{\circ}$ , геометрія Бреґґа-Брентано) та STOE Stadi P (проміння Cu Ka<sub>1</sub>, увігнутий Ge[111] монохроматор типу Іоганна, крок детектора 0,015° 2 $\theta$ , інтервал сканування 6°  $\leq 2\theta \leq 110^{\circ}$ , модифікована геометрія Гіньє).

Під час підготовки зразків, їх розтирали до дрібнодисперсного порошку в агатовій ступці, в окремих випадках отримані порошки просійювали через сита, наносили на кювети, які поміщали на гоніометри дифрактометрів для експозиції.

Параметри профілю та структури уточнювали, використовуючи алгоритм Рітвельда [129], за допомогою пакету програм FullProf Suite [130]. Цей метод передбачає наявність вихідної моделі структури для уточнення і ґрунтується на математичному методі найменших квадратів. Як вихідні моделі структур використовували координати атомів у прототипах (структурних типах) чи параметри структур споріднених сполук. Параметри профілю включають в себе такі параметри як відносне зміщення зразка (геометрія Бретта-Брентано) або товщину зразка (для масивів даних знятих на проходження), параметри елементарної комірки, параметри форми піків дифрактограми (функція профілю псевдо-Войта), параметр змішування піків та параметри асиметрії піків дифрактограми. Поміж уточнюваних параметрів структури були координати атомів, коефіцієнти заповнення кристалографічних позицій, ізотропні параметри зміщення (теплового коливання) атомів та параметри домінуючої орієнтації кристалічних зерен (текстурованості). Використовуючи поліномні функції з задіянням алгоритму фільтрування Фур'є уточнювали фон усього профілю експериментальних дифрактограм.

Правильність обраної моделі оцінювали за значеннями факторів розбіжності та добростності:

$$\begin{split} R_{B} &= \frac{\sum_{k} |I_{k} - I_{k,c}|}{\sum_{k} |I_{k}|} & - \text{ брегтівський структурний фактор розбіжності;} \\ R_{p} &= \frac{\sum_{i} |y_{i} - y_{c,i}|}{\sum_{i} |y_{i}|} & - \text{ профільний фактор розбіжності;} \\ R_{wp} &= \left(\frac{\sum_{i} w_{i} (y_{i} - y_{c,i})^{2}}{\sum_{i} w_{i} (y_{i})^{2}}\right)^{\frac{1}{2}} & - \text{ зважений профільний фактор розбіжності;} \\ \chi^{2} &= \left(\frac{R_{wp}}{R_{exp}}\right)^{2} & - \text{ фактор добротності опису профілю;} \\ R_{exp} &= \left(\frac{(N - P + C)}{\sum_{i} w_{i} (y_{i})^{2}}\right)^{\frac{1}{2}} & - \text{ очікуваний фактор розбіжності,} \end{split}$$

де  $y_i$  та  $y_{c,i}$  – спостережувана та розрахована інтенсивність відбиття на *i*-му кроці;  $w_i = \frac{1}{y_i}$ ;  $I_k$  та  $I_{k,c}$  – спостережувана та розрахована інтенсивність відбиттів; N – кількість виміряних точок; P – кількість параметрів, які уточнювали; C – кількість пов'язаних параметрів. Структуру вважали достовірно визначеною при значенні брегтівського фактора менше 0,1.

#### 2.3. Кристалохімічний аналіз структур

Під час аналізу та опису кристалічних структур тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} використовували фундаментальні засади кристалографії [131], а також кристалохімічні параметри, такі як міжатомні віддалі, координаційні числа і многогранники атомів. Для аналізу кристалохімічних особливостей структур, експериментально визначені параметри були стандартизовані за **STRUCTURE** TIDY [132] допомогою програми та Міжнародних кристалографічних таблиць [133]. Під час опису координаційного оточення атомів у структурах тернарних інтерметалідів використовували систематику структурних типів П.І. Крип'якевича [134], в основі якої лежить координація атомів малого розміру. Під час встановлення взаємозв'язків між структурами бінарних і тернарних сполук також аналізували особливості їхньої побудови, як зрощення сіток атомів, шарів поліедрів чи фрагментів простіших структурних типів інтерметалічних слолук [135].

#### РОЗДІЛ З

## РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

#### 3.1. Фазові рівноваги в потрійних системах

Ізотермічні перерізи при 600°С діаграм стану потрійних систем {Zr,Hf}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb} побудовано в повних концентраційних інтервалах з використанням методів рентгенівського фазового, структурного та локального спектрального аналізів.

# 3.1.1. Бінарні сполуки систем {Zr,Hf}–Al, {Zr,Hf}–{Si,Ge,Sn,Sb} та {Zr,Hf}–Sb

З огляду на те, що подвійні системи {Zr,Hf}–Al, {Zr,Hf}–{Si,Ge,Sn,Sb} та {Zr,Hf}–Sb досліджені достатньо ґрунтовно, то під час виконання роботи двокомпонентні сплави синтезували з метою підтвердження існування при 600°C бінарних сполук та їхніх кристалічних структур. Загалом синтезовано та досліджено фазовий склад 61 двокомпонентного зразка.

Рентгенівськими дифракційним та спектральним методомами при температурі дослідження (600°С) підтверджено існування та типи структур:

- 15 бінарних алюмінідів: Zr<sub>3</sub>Al (CT Cu<sub>3</sub>Al), Zr<sub>2</sub>Al (CT Co<sub>1,75</sub>Ge), Zr<sub>3</sub>Al<sub>2</sub> (CT Zr<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>), Zr<sub>4</sub>Al<sub>3</sub> (CT Zr<sub>4</sub>Al<sub>3</sub>), ZrAl (CT TII), Zr<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> (CT Zr<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>), ZrAl<sub>2</sub> (CT MgZn<sub>2</sub>), ZrAl<sub>3</sub> (CT ZrAl<sub>3</sub>), Hf<sub>2</sub>Al (CT CuAl<sub>2</sub>), Hf<sub>3</sub>Al<sub>2</sub> (CT Zr<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>), Hf<sub>4</sub>Al<sub>3</sub> (CT Zr<sub>4</sub>Al<sub>3</sub>), HfAl (CT TII), Hf<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> (CT Zr<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>), HfAl<sub>2</sub> (CT MgZn<sub>2</sub>), HfAl<sub>3</sub> (CT ZrAl<sub>3</sub>);
- 13 бінарних силіцидів: Zr<sub>3</sub>Si (CT Ti<sub>3</sub>P), Zr<sub>2</sub>Si (CT CuAl<sub>2</sub>), Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), Zr<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> (CT U<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>), Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> (CT Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>), ZrSi (CT FeB), ZrSi<sub>2</sub> (CT ZrSi<sub>2</sub>), Hf<sub>2</sub>Si (CT CuAl<sub>2</sub>), Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), Hf<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> (CT U<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>), Hf<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> (CT Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>), HfSi (CT FeB), HfSi<sub>2</sub> (CT ZrSi<sub>2</sub>);

- 11 бінарних германідів: Zr<sub>3</sub>Ge (CT Ti<sub>3</sub>P), Zr<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), Zr<sub>5</sub>Ge<sub>4</sub> (CT Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>), ZrGe (CT FeB), ZrGe<sub>2</sub> (CT ZrSi<sub>2</sub>), Hf<sub>3</sub>Ge (CT Ti<sub>3</sub>P), Hf<sub>2</sub>Ge (CT CuAl<sub>2</sub>), Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), Hf<sub>3</sub>Ge<sub>2</sub> (CT U<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>), Hf<sub>5</sub>Ge<sub>4</sub> (CT Sm<sub>5</sub>Ge<sub>4</sub>), HfGe<sub>2</sub> (CT ZrSi<sub>2</sub>);
- 6 бінарних станідів: Zr<sub>3,2</sub>Sn<sub>0,8</sub> (СТ Cr<sub>3</sub>Si), Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> (СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> (СТ Ті<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub>),
   ZrSn<sub>2</sub> (СТ ТіSi<sub>2</sub>), Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> (СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), HfSn<sub>2</sub> (СТ CrSi<sub>2</sub>);
- 11 бінарних антимонідів: Zr<sub>3</sub>Sb (CT Ni<sub>3</sub>P), Zr<sub>2</sub>Sb (CT La<sub>2</sub>Sb), Zr<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub> (CT Ti<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub>), ZrSb (CT ZrSb), ZrSb<sub>2</sub> (CT PbCl<sub>2</sub>), Hf<sub>3</sub>Sb (CT Ni<sub>3</sub>P), Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> (CT Y<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>), HfSb (CT ZrSb), HfSb<sub>2</sub> (CT TiAs<sub>2</sub>), AlSb (CT ZnS).

## 3.1.2. Системи {Zr,Hf}-Al-Si

Для встановлення фазових рівноваг у системі Zr–Al–Si було виготовлено 17 двокомпонентних та 45 трикомпонентних сплавів, хімічний склад яких зображено на рис. 3.1.



Рис. 3.1. Склад сплавів системи Zr-Al-Si.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Zr–Al–Si при 600°C побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.2). Він містить 21 одно-, 42 дво- та 22 трифазних областей. Бінарні алюмініди цирконію не розчиняють помітної кількості Si, тоді як бінарні силіциди цирконію розчиняють алюміній з утворенням обмежених твердих розчинів заміщення різної протяжності:  $Zr_2Si - 9$  ат.% Al,  $Zr_5Si_3 - 15$  ат.% Al,  $Zr_3Si_2 - 7,5$  ат.% Al,  $Zr_5Si_4 - 6$  ат.% Al, ZrSi - 9,5 ат.% Al та  $ZrSi_2 - 12$  ат.% Al. У системі Zr-Al-Si при 600°C встановлено існування трьох тернарних сполук постійного складу:  $ZrAl_{2,55}Si_{0,45}$ ,  $ZrAl_{0,33}Si_{1,67}$  і  $Zr_5Al_{2,44}Si_{0,56}$  (табл. 3.1). Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (7) характеризується твердий розчин заміщення на основі бінарної сполуки  $Zr_5Si_3$ .



Рис. 3.2. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Zr-Al-Si при 600°С.

Для дослідження фазових рівноваг у системі Hf–Al–Si було виготовлено 14 двокомпонентних та 39 трикомпонентних сплавів, хімічний склад яких зображено на рис. 3.3.


Рис. 3.3. Склад сплавів системи Hf-Al-Si.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Hf-Al-Si при 600°С побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.4). Він містить 17 одно-, 32 дво- та 16 трифазних областей. Між ізоструктурними бінарними сполуками Hf<sub>2</sub>Al i Hf<sub>2</sub>Si (CT CuAl<sub>2</sub>, CП tI12, ПГ I4/mcm) утворюється HPTP. Параметри елементарної комірки зменшуються при заміщенні атомів Al на атоми Si (a = 6,775(3)-6,553(2), c = 5,3969(2)-5,186(2) Å, V = 246,46(6)-222,65(4) Å<sup>3</sup>). На відповідних графіках (рис. 3.5) спостерігається незначне від'ємне відхилення від лінійності (правила Вегарда), зумовлене, очевидно, сильнішою взаємодією між атомами. Інші бінарні алюмініди гафнію практично не розчиняють Si, а бінарні силіциди гафнію розчиняють алюміній з утворенням відповідних обмежених твердих розчинів заміщення різної протяжності: Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> – 13,5 ат.% Al, Hf<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> – 7 2,5 ат.% Аl, ат.% Al, Hf<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> \_ 5.5 ат.% Al, HfSi \_ HfSi<sub>2</sub> 8 ат.% Аl. У системі Hf-Al-Si при 600°С знайдено дві тернарні сполуки постійного складу, HfAl<sub>2.55</sub>Si<sub>0.45</sub> та Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.56</sub>Si<sub>0.44</sub>, кристалографічні характеристики яких приведено у табл. 3.1. Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (7 і 6) характеризуються тернарна сполука HfAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub> і твердий розчин заміщення на основі бінарної сполуки Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Границі рідини у системі Al–Si зображено згідно з її діаграмою стану.



Рис. 3.4. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf-Al-Si при 600°С.

Таблиця 3.1

Спотиса	СТ	СПГ		Параметр		гри комірки, Å	
Сполука	CI	CII	111	а	b	С	
ZrAl <sub>2,55</sub> Si <sub>0,45</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,91422(15)	_	8,9753(3)	
ZrAl <sub>0,33</sub> Si <sub>1,67</sub>	ZrAl <sub>0,23</sub> Ge <sub>1,77</sub>	<i>tI</i> 32	$I4_1/amd$	3,7095(2)	_	29,345(3)	
Zr <sub>5</sub> Al <sub>2,44</sub> Si <sub>0,56</sub>	$Nb_5SiSn_2$	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,0454(4)	_	5,3942(2)	
HfAl <sub>2,55</sub> Si <sub>0,45</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,89413(14)	_	8,9386(3)	
Hf <sub>5</sub> Al <sub>2,54</sub> Si <sub>0,46</sub>	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	$P6_3/mcm$	8,0321(3)	_	5,6247(2)	

Кристалографічні характеристики тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-Si



Рис. 3.5. Параметри елементарної комірки в області гомогенності HPTP  $Hf_2Al_{1-x}Si_x$  ( $0 \le x \le 1$ ).

#### 3.1.3. Системи {Zr,Hf}-Al-Ge

Для дослідження діаграми стану системи Zr–Al–Ge було виготовлено 15 двокомпонентних та 52 трикомпонентні сплави. Хімічний склад синтезованих сплавів системи Zr–Al–Ge зображено на рис. 3.6.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Zr–Al–Ge при 600°C побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.7). Він містить 21 одно-, 43 дво- та 24 трифазних областей. Бінарні алюмініди цирконію не розчиняють помітної кількості ґерманію. Бінарні ґерманіди цирконію ZrGe<sub>2</sub> та Zr<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> розчиняють 4 і 10 і ат.% Al, відповідно, тоді як Zr<sub>5</sub>Ge<sub>4</sub> та ZrGe практично не розчиняють алюміній. У системі Zr–Al–Ge при 600°C встановлено існування п'яти тернарних сполук постійного складу: ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub>, ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, Zr<sub>11</sub>Al<sub>4</sub>Ge<sub>6</sub>, Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> та Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> (табл. 3.2). Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (10) характеризується твердий розчин заміщення на основі ґерманіду Zr<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub>.



Рис. 3.6. Склад сплавів системи Zr-Al-Ge.



Рис. 3.7. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Zr-Al-Ge при 600°С.

Для дослідження діаграми стану системи Hf–Al–Ge було виготовлено 13 двокомпонентних та 47 трикомпонентних сплавів. Хімічний склад синтезованих сплавів системи Hf–Al–Ge зображено на рис. 3.8.



Рис. 3.8. Склад сплавів системи Hf-Al-Ge.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Hf–Al–Ge при 600°C побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.9). Він містить 19 одно-, 37 дво- та 20 трифазних областей. Між ізоструктурними бінарними сполуками Hf<sub>2</sub>Al і Hf<sub>2</sub>Ge (CT CuAl<sub>2</sub>, CП *tl*12, ПГ *I4/mcm*) утворюється HPTP. Параметри елементарної комірки зменшуються при заміщенні атомів Al на атоми Ge (a = 6,775(3)-6,596(2), c = 5,3969(2)-5,291(2) Å, V = 246,46(6)-230,19(4) Å<sup>3</sup>). Подібно до HPTP Hf<sub>2</sub>Al<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub> (x = 0-1) у системі Hf–Al–Si, графіки зміни параметрів елементарної комірки для HPTP Hf<sub>2</sub>Al<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub> (x = 0-1) (рис. 3.10) характеризуються від'ємним відхиленням від лінійності (правила Веґарда), зумувлене, очевидно, сильнішою взаємодією атомів.



Рис. 3.9. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf-Al-Ge при 600°С.



Рис. 3.10. Параметри елементарної комірки в області гомогенності HPTP  $Hf_2Al_{1-x}Ge_x \ (0 \le x \le 1).$ 

Бінарні алюмініди гафнію не розчиняють помітної кількості германію. Бінарні германіди гафнію HfGe<sub>2</sub>, Hf<sub>3</sub>Ge<sub>2</sub> та Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> розчиняють 9, 2,5 та 5 ат.% Al, відповідно, тоді як HfGe та Hf<sub>5</sub>Ge<sub>4</sub> практично не розчиняють алюміній. У системі Hf–Al–Ge при 600°C існує чотири тернарні сполуки постійного складу: HfAl<sub>2,40</sub>Ge<sub>0,60</sub>, Hf<sub>11</sub>Al<sub>4</sub>Ge<sub>6</sub>, Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> та Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> (табл. 3.2). Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (по 8) характеризуються твердий розчин заміщення на основі бінарної сполуки Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> та тернарна сполука Hf<sub>11</sub>Al<sub>3,5</sub>Ge<sub>6,50</sub>. Границі рідини у системі Al–Ge зображено згідно з її діаграмою стану.

#### Таблиця 3.2

Сножие					Параметри комірки, Å		
Сполука	CI	CII	111	а	b	С	
ZrAl <sub>2,52</sub> Ge <sub>0,48</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,92395(11)		9,0476(4)	
ZrAl <sub>0,23</sub> Ge <sub>1,77</sub>	ZrAl <sub>0,23</sub> Ge <sub>1,77</sub>	<i>tI</i> 32	$I4_1/amd$	3,8013(2)	_	29,893(3)	
Zr <sub>11</sub> Al <sub>3,34</sub> Ge <sub>3,66</sub>	Zr <sub>11</sub> Al <sub>3,34</sub> Ge <sub>3,66</sub>	<i>tI</i> 84	I4/mmm	10,3679(7)		14,8529(11)	
Zr <sub>5</sub> AlGe <sub>3</sub>	$Hf_5CuSn_3$	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,104(3)		5,654(2)	
$Zr_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$	$Nb_5SiSn_2$	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,0145(7)		5,3921(4)	
HfAl <sub>2,40</sub> Ge <sub>0,60</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	I4/mmm	3,9021(2)	_	8,9549(8)	
Hf <sub>11</sub> Al <sub>3,50</sub> Ge <sub>6,50</sub>	Zr <sub>11</sub> Al <sub>3,34</sub> Ge <sub>3,66</sub>	<i>tI</i> 84	I4/mmm	10,1764(8)	_	14,1729(13)	
Hf <sub>5</sub> AlGe <sub>3</sub>	$Hf_5CuSn_3$	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,0641(3)		5,5874(2)	
$Hf_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	<i>hP</i> 16	$P_{6_3/mcm}$	8,0880(3)	_	5,6511(2)	

Кристалографічні характеристики тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-Ge

#### 3.1.4. Системи {Zr,Hf}-Al-Sn

Для дослідження діаграми стану системи Zr–Al–Sn було виготовлено 15 двокомпонентних та 44 трикомпонентних сплавів, хімічний склад яких зображено на рис. 3.11.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Zr–Al–Sn при 600°C побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.12) [136]. Він містить 18 одно-, 36 дво- та 19 трифазних областей.



Рис. 3.11. Склад сплавів системи Zr-Al-Sn.

При 600°С олово i, відповідно, частина подвійної системи Al–Sn (до 80 ат.% Al) перебувають у рідкому стані. Межі рідкої фази у потрійній області системи Zr–Al–Sn екстрапольовано, виходячи з меж рідини у подвійних системах: 3,5 ат.% Zr у системі Zr–Sn i 80 ат.% Al у системі Al–Sn. При 600°С у рівновазі з рідиною перебувають три фази: Al, ZrSn<sub>2</sub> i ZrAl<sub>2,68</sub>Sn<sub>0,32</sub>. Бінарні сполуки Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> та Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> розчиняють 11,1 i 2,5 ат.% Al, відповідно, що супроводжується утворенням твердих розчинів заміщення вздовж ізоконцентрат 55,5 i 62,5 ат.% Zr, відповідно. Інші бінарні станіди цирконію, а також всі алюмініди цирконію не розчиняють помітної кількості третього компонента. У системі Zr–Al–Sn при 600°С знайдено три тернарні сполуки: ZrAl<sub>2,68</sub>Sn<sub>0,32</sub>, Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,71</sub>Sn<sub>0,29</sub> i Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>Sn<sub>1,32-2,60</sub> (табл. 3.3). Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (по 8) характеризуються твердий розчин заміщення на основі бінарної сполуки Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> та тернарна сполука Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>Sn<sub>1,32-2,60</sub>.



Рис. 3.12. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Zr-Al-Sn при 600°С.

Для дослідження діаграми стану системи Hf–Al–Sn було виготовлено 12 двокомпонентних та 42 трикомпонентних сплавів, хімічний склад яких зображено на рис. 3.13.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Hf–Al–Sn при 600°C побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.14). Він містить 15 одно-, 30 дво- та 16 трифазних областей. Межі рідкої фази у багатій на Sn частині системи Hf–Al–Sn екстрапольовано, виходячи з меж рідини у подвійних системах: 3 ат.% Hf у системі Hf–Sn i 80 ат.% Al у системі Al–Sn. При 600°C у рівновазі з рідиною перебувають три фази: Al, HfSn<sub>2</sub> i ZrAl<sub>2,64</sub>Sn<sub>0,36</sub>. Бінарні сполуки не розчиняють помітної кількості третього компонента, окрім станіду Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub>, на основі якого утворюється твердий розчин включення протяжністю до 11,1 ат.% Al. У системі Hf–Al–Sn при 600°C знайдено три тернарні сполуки: HfAl<sub>2,64</sub>Sn<sub>0,36</sub>, Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Sn<sub>0,30</sub> і Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,33-0,78</sub>Sn<sub>1,67-2,22</sub> (табл. 3.3). Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (6) характеризується твердий розчин на основі бінарної сполуки Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub>.



Рис. 3.13. Склад сплавів системи Hf-Al-Sn.



Рис. 3.14. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf–Al–Sn при 600°С.

	гаолиця 5.5					
и тернарних сполук систем {Zr,Hf}–Al–Sn						
пг	Параметри комірки, Å					
111	а	b	С			
I4/mmm	3,98855(18)	_	9,0848(4)			

\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

11,0530(9)

11,1005(9)-

11,1829(12)

3,95450(2)

8,0910(4)

10,9627(8)-

11,0291(9)

Кристалографічні характеристик

I4/mcm

I4/mcm

I4/mmm

 $P6_3/mcm$ 

I4/mcm

# 3.1.5. Системи {Zr,Hf}-Al-Sb

CT

 $UCuAl_2$ 

Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>

Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>

 $UCuAl_2$ 

Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>

Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>

Сполука

 $ZrAl_{2.68}Sn_{0.32}$ 

Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,71</sub>Sn<sub>0,29</sub>

Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>×

 $\times Sn_{1.32-2.60}$ 

HfAl<sub>2,64</sub>Sn<sub>0,36</sub>

Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Sn<sub>0,30</sub>

Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,33-0,78</sub>×

 $\times Sn_{1,67-2,22}$ 

СП

tI8

*tI*32

*tI*32

*tI*8

*hP*16

*tI*32

Для дослідження діаграми стану системи Zr-Al-Sb було виготовлено 16 двокомпонентних та 45 трикомпонентних сплавів, хімічний склад яких зображено на рис. 3.15.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Zr-Al-Sb при 600°С побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.16). Він містить 22 одно-, 45 дво- та 24 трифазних областей. Бінарні сполуки не розчиняють помітної кількості третього компонента, окрім антимонідів цирконію Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub> та Zr<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub>, на основі яких утворюються тверді розчини заміщення протяжністю 11,1 та 2,5 ат.% Al, відповідно. У системі Zr–Al–Sb при 600°C встановлено існування трьох тернарних сполук сталого складу – ZrAl<sub>2.65</sub>Sb<sub>0.35</sub>, Zr<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> та Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.55</sub>Sb<sub>0.45</sub>, та однієї тернарної сполуки змінного складу – Zr<sub>5</sub>Al<sub>1.55-0.65</sub>Sb<sub>1.45-2.35</sub> (табл. 3.4). Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (по 9) характеризуються твердий розчин на основі бінарної сполуки Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub> та тернарна сполука Zr<sub>5</sub>Al<sub>1.55-0.65</sub>Sb<sub>1.45-2.35</sub>.

Для дослідження діаграми стану системи Hf-Al-Sb було виготовлено 13 двокомпонентних та 43 трикомпонентні сплави, хімічний склад яких зображено на рис. 3.17.

Таблина 33

5,4071(5)

5,4537(5)-

5,5449(6)

8,94451(12)

5,6515(4)

5,4138(4)-

5,4913(5)



Рис. 3.15. Склад сплавів системи Zr-Al-Sb.



Рис. 3.16. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Zr-Al-Sb при 600°С.



Рис. 3.17. Склад сплавів системи Hf-Al-Sb.

Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Hf–Al–Sb при 600°C побудовано в повному концентраційному інтервалі (рис. 3.18). Він містить 20 одно-, 41 дво- та 23 трифазних областей. Бінарна сполука Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> розчиняє 3 ат.% Al з утворенням твердого розчину заміщення вздовж ізоконцентрати 62,5 ат.% Hf. Інші бінарні сполуки не розчиняють помітної кількості третього компонента. У системі Hf–Al–Sb при 600°C встановлено існування п'яти тернарних сполук: HfAl<sub>2,67</sub>Sb<sub>0,33</sub>, Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,48</sub>Sb<sub>0,52</sub> та Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,52-0,74</sub>Sb<sub>1,48-2,26</sub> (табл. 3.4).

Найбільшою кількістю подвійних рівноваг (по 8) характеризуються тернарні сполуки Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> та Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,52-0,74</sub>Sb<sub>1,48-2,26</sub>.



Рис. 3.18. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Hf–Al–Sb при 600°С.

таолиця 3
-----------

Cramma	СТ	СП ПГ				Пара	Параметри комірки, Å	
Сполука	CI	CII	111	а	b	С		
ZrAl <sub>2,65</sub> Sb <sub>0,35</sub>	UCuAl <sub>2</sub>	tI8	I4/mmm	3,9142(2)	_	8,9753(4)		
Zr <sub>2</sub> AlSb <sub>3</sub>	Zr <sub>2</sub> CuSb <sub>3</sub>	tP6	<i>P</i> -4 <i>m</i> 2	3,9826(2)	_	8,7144(5)		
Zr <sub>5</sub> Al <sub>2,55</sub> Sb <sub>0,45</sub>	$Nb_5SiSn_2$	<i>tI</i> 32	I4/mcm	11,0120(9)	_	5,3913(5)		
$Zr_5Al_{1,55-0,65} \times$	Nh-SiSn-	+132	IA/mcm	10,9810(9)-	_	5,4153(5)-		
$\times$ Sb <sub>1,45-2,35</sub>	1105515112	1152	14/mcm	11,0731(12)		5,4482(6)		
$HfAl_{2,67}Sb_{0,33}$	UCuAl <sub>2</sub>	tI8	I4/mmm	3,94191(9)	_	8,9078(2)		
Hf <sub>2</sub> AlSb <sub>3</sub>	Zr <sub>2</sub> CuSb <sub>3</sub>	tP6	<i>P</i> -4 <i>m</i> 2	3,9021(2)	_	8,6510(5)		
Hf <sub>5</sub> AlSb <sub>3</sub>	Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub>	<i>hP</i> 18	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,3572(3)	—	5,6914(2)		
$Hf_{5}Al_{2,49}Sb_{0,51}$	$Mn_5Si_3$	<i>hP</i> 16	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>	8,0934(5)	_	5,6560(5)		
Hf <sub>5</sub> Al <sub>1,52-0,74</sub> ×	NIL C.C.	+12 <b>2</b>	IA/ma ama	10,8908(8)-	_	5,5114(4)-		
$\times$ Sb <sub>1,48-2,26</sub>	105515112	1132	14/ <i>MCM</i>	10,9344(9)		5,5403(5)		

Кристалографічні характеристики тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-Sb

#### 3.2. Кристалічні структури тернарних фаз

У системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С встановлено існування 29 тернарних сполук (див. табл. 3.1-3.4), з них 22 сполуки синтезовано вперше. У цьому розділі приведено результати визначення параметрів кристалічної структури тернарних сполук та деяких твердих розчинів на основі бінарних сполук рентгенівськими дифракційними методами монокристалу та порошку.

## 3.2.1. Сполуки $TAl_{3-x}M_x$ (T = Zr, Hf; M = Si, Ge, Sn, Sb) з структурами типів TiAl<sub>3</sub> i UCuAl<sub>2</sub>

В усіх потрійних системах {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С на ізоконцентратах 25 ат.% Zr чи Hf та при великому вмісті Al (63-67 ат.%) існують тернарні сполуки постійного складу загальної формули  $TAl_{3-x}M_x$  (T = Zr, Hf; M = Si, Ge, Sn, Sb). Їхні кристалічні структури визначено рентгеніським дифракційним методом порошку. Па прикладі систем {Zr,Hf}-Al-Ge було досліджено фазовий склад сплавів, встановлено фазові рівноваги, визначено області гомогенності і параметри структури бінарних і тернарних фаз на розрізах  $TAl_{3-x}Ge_x$  (T = Zr, Hf; x = 0-0,8) [137-140].

Кристалічні структури бінарних алюмінідів ZrAl<sub>3</sub> і HfAl<sub>3</sub> при 600°С належать до типу ZrAl<sub>3</sub> (СП *tI*16, ПГ *I4/mmm*) з чотирма повністю зайнятими правильними системам точок: одна позиція (4e) – для атомів Zr чи Hf і три позиції (4e, 4d ta 4c)для атомів Al. Параметри їхніх кристалічних структур уточнено методом Рітвельда за дифрактограмами двокомпонентних сплавів Zr<sub>25</sub>Al<sub>75</sub> і Hf<sub>25</sub>Al<sub>75</sub>, відповідно. Деталі експерименту і кристалографічні характеристики сполук приведено у табл. 3.5, а координати та ізотропні параметри зміщення атомів – у табл. 3.6. Часткова заміна атомів Al на атоми Ge приводить до утворення тернарних сполук  $ZrAl_{2.52}Ge_{0.48}$  i  $HfAl_{2.40}Ge_{0.60}$ . Дифрактограми зразків Zr<sub>25</sub>Al<sub>72,5-65</sub>Ge<sub>2,5-10</sub> та Hf<sub>25</sub>Al<sub>72,5-65</sub>Ge<sub>5-10</sub> свідчать про існування двофазних областей між відповідними бінарними і тернарними сполуками. Однакові значення параметрів елементарних комірок для фаз у різних багатофазних зразках свідчать про відсутність значної розчинності Ge в ZrAl<sub>3</sub> та HfAl<sub>3</sub> і про сталий склад тернарних сполук.

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для ZrAl $_3$  та HfAl $_3$ 

Сполука	ZrAl <sub>3</sub>	HfAl <sub>3</sub>
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , Å <i>c</i> , Å	4,00930(11) 17,2718(7)	3,9849(3) 17,1443(15)
Об'єм елементарної комірки V, Å <sup>3</sup>	277,636(16)	272,24(3)
Густина $D_{\rm X}$ , г см <sup>-3</sup>	4,118	6,332
Параметр текстури / [напрям]	0,965(3) / [001]	0,931(3)/[110]
Дифрактометр	ДРОН-2.0М	STOE Stadi P
Інтервал 2 $\theta$ , °; крок, °	15-132; 0,05	6-110; 0,015
Параметри профілю: U V W	0,274(16) -0,28(2) 0,119(7)	0,036(3) 0,026(5) 0,006(10)
Параметр змішування η	0,906(18)	0,857(11)
Фактори розбіжності: <i>R</i> <sub>В</sub>	0,0552	0,0500
$R_{ m p}, R_{ m wp}$	0,0335, 0,0422	0,0346, 0,0931
$\chi^2$	1,20	1,23

(CT ZrAl<sub>3</sub>, CII tI16, IIC I4/mmm, Z = 4)

Таблиця 3.6

## Координати та ізотропні параметри зміщення атомів

у структурі сполук ZrAl<sub>3</sub> та HfAl<sub>3</sub> (СТ ZrAl<sub>3</sub>, СП *tI*16, ПГ *I*4/*mmm*)

Атом	ПСТ	x	У	Z	B <sub>i30</sub> , Å <sup>2</sup>		
	ZrAl <sub>3</sub>						
Zr	4 <i>e</i>	0	0	0,11846(16)	0,78(4)		
Al1	4 <i>e</i>	0	0	0,3772(6)			
Al2	4 <i>d</i>	0	1/2	1/4	1,20(6)		
A13	4 <i>c</i>	0	1/2	0			
	HfAl <sub>3</sub>						
Hf	4 <i>e</i>	0	0	0,11857(9)	0,58(3)		
Al1	4 <i>e</i>	0	0	0,3777(6)			
Al2	4 <i>d</i>	0	1/2	1/4	1,08(6)		
Al3	4 <i>c</i>	0	1/2	0			

Кристалічну тернарних алюмогерманідів  $ZrAl_{2.52}Ge_{0.48}$ i структуру  $HfAl_{2,40}Ge_{0.60}$ уточнено методом Рітвельда дифрактограмами зразків за  $Zr_{25}Al_{62.5}Ge_{12.5}$  і  $Hf_{25}Al_{60}Ge_{15}$ , відповідно (рис. 3.19). Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для тернарних фаз приведено у табл. 3.7, координати та ізотропні параметри зміщення атомів – у табл. 3.8. Хімічний склад фаз у зразках Zr<sub>25</sub>Al<sub>62,5</sub>Ge<sub>12,5</sub> і Hf<sub>25</sub>Al<sub>60</sub>Ge<sub>15</sub> додатково визначено локальним рентгеноспектральним аналізом шліфів сплавів (рис. 3.20). Визначені цим методом  $(Zr_{1,01(3)}Al_{2,53(4)}Ge_{0,46(4)})$ i  $Hf_{1,01(3)}Al_{2,40(4)}Ge_{0,59(4)}$ склали тернарних сполук відповідають складам, отриманим з дифракційного експерименту.



Рис. 3.19. Експериментальні (точки), розраховані (лінії) та різницеві (внизу рисунків) дифрактограми зразків: *a* – Zr<sub>25</sub>Al<sub>62,5</sub>Ge<sub>12,5</sub> (проміння Fe Kα) і *б* – Hf<sub>25</sub>Al<sub>60</sub>Ge<sub>15</sub> (проміння Cu Kα<sub>1</sub>). Вертикальні риски вказують на положення відбиттів індивідуальних фаз.

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для  $ZrAl_{2,52}Ge_{0,48}$  і HfAl<sub>2,40</sub>Ge<sub>0,60</sub> (CT TiAl<sub>3</sub>, СП *tI*8, ПГ *I*4/*mmm*, *Z* = 2)

Уточнений склад сполуки	ZrAl <sub>2,52(1)</sub> Ge <sub>0,48(1)</sub>	HfAl <sub>2,40(1)</sub> Ge <sub>0,60(1)</sub>
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , Å	3,92395(11)	3,9021(2)
<i>c</i> , Å	9,0476(4)	8,9549(8)
Об'єм елементарної комірки V, Å <sup>3</sup>	139,309(8)	136,351(8)
Густина $D_{\rm X}$ , г см <sup>-3</sup>	4,628	6,988
Параметр текстури / [напрям]	0,9873(18) / [001]	0,927(2)/[110]
Дифрактометр	ДРОН-2.0М	STOE Stadi P
Інтервал 2 $\theta$ , °; крок, °	15-130; 0,05	6-106; 0,015
Параметри профілю: U	0,221(13)	0,220(2)
V	-0,218(18)	-0,046(4)
W	0,118(6)	0,0201(8)
Параметр змішування η	0,602(16)	0,689(5)
Фактори розбіжності: <i>R</i> <sub>В</sub>	0,0630	0,0383
$R_{\rm p}, R_{\rm wp}$	0,0263, 0,0341	0,0365, 0,0410
$\chi^2$	1,12	1,27

### Таблиця 3.8

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурах сполук

Атом	ПСТ	x	У	Z	$B_{ m i30}$ , Å <sup>2</sup>
ZrAl <sub>2,52(1)</sub> Ge	$e_{0,48(1)}(M1=0,$	922(4)Al + 0,0	78(4)Ge; <i>M</i> 2 =	= 0,675(6)Al +	0,325(6)Ge)
Zr	2 <i>a</i>	0	0	0	0,86(3)
<i>M</i> 1	4 <i>d</i>	0	1/2	1/4	1,29(3)
M2	2b	0	0	1/2	1,20(3)
$HfAl_{2,40(1)}Ge_{0,60(1)}$ (M1 = 0,915(4)Al + 0,085(4)Ge; M2 = 0,570(6)Al + 0,430(6)Ge)					
Hf	2 <i>a</i>	0	0	0	0,584(13)
<i>M</i> 1	4 <i>d</i>	0	1/2	1/4	1,23(8)
M2	2b	0	0	1/2	1,17(8)

ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub> i HfAl<sub>2,40</sub>Ge<sub>0,60</sub> (CT TiAl<sub>3</sub>, CΠ *tI*8, ΠΓ *I*4/*mmm*)

Кристалічні структури тернарних сполук  $ZrAl_{2,52}Ge_{0,48}$  і  $HfAl_{2,40}Ge_{0,60}$  належать до тетрагонального структурного типу TiAl<sub>3</sub> (СП *tl*8, ПГ *I4/mmm*) і описується таким набором правильних систем точок: 2*a* для атомів Zr або Hf, 4*d* і 2*b* для статистичних сумішей атомів Al і Ge. Встановлено, що у структурах обох сполук склади статистичних сумішей відрізняються між собою: переважаюче заміщення атомів Al на атоми Ge відбувається у положенні 2*b* (32,5 і 43 % для Zr- і Hf-вмісної сполуки, відповідно), на відміну від положення 4*d* (~8 % для обох сполук).



Рис. 3.20. Зображення поверхонь шліфів зразків  $a - Zr_{25}Al_{62,5}Ge_{12,5}$  і  $\delta - Hf_{25}Al_{60}Ge_{15}$  у вторинних електронах (електронний мікроскоп РЕММА-102-02). Світлі вкраплення– сплав Вуда, темні ділянки – тріщини і пори у зразках.

Структури сполук ZrAl<sub>3</sub> і ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub> близькоспорідені і належать до родини кубічних щільноупакованих структур. За систематикою П.І. Крип'якевича [134], структурні типи ZrAl<sub>3</sub> та TiAl<sub>3</sub> належать до класу 1 (структури з кубооктаедричним оточенням атомів малого розміру), а координаційними многогранниками усіх атомів в обох структурах є кубооктаедри (рис. 3.21). Міжатомні віддалі і координаційні числа атомів приведені у табл. 3.9 і 3.10. Міжатомні віддалі корелюють з сумами атомних і металічних радіусів відповідних елементів. Для тернарних алюмосиліцидів ZrAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub> та HfAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub> склади статистичних сумішей атомів Al та Si приймали рівними співвідношенням цих елементів, отриманим у результаті локального рентгеноспектрального аналізу сплавів та не уточнювали, з огляду на подібні значення факторів розсіювання рентгенівського проміння атомами Al i Si.



Рис. 3.21. Елементарні комірки та координаційні многогранники атомів у структурах сполук ZrAl<sub>3</sub> і ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub>.

У структурах тернарних сполук з більшими за розміром атомів Sn i Sb спостерігається тенденція до впорядкування атомів Al i Sn чи Sb у двох ПСТ (4*d* i 2*b*) просторової групи *I4/mmm*. Слід зазначити, що повне впорядкування атомів *p*-елементів привело б до реалізації надструктури типу UCuAl<sub>2</sub> (СП *tI*8, ПГ *I4/mmm*), яка є тернарним варіантом структурного типу TiAl<sub>3</sub>. Нижче приведено результати уточнення кристалічної структури тернарного алюмостаніду ZrAl<sub>2,68</sub>Sn<sub>0,32</sub> [136,141] методом Рітвельда за дифрактограмою однофазного зразка Zr<sub>25</sub>Al<sub>67</sub>Sn<sub>8</sub> (рис. 3.22).

## Таблиця 3.9

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурах

A		δ,	Å	ICH
AT	ОМИ	ZrAl <sub>3</sub>	HfAl <sub>3</sub>	КЧ
T (Zr/Hf)	-4 Al1	2,836	2,820	
	- 4 Al3	2,864	2,847	12
	-4 Al2	3,030	3,008	
All	-4 T	2,836	2,820	
	-4 Al2	2,974	2,961	12
	- 4 Al3	2,918	2,893	
Al2	-4 Al2	2,835	2,819	
	-4 Al1	2,974	2,961	12
	-4 T	3,030	3,008	
A13	- 4 Al3	2,835	2,819	
	-4 T	2,864	2,847	12
	-4 Al1	2,918	2,893	

сполук ZrAl<sub>3</sub> та HfAl<sub>3</sub> (стандартні відхилення < 0,01 Å).

Таблиця 3.10

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурах

сполук ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub> та HfAl<sub>2,40</sub>Ge<sub>0,60</sub> (стандартні відхилення < 0,01 Å).

Arong		δ,	$\delta,$ Å		
AT	ОМИ	$ZrAl_{2,52}Ge_{0,48}$	$HfAl_{2,40}Ge_{0,60}$	МЧ	
T (Zr/Hf)	- 4 <i>M</i> 2	2,775	2,770	12	
	- 8 <i>M</i> 1	2,994	2,971	12	
<i>M</i> 1	- 4 <i>M</i> 1	2,775	2,770	10	
	- 4 <i>M</i> 2	2,994	2,971	12	
	-4 T	2,994	2,971		
M2	-4 T	2,775	2,770	12	
	- 8 <i>M</i> 1	2,994	2,971		



Рис. 3.22. Експериментальна (точки), розрахована (лінія) та різницева (внизу рисунка) дифрактограма зразка Zr<sub>25</sub>Al<sub>67</sub>Sn<sub>8</sub> (проміння Cu Kα<sub>1</sub>). Вертикальні риски вказують на положення відбиттів сполуки ZrAl<sub>2,68</sub>Sn<sub>0,32</sub>.

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для  $ZrAl_{2,68}Sn_{0,32}$  приведено у табл. 3.11, координати та ізотропні параметри зміщення атомів – у табл. 3.12. Хімічний склад фази, визначений локальним рентгеноспектральним аналізом ( $Zr_{1,00(2)}Al_{2,68(2)}Sn_{0,32(2)}$ ) відповідає складу, отриманому з дифракційного експерименту.

Подібне часткове впорядкування атомів Al i Sn чи Sb, тобто статистичне заміщення атомів Al на атоми Sn чи Sb виключно у позиції 2*b*, спостерігається і у структурах тернарних сполук HfAl<sub>2,64</sub>Sn<sub>0,36</sub>, ZrAl<sub>2,65</sub>Sb<sub>0,35</sub> і HfAl<sub>2,67</sub>Sb<sub>0,33</sub>.

У потрійних системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С тернарні фази зі структурами типів TiAl<sub>3</sub> і UCuAl<sub>2</sub> з цирконієм є індивідуальними тернарними сполуками, тоді як фази з гафнієм, що існують при 600°С як тернарні сполуки, можуть бути частинами твердих розчинів на основі високотемпературної модифікації бінарної сполуки HfAl<sub>3</sub> (CT TiAl<sub>3</sub>), стабілізованих атомами Si, Ge, Sn чи Sb при нижчих температурах.

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для  $ZrAl_{2,68}Sn_{0,32}$ 

Уточнений склад сполуки	ZrAl <sub>2,682(4)</sub> Sn <sub>0,318(4)</sub>	
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , <i>c</i> , Å	3,98855(18), 9,0848(4)	
Об'єм елементарної комірки V, Å <sup>3</sup>	144,526(12)	
Густина $D_{\rm X}$ , г см <sup>-3</sup>	4,426	
Параметр текстури / [напрям]	0,981(4) / [110]	
Дифрактометр	STOE Stadi P	
Інтервал 2 <i>θ</i> , °; крок, °	6-106; 0,015	
Параметри профілю: U, V, W	0,116(7), 0,018(6), 0,0227(13)	
Параметр змішування η	0,343(7)	
Параметри асиметрії Р <sub>1</sub> , Р <sub>2</sub>	0,064(5), 0,0174(16)	
Фактори розбіжності: <i>R</i> <sub>В</sub>	0,0380	
$R_{ m p}, R_{ m wp}, \chi^2$	0,0327, 0,0461, 1,53	

(CT UCuAl<sub>2</sub>, C $\Pi$  *tI*8,  $\Pi\Gamma$  *I*4/*mmm*, *Z* = 2)

## Таблиця 3.12

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки ZrAl<sub>2.68</sub>Sn<sub>0.32</sub> (CT UCuAl<sub>2</sub>, СП *tI*8, ПГ *I*4/*mmm*)

Атом	ПСТ	x	У	Ζ	$B_{i30}$ , Å <sup>2</sup>
Zr	2 <i>a</i>	0	0	0	0,69(5)
Al	4 <i>d</i>	0	1/2	1/4	1,27(14)
$M^1$	2b	0	0	1/2	1,23(8)

Примітка:  $^{1}M = 0,841(2)$ Al+0,159(2)Sn.

## 3.2.2. Новий структурний тип ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>

У потрійних системах Zr–Al–{Si,Ge} на ізоконцентратах 33,3 ат.% Zr знайдено тернарні сполуки постійного складу ZrAl<sub>0,33</sub>Si<sub>1,67</sub> і ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>. Подібність дифрактограм відповідних зразків між собою свідчила про їхню ізоструктурність. З огляду на близькі значення факторів розсіювання рентгенівського проміння атомами Al i Si, i, відповідно, утрудненість прецизійного визначення їхнього розподілу у структурі, кристалічну структуру було визначено для алюмоґерманіду ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1,77</sub> [142,143].

Параметри структури ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> визначено рентгенівським дифракційним методом монокристалу. Кристал у формі пластинки було відібрано зі зразка Zr<sub>33,3</sub>Al<sub>10</sub>Ge<sub>56,7</sub>, а масив дифракційних даних отримано на дифрактометрі Rigaku AFC7. Після корекції експериментальних даних на поглинання, кристалічну структуру сполуки було визначено прямими методами у просторовій групі  $I4_1/amd$  та уточнено методом найменших квадратів за допомогою пакету програм WinCSD (табл. 3.13). Склад тернарної сполуки (Zr<sub>0,99(2)</sub>Al<sub>0,25(3)</sub>Ge<sub>1,75(3)</sub>) було незалежно визначено за допомогою енергодисперсійного рентгенівського спектрального аналізу (рис. 3.23).

#### Таблиця 3.13

Уточнений склад сполуки	ZrAl <sub>0,230(5)</sub> Ge <sub>1,770(5)</sub>
СТ	ZrAl <sub>0,23</sub> Ge <sub>1,77</sub>
СП	<i>tI</i> 32-8
ΠΓ	I4 <sub>1</sub> /amd
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , Å <i>c</i> , Å	3,8013(2) 29,893(3)
Об'єм елементарної комірки V, Å <sup>3</sup>	431,95(9)
Кількість формульних одиниць Z	8
Густина $D_{\rm X}$ , г см <sup>-3</sup>	6,950
Коефіцієнт поглинання µ, мм <sup>-1</sup>	30,16
Кількість відбиттів: виміряних незалежних (з F > 3 σ(F))	1474 254
Фактор розбіжності $R_{e\kappa B}$	0,0392
Інтервал <i>h</i> , <i>k</i> , <i>l</i>	$-5 \le h \le 2, -5 \le k \le 5, -43 \le l \le 43$
Граничний кут вимірювання $ heta, ^{\circ}$	33,2
Фактори розбіжності: <i>R</i> <i>wR</i> <i>S</i>	0,0311 0,0320 1,01

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub>



Рис. 3.23. Зображення поверхні зразка Zr<sub>33,3</sub>Al<sub>10</sub>Ge<sub>56,7</sub> у вторинних електронах (зліва) і у зворотно розсіяних електронах (справа).

Кристалічна структура тернарного алюмогерманіду ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> є першим представником нового структурного типу (СП *tI*32-8, ПГ *I*4<sub>1</sub>/*amd*), який характеризується частково впорядкованим розміщенням атомів Al i Ge. Координати та параметри зміщення атомів у структурі ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> приведено у табл. 3.14.

На початковому етапі було визначено координати атомів, які відповідали моделі структурного типу TiAl<sub>0,29</sub>Ge<sub>1,71</sub> (СП *tI*24, ПГ *I*4<sub>1</sub>/*amd*, *a* = 3,6959, *c* = 28,345 Å [91]). Однак, уточнені ізотропні параметри зміщення атомів Ge у ПСТ 8*e* у цій моделі були у кілька разів більшими за інші, а відповідні еліпсоїди були витягнутими вздовж кристалографічного напряму [001]. Це вказало на можливість позиційного невпорядкування атомів Ge навколо ПСТ 8*e*. Це невпорядкування атомів було успішно змодельовано розщепленням позиції 8*e* на дві позиції 8*e* вздовж [001] – положення Ge1A та Ge1B. Після попередніх уточнень КЗП обох цих положень було зафіксовано як 0,5. Віддаль між сусідніми ПСТ 8*e* ( $\delta_{Ge1A-Ge1B}$ ) становить 0,254(3) Å.

#### Таблиця 3.14

Координати та параметри зміщення атомів (Å<sup>2</sup>) у структурі сполуки  $ZrAl_{0.23}Ge_{1.77}$  (СТ  $ZrAl_{0.23}Ge_{1.77}$  СП tI32-8, ПГ  $I4_1/amd$ ,

Атом	ПСТ		x			у		Ζ		$B_{i30}$
Zr	8e		0		1	/4	0,1	9867(4)		0,47(3)
$M^1$	4 <i>b</i>		0		1	/4		3/8		0,67(4)
Ge1A <sup>2</sup>	8e		0		1	/4	0,0	)2789(6)		0,35(4)
Ge1B <sup>2</sup>	8e		0		1	/4	0,	0364(1)	(	0,26(12)
Ge2	4 <i>a</i>		0		3	5/4		1/8		0,69(3)
Атом	$B_{11}$		$B_{22}$	Ŀ	B <sub>33</sub>	<i>B</i> <sub>12</sub>		<i>B</i> <sub>13</sub>		$B_{23}$
Zr	0,34(5)	(	),27(5)	0,8	31(4)	0		0		0
$M^1$	0,50(6)	(	),50(6)	1,0	2(9)	0		0		0
Ge1A <sup>2</sup>	0,39(8)	(	),31(8)	0,3	6(6)	0		0		0
Ge1B <sup>2</sup>	0,3(2)		0,2(2)	0,24	4(12)	0		0		0
Ge2	0,51(4)	(	),51(4)	1,0	5(7)	0		0		0

a = 3,8013(2), c = 29,893(3) Å)

Примітки:  ${}^{1}M = 0,461(9)Al + 0,539(9)Ge$ ;  ${}^{2}K3\Pi$  (Ge1A) = K3П (Ge1B) = 0,5.

У структурі сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, як і у структурі TiAl<sub>0,29</sub>Ge<sub>1,71</sub>, атоми перехідного металу займають одне положення 8*e*, тоді як атоми *p*-елементів (Al i Ge) частково впорядковано займають інші ПСТ: статистична суміш атомів Al i Ge – ПСТ 4*b*, а атоми Ge – ПСТ 8*e* і 4*a*. Структурні типи ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> і TiAl<sub>0,29</sub>Ge<sub>1,71</sub> є тернарними частково впорядкованими варіантами псевдо-бінарного структурного типу Zr<sub>0,75</sub>AlSi<sub>1,25</sub> ((Zr<sub>0,75</sub>Al<sub>0,25</sub>)(Al<sub>0,38</sub>Si<sub>0,62</sub>)<sub>2</sub>, СП *tl*24, ПГ *I*4<sub>1</sub>/*amd*, a = 3,71, c = 29,35 Å [90]), у якому всі ПСТ зайняті статистичними сумішами атомів.

Вміст елементарної комірки та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> зображено на рис. 3.24, а міжатомні віддалі приведено у табл. 3.15. Значення міжатомних віддалей корелюють з сумами атомних радіусів відповідних компонентів, за винятком атомів Ge, які утворюють у структурі зигзагоподібні ланцюги.

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів

	Атоми	$\delta$ , Å	КМ
Zr	$-4 \text{ Ge1B}^{a} (4 \text{ Ge1A}^{1})$	2,725(1) (2,778(1))	
	– 2 Ge2	2,909(1)	
	$-2 M^2$	2,909(1)	1.6
	$-2 \text{ Ge1A} (2 \text{ Ge1B}^{1})$	3,037(2) (3,239(3))	10
	- 2 Zr	3,610(1)	
	-4 Zr	3,801(1)	
$M^{\mathrm{b}}$	- 4 Ge2	2,688(1)	0
	-4 Zr	2,909(1)	8
Ge1A	$(1 \text{ Ge}1\text{B}^{1})$	(0,254(3))	
	$-2 \text{ Ge1A}^{1} (2 \text{ Ge1B}^{1})$	2,528(2) (2,703(2))	0
	-4 Zr	2,778(1)	8
	- 2 Zr	3,037(2)	
Ge1B	$(1 \text{ GelA}^1)$	(0,254(3))	
	- 2 Ge1A (2 Ge1B <sup>1</sup> )	2,703(2) (2,889(3))	0
	-4 Zr	2,725(1)	8
	- 2 Zr	3,239(3)	
Ge2	$-4 M^2$	2,688(1)	0
	-4 Zr	2,909(1)	8

у структурі сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>

Примітки:  ${}^{1}M = 0,461(9)Al + 0,539(9)Ge$ ;  ${}^{2}K3\Pi$  (Ge1A) = K3П (Ge1B) = 0,5.

Атоми Zr координовані 16 атомами, які утворюють поліедр складу <u>Zr</u> $M_2$ Ge<sub>8</sub>Zr<sub>6</sub>. Його можна описати як кубооктаедр  $M_2$ Ge<sub>8</sub>Zr<sub>2</sub> з чотирма додатковими атомами Zr. Атоми найближчого координаційного оточнення статистичної суміші атомів Al i Ge (*M*) і атомів Ge2 утворюють 8-вершинники <u>M</u>Ge<sub>4</sub>Zr<sub>4</sub> і <u>Ge2</u> $M_4$ Zr<sub>4</sub>, відповідно, які побудовані з двох тригональних призм, зрощених взаємноперпендикулярно через прямокутну грань (gyrobifastigium) – комбінація тетраедра  $T_4$  і квадрата  $M_4$ . Координаційним многогранником атомів Ge1A є тригональна призма Zr<sub>6</sub> з двома додатковими атомами Ge навпроти прямокутних граней. Навколо атомів Ge1B утворюється подібний поліедр, але з іншим розподілом міжатомних віддалей.



Рис. 3.24. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>.

Згідно з систематикою структурних типів П.І. Крип'якевича, структура ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> належить до класів структур з тригонально-призматичною чи тетраедричною координацією атомів малого розміру.

### 3.2.3. Сполуки $T_2$ AlSb<sub>3</sub> (T = Zr, Hf) з структурою типу $Zr_2$ CuSb<sub>3</sub>

У системах {Zr,Hf}–Al–Sb на ізоконцентратах 33,3 ат.% Zr та Hf встановлено існування тернарних сполук постійного складу  $Zr_2AlSb_3$  і Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>. Подібність дифрактограм відповідних зразків між собою свідчила про їхню ізоструктурність. Нижче приведено деталі визначення кристалічної структури на прикладі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> [144].

Характер розташування та інтенсивність відбиттів на дифрактограмі зразка Hf<sub>33,3</sub>Al<sub>16,7</sub>Sb<sub>50</sub> вказали на можливу реалізацію структурного типу UAs<sub>2</sub>, до якого належить структура високотемпературної модифікації бінарного антимоніду HfSb<sub>2</sub>

(СТ UAs<sub>2</sub>, СП *tP*6, ПГ *P*4/*nmm*, a = 3,916, c = 8,678 Å [77]). Крім того, з літератури відомо про існування у спорідненій системі Hf–Ga–Sb ізостехіометричної тернарної сполуки Hf<sub>2</sub>GaSb<sub>3</sub> зі структурою типу Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub> [145]:СП *tP*6, ПГ *P*-4*m*2, a = 3,89841, c = 8,62650 Å для Hf<sub>2</sub>GaSb<sub>3</sub> [117]. Структурний тип Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub> є тернарним впорядкованим варіантом бінарного структурного типу UAs<sub>2</sub>. Кристалічну структуру тернарної сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> уточнено методом Рітвельда за дифрактограмою однофазного зразка Hf<sub>33,3</sub>Al<sub>16,7</sub>Sb<sub>50</sub>, виходячи з координат атомів у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>GaSb<sub>3</sub>.



Рис. 3.25. Експериментальна (точки), розрахована (лінії) та різницева (внизу рисунка) дифрактограми зразка Hf<sub>33,3</sub>Al<sub>16,7</sub>Sb<sub>50</sub> (проміння Cu Kα<sub>1</sub>). Вертикальні риски вказують на положення відбиттів сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>.

Встановлено, що кристалічна структура тернарної сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> належить до структурного типу Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>. Експериментальна, розрахована та різицева дифрактограми зразка складу Hf<sub>33</sub>Ga<sub>16,5</sub>Sb<sub>49,5</sub> представлені на рис. 3.25. Деталі експерименту та результати уточнення структури сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> подано у табл. 3.16. Склад сполуки було підтверджено локальним рентгеноспектральним аналізом.

Склад сполуки		Hf <sub>2</sub> AlSb <sub>3</sub>
СТ		Zr <sub>2</sub> CuSb <sub>3</sub>
СП		tP6
ΠΓ		<i>P-4m2</i>
Параметри елементарної	комірки: <i>a</i> , <i>c</i> , Å	3,9021(2), 8,6510(5)
Об'єм елементарної комі	рки <i>V</i> , Å <sup>3</sup>	131,74(2)
Густина $D_X$ , г см <sup>-3</sup>		9,443
Параметр текстури / [нап	рям]	0,977(4) / [110]
Дифрактометр		STOE Stadi P
Інтервал 2 <i>0</i> , °; крок, °		6-106; 0,015
Параметри профілю:	<i>U</i> , <i>V</i> , <i>W</i>	0,110(8), -0,036(6), 0,0162(16)
Параметр змішування	η	0,441(13)
Параметри асиметрії	$P_1, P_2$	0,061(9), 0,0057(15)
Фактори розбіжності:	$R_{ m B}$	0,0382
	$R_{ m p}, R_{ m wp}, \chi^2$	0,0436, 0,0491, 1,73

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> приведено у табл. 3.17. Вміст елементарної комірки та координаційні многогранники атомів зображено на рис. 3.26. Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> подано у табл. 3.18.

Таблиця 3.17

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>

$(C1 \Sigma1_2Cu50_3, C11 11 0, 111 1$						
Атом	ПСТ	x	у	Ζ	$B_{i30}$ , Å <sup>2</sup>	
Hf	2g	0	1/2	0,2636(2)	0,43(2)	
Al	1 <i>b</i>	1/2	1/2	0	1,08(10)	
Sb1	2g	0	1/2	0,6157(3)	0,74(7)	
Sb2	1 <i>a</i>	0	0	0	0,82(8)	

(CT Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>, СП *tP*6, ПГ *P*-4*m*2, *a* = 3,9021(2), *c* = 8,6510(5) Å)



Рис. 3.26. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>.

Таблиця 3.18

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>

Атоми		$\delta$ , Å	КЧ
Hf	Hf $-4$ Sb1		
	- 2 Al	3,001(1)	0
	-2 Sb2	3,001(1)	9
	– 1 Sb1	3,046(3)	
Al – 4 Sb2		2,759(1)	0
	-4 Hf	3,001(1)	0
Sb1	– 4 Hf	2,950(1)	
	– 1 Hf	3,046(3)	
	(-4 Sb2)	3,409(2)	17
	(-2 Al)	3,855(2)	1 /
	(- 2 Sb1)	3,855(2)	
	(-4 Sb2)	3,902(1)	
Sb2	-4 Al	2,759(1)	0
	– 4 Hf	3,001(1)	8

Атоми Hf оточені сімома атомами Sb та двома атомами Al, які утворюють тришапкові тригональні призми (чи тетрагональні антипризми з одним додатковим атомом) складу Al<sub>2</sub>Sb<sub>7</sub>. Координаційні многогранники атомів Al та Sb2 утворені з восьми атомів у вигляді зрощених через прямокутну грань двох тригональних призм (взаємноперпендикулярні осі призм), утворючи фігури *gyrobifastigium* складів Hf<sub>4</sub>Sb<sub>4</sub> і Hf<sub>4</sub>Al<sub>4</sub>, відповідно. Найближче оточення атомів Sb1 складається з п'яти атомів Hf, які утворюють тетрагональну піраміду, а координаційним многогранником є 17-вершинники <u>Sb1</u>Hf<sub>5</sub>Al<sub>2</sub>Sb<sub>10</sub>, які можна представити як пентагональні призми з сімома додатковими атомами.

Найкоротшими міжатомними віддалями у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> є віддалі Al–Sb2 (2,759(1) Å) і Hf–Sb1 (2,950(1) Å). Ці значення є меншими за суми атомних радіусів Al та Sb ( $r_{Al} + r_{Sb} = 1,43 + 1,59 = 3,02$  Å) і Hf та Sb ( $r_{Hf} + r_{Sb} = 1,56 + 1,59 = 3,15$  Å), відповідно, і може вказувати на частку ковалентності у зв'язках Al–Sb (сума ковалентних радіусів Al i Sb:  $r_{Al} + r_{Sb} = 1,18 + 1,40 = 2,58$  Å) і Hf–Sb (сума ковалентних радіусів Hf i Sb:  $r_{Hf} + r_{Sb} = 1,44 + 1,40 = 2,84$  Å).

З огляду на існування ВТМ бінарної сполуки HfSb<sub>2</sub> (СТ UAs<sub>2</sub>, СП tP6, ПГ P4/nmm), можна припустити, що Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> утворюється шляхом стабілізації атомами Al бінарної сполуки HfSb<sub>2</sub> до нижчих температур, а впорядкування атомів Al і Sb приводить до реалізації тернарної надструктури – СТ Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>. Слід зазначити, що у системі Zr–Sb бінарної сполуки з такою структурою знайдено не було.

## 3.2.4. Новий структурний тип Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub>

У системах {Zr,Hf}–Al–Ge при 600°С при вмісті 52,4 ат.% Zr і Hf встановлено існування тернарних сполук точкових складів  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  і Hf<sub>11</sub>Al<sub>3,50</sub>Ge<sub>6,50</sub>. Їхні кристалічні структури визначено рентгенівським дифракційним методом порошку. Нижче приведено експериментальні результати для  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$ .

Склад тернарної сполуки у системі Zr–Al–Ge (Zr<sub>11,0(1)</sub>Al<sub>3,3(2)</sub>Ge<sub>6,7(2)</sub>), визначений локальним рентгенівським спектральним аналізом (рис. 3.27), а також характер розташування та інтенсивність її відбиттів на дифрактограмах низки зразків дозволили припустити реалізацію структурного типу Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub> (СП *t1*84, ПГ *I4/mmm*) [146], чи однієї з його чисельних тернарних впорядкованих похідних.



Рис. 3.27. Зображення поверхні шліфа зразка Zr<sub>54</sub>Al<sub>10</sub>Ge<sub>36</sub> у вторинних електронах (електронний мікроскоп PEMMA-102-02). Основна фаза (світло-сіра) –

Zr<sub>11,0(1)</sub>Al<sub>3,3(2)</sub>Ge<sub>6,7(2)</sub>, темні ділянки – пори у зразку.

Уточнення параметрів профілю та структури здійснено методом Рітвельда за масивом рентгенівських дифракційних даних трифазного зразка  $Zr_{54}Al_{10}Ge_{36}$ , отриманих на дифрактометрі ДРОН-2.0М (проміння Fe Ka). Експериментальну, розраховану та різницеву дифрактограми зразка зображено на рис. 3.28. Умови експерименту та результати уточнення кристалічної структури індивідуальних фаз приведено у табл. 3.19, а координати та ізотропні параметри зміщення атомів – у табл. 3.20.

Кристалічна структура тернарного алюмоґерманіду з уточненим складом  $Zr_{11}Al_{3,34(3)}Ge_{6,66(3)}$  належить до структурного типу  $Ho_{11}Ge_{10}$  і характеризується частково впорядкованим розташуванням атомів *p*-елементів у п'яти правильних системах точок: атоми Al займають положення 8*h*, атоми Ge – положення 4*d*, тоді як три інші ПСТ (16*m*, 8*j* і 4*e*) зайняті статистичними сумішами атомів Al і Ge. Слід зазначити, що склади статистичних сумішей є різними. Надструктури з таким заповненням ПСТ структурного типу Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub> досі в літературі описано не було.



Рис. 3.28. Експериментальна (точки), розрахована (лінія) та різницева (внизу рисунка) дифрактограми зразка Zr<sub>54</sub>Al<sub>10</sub>Ge<sub>36</sub> (проміння Fe Kα). Вертикальні риски вказують на положення відбиттів індивідуальних фаз.

Таблиця 3.19

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики індивідуальних фаз у зразку Zr<sub>54</sub>Al<sub>10</sub>Ge<sub>36</sub> (дифрактометр ДРОН-2.0М, проміння Fe *K*α)

Склад сполуки	Zr <sub>11</sub> Al <sub>3,34</sub> Ge <sub>6,66</sub>	Zr <sub>5</sub> Ge <sub>4</sub>	Zr <sub>5</sub> AlGe <sub>3</sub>
Вміст (мас.%)	61,0(9)	32,7(7)	6,3(1)
СТ	Zr <sub>11</sub> Al <sub>3,34</sub> Ge <sub>6,66</sub>	$Zr_5Si_4$	$Hf_5CuSn_3$
СП	<i>tI</i> 84	<i>tP</i> 36	<i>hP</i> 18
ПГ	I4/mmm	$P4_{1}2_{1}2$	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>
Параметри елементарної комірки:			
a, Å	10,3679(9)	7,2473(8)	8,1037(19)
<i>c</i> , Å	14,8529(18)	13,1524(19)	5,567(2)
Об'єм елементарної комірки $V$ , Å <sup>3</sup>	1596,6(3)	690,81(14)	321,64(18)
Кількість формульних одиниць Z	4	4	2
Густина $D_X$ , г см <sup>-3</sup>	6,564	7,181	7,240
Параметр текстури / [напрям]	0,976(10) / [001]	_	_
Фактор розбіжності <i>R</i> <sub>В</sub>	0,0798	0,0960	0,0845
Параметри профілю: U, V, W	0,21	(5), -0,22(7), 0,1	2(2)
Параметр змішування η		0,74(3)	
Фактори розбіжності: $R_{ m p}, R_{ m wp}, \chi^2$	0,	0460, 0,0510, 4,9	92

#### Таблиця 3.20

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки

			, , , ( ,	( = -)	
Атом	ПСТ	x	У	Z	$B_{i30}$ , Å <sup>2</sup>
Zr1	16 <i>n</i>	0	0,2512(10)	0,3131(16)	0,53(7)
Zr2	16 <i>n</i>	0	0,3374(13)	0,1008(8)	0,48(8)
Zr3	8 <i>h</i>	0,3181(11)	0,3181(11)	0	0,56(6)
Zr4	4 <i>e</i>	0	0	0,1701(16)	0,50(7)
Al	8 <i>h</i>	0,147(3)	0,147(3)	0	1,16(8)
$M1^{-1}$	16 <i>m</i>	0,2098(12)	0,2098(12)	0,1786(13)	1,10(8)
M2 <sup>2</sup>	8 <i>j</i>	0,144(2)	1/2	0	1,12(8)
M3 <sup>3</sup>	4 <i>e</i>	0	0	0,3873(19)	1,03(9)
Ge	4 <i>d</i>	0	1/2	1/4	0,95(7)

 $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  (CT  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$ , C $\Pi$  *t1*84,  $\Pi\Gamma$  *14/mmm*,

*a* = 10,3679(9), *c* = 14,8529(18) Å)

Примітки:  ${}^{1}M1 = 0,19(2)Al+0,81(2)Ge; {}^{2}M2 = 0,37(2)Al+0,63(2)Ge;$ 

 $^{3}M3 = 0,48(2)Al+0,52(2)Ge.$ 

Вміст елементарної комірки та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  зображено на рис. 3.29. Координаційними многогранниками атомів Zr є 15- і 17-вершинники <u>Zr1M</u><sub>6</sub>GeZr<sub>8</sub>, <u>Zr2Al</u><sub>2</sub>M<sub>4</sub>GeZr<sub>8</sub>, <u>Zr3AlM</u><sub>6</sub>Zr<sub>10</sub> і <u>Zr4Al</u><sub>4</sub>M<sub>5</sub>Zr<sub>8</sub> (пентагональні призми з додатковими 5 чи 7 вершинами), атомів Al – тетрагональні антипризми з трьома додатковими атомами <u>AlM</u><sub>2</sub>Zr<sub>7</sub>Al<sub>2</sub>, атомів Ge – тетрагональні антипризми <u>Ge</u>Zr<sub>8</sub>, a статистичних сумішей атомів Al і Ge – тригональні призми з трьома додатковими навпроти прямокутних граней <u>M2</u>Zr<sub>8</sub>M і тетрагональні антипризми з двома додатковими атомами атомами навпроти квадратних граней – <u>M1</u>Zr<sub>8</sub>AlM і <u>M3</u>Zr<sub>9</sub>M. Міжатомні віддалі в межах координаційних многогранників приведено у табл. 3.21.

Кристалічна структура тернарного алюмогерманіду  $Hf_{11}Al_{3,50}Ge_{6,50}$ (a = 10,1764(8), c = 14,1729(13) Å) характеризується подібним заповненням ПСТ просторової групи *I4/mmm* атомами Hf, Al i Ge.

## 108

Таблиця 3.21

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки

			3,34066,66		
Атоми	$\delta, \text{\AA}$	КЧ	Атоми	$\delta$ , Å	КЧ
Zr1 – 1 Ge	2,745(13)		Al–1 Zr3	2,51(3)	
$-1 M3^{3}$	2,828(17)		$-2 M1^{1}$	2,81(2)	
$-2 M2^{2}$	2,981(19)		- 4 Zr2	2,91(3)	11
$-2 M 1^{1}$	2,984(19)		- 2 Al	3,05(4)	
$-1 M 1^{1}$	3,038(13)	1.5	– 2 Zr4	3,32(3)	
- 1 Zr2	3,277(19)	15	$M1^1 - 1 M1^1$	2,43(2)	
- 2 Zr2	3,336(15)		– 2 Zr2	2,796(16)	
- 1 Zr4	3,361(19)		- 1 Al	2,81(2)	
- 2 Zr3	3,342(19)		– 2 Zr1	2,984(19)	10
-2 Zr1	3,683(10)		– 2 Zr1	3,038(13)	
$Zr2 - 2M2^{2}$	2,704(16)		- 1 Zr4	3,079(12)	
- 1 Ge	2,784(12)		- 1 Zr3	3,092(19)	
$-2 M 1^{1}$	2,796(16)		$M2^{2}-2$ Zr3	2,611(18)	
-2 Al	2,91(3)		- 4 Zr2	2,704(16)	
- 1 Zr2	2,994(17)	1.5	– 2 Zr1	2,981(19)	9
-1 Zr1	3,277(19)	- 15	$-1 M2^{2}$	2,99(3)	
-2 Zr1	3,336(15)		$M3^{3}-4$ Zr1	2,828(17)	
- 1 Zr2	3,372(19)		- 4 Zr3	3,149(18)	10
- 2 Zr3	3,627(12)		- 1 Zr4	3,23(4)	
-1 Zr4	3,646(15)		$-1 M3^{3}$	3,35(4)	
Zr3 – 1 Al	2,51(3)		Ge–4Zr1	2,745(13)	0
$-2 M2^{2}$	2,611(18)		- 4 Zr2	2,784(12)	8
$-2 M 1^{1}$	3,092(19)				•
$-2 M3^{3}$	3,149(18)	17			
-4 Zr1	3,342(19)				
-4 Zr2	3,627(12)				
- 2 Zr3	3,772(16)				
$Zr4 - 4 M1^{1}$	3,079(12)				
$-1 M3^{3}$	3,23(4)		<del>н</del> .		
-4 Al	3,32(3)	17	Примітки:	A1+0.91(2)C	
-4 Zr1	3,361(19)		$^{2}M^{2} = 0.37(2)$	A1 + 0.81(2)Ge; A1 + 0.63(2)Ge;	
-4 Zr2	3,646(15)		$^{3}M3 = 0,48(2)$	Al+0,52(2)Ge.	

Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub>


Рис. 3.29. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub>.

Згідно з систематикою структурних типів П.І. Крип'якевича, структури Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub> і Hf<sub>11</sub>Al<sub>3,50</sub>Ge<sub>6,50</sub> слід віднести до класів структур з тригональнопризматичною та тетрагонально-антипризматичною координацією атомів малого розміру.

### 3.2.5. Фази T<sub>5</sub>AlM<sub>3</sub> (T = Zr, Hf; M = Ge, Sn, Sb) з структурою типу Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>

У системах {Zr,Hf}–Al–{Ge,Sn,Sb} при 600°С існують тернарні фази складу  $T_5$ Al $M_3$  (T = Zr, Hf; M = Ge, Sn, Sb) зі структурою типу Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> (СП *hP*18, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*). Фази Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (a = 8,104(3), c = 5,654(2) Å) [147,148], Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (a = 8,0641(3), c = 5,5874(2) Å) і Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> (a = 8,4983(4), c = 5,7459(2) Å) є

індивідуальними тернарними сполуками, тоді як Zr<sub>5</sub>AlSn<sub>3</sub> (a = 8,6184(19), c = 5,8656(14) Å) [136] і Zr<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> (a = 8,6234(17), c = 5,8802(12) Å) – граничними складами твердих розчинів заміщення Zr<sub>5</sub>Al<sub>x</sub> $M_{4-x}$  (M =Sn, Sb), а Hf<sub>5</sub>AlSn<sub>3</sub> (a = 8,6105(15), c = 5,8337(11) Å) – граничним складом твердого розчину включення Hf<sub>5</sub>Al<sub>x</sub>Sb<sub>3</sub>. Нижче приведено експериментальні результати визначення параметрів структури тернарної сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> рентгенівським дифракційним методом монокристалу.

Кристал у формі призми було відібрано зі зразка  $Zr_{55,6}Al_{11,1}Ge_{33,3}$ , а масив дифракційних даних отримано на дифрактометрі Rigaku AFC7. Після корекції експериментальних даних на поглинання, кристалічну структуру сполуки було визначено прямими методами у просторовій групі *P*6<sub>3</sub>/*mcm* та уточнено методом найменших квадратів за допомогою пакету програм WinCSD (табл. 3.22). Склад тернарної сполуки ( $Zr_{4,99(2)}Al_{1,01(3)}Ge_{3,00(3)}$ ) було незалежно визначено за допомогою енергодисперсійного рентгенівського спектрального аналізу (рис. 3.30).



Рис. 3.30. Зображення поверхні шліфа зразка Zr<sub>55,6</sub>Al<sub>11,1</sub>Ge<sub>33,3</sub> у вторинних електронах (електронний мікроскоп PEMMA-102-02). Основна фаза (cipa) – Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>, світлі вкраплення – сплав Вуда, темні ділянки – пори у зразку.

Кристалічна структура тернарного алюмоґерманіду Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> належить до структурного типу Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> (СП *hP*18, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*) і характеризується впорядкованим розміщенням атомів Zr, Al і Ge. CT Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> є тернарним впроядкованим варіантом СТ Ti<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub> (СП *hP*18, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*), який у свою чергу є

структурою включення до СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (СП *hP*16, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*). Координати та параметри зміщення атомів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>5</sub> приведено у табл. 3.23.

Таблиця 3.22

Склад сполуки	Zr <sub>5</sub> AlGe <sub>3</sub>		
СТ	Hf5CuSn3		
СП	hP18		
ΠΓ	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i>		
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , Å <i>c</i> , Å	8,104(3) 5,564(2)		
Об'єм елементарної комірки V, Å <sup>3</sup>	321,62(18)		
Кількість формульних одиниць Z	2		
Густина <i>D</i> <sub>X</sub> , г см <sup>-3</sup>	7,241		
Коефіцієнт поглинання µ, мм-1	22,2		
Кількість відбиттів: виміряних незалежних (з <i>F</i> > 3σ( <i>F</i> ))	1558 248		
Фактор розбіжності $R_{e_{KB}}$	0,0392		
Інтервал <i>h</i> , <i>k</i> , <i>l</i>	$-10 \le h \le 9, -6 \le k \le 12, -8 \le l \le 8$		
Граничний кут вимірювання $ heta, \circ$	33,4		
Фактори розбіжності: <i>R</i> <i>wR</i> <i>S</i>	0,0357 0,0375 1,01		

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики для Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>

Вміст елементарної комірки та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки  $Zr_5AlGe_3$  зображено на рис. 3.31. Навколо атомів Zr утворюються 11- і 14 вершинники  $Zr1Al_2Ge_5Zr_4$  і  $Zr2Ge_6Zr_8$ , відповідно. Дефектний антикубооктаедр  $Zr1Al_2Ge_5Zr_4$  можна також описати як деформовану пентагональну дипіраміду складу  $Ge_5Al_2$  з чотирма додатковими атомами Zr, чи як тришапкову тригональну призму складу  $Ge_5Zr_4$  з двома додатковими атомами Al. Многогранник Франка-Каспера  $Zr2Ge_6Zr_8$  можна описати як деформовану гексагональну призму складу  $Ge_6Zr_6$  з двома додатковими атомами Zr навпроти

шестикутних граней. Атоми найближчого координаційного оточення атомів Al також утворюють 14-вершинник Франка-Каспера <u>Al</u>Ge<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>Zr<sub>6</sub>, який можна описати як ромбододекаедр, утворений кубом складу Ge<sub>6</sub>Al<sub>2</sub> та октаедром складу Zr<sub>6</sub>. Атоми Ge координовані дев'ятьма атомами Zr, двома атомами Al і двома атомами Ge, які утворюють 13-вершинник Франка-Каспера <u>Ge</u>Al<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>Zr<sub>9</sub>. Його можна описати як деформований антикубооктаедр з одним додатковим атомом, чи як тришапкову тригональну призму складу Zr<sub>9</sub> з чотирма додатковими атомами.

Таблиця 3.23

Атом	ПСТ		x			у		Z		$B_{i30}$
Zr1	6g		0,2567	7(2)		0		1/4		1,21(4)
Zr2	4 <i>d</i>		1/3		2	2/3		0		0,87(3)
Al	2b		0			0		0		1,27(14)
Ge	6g		0,6100(2) 0			1/4		1,05(4)		
Атом	$B_{11}$		$B_{22}$	l	B <sub>33</sub>	<i>B</i> <sub>12</sub>		<i>B</i> <sub>13</sub>		<i>B</i> <sub>23</sub>
Zr1	1,25(4)	(	),87(5)	1,0	9(5)	0,43(	2)	0		0
Zr2	0,86(3)	(	),86(3)	0,5	9(5)	0,43(	2)	0		0
Al	1,4(2)		1,4(2)	0,	6(2)	0,69(	9)	0		0
Ge	0,96(4)	(	),94(5)	0,9	94(5)	0,47(	3)	0		0

Координати та параметри зміщення атомів (Å<sup>2</sup>) у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (CT Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, СП *hP*18, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, a = 8,104(3), c = 5,564(2) Å)

Міжатомні віддалі у структурі сполуки  $Zr_5AlGe_3$  приведено у табл. 3.24. Їхні значення корелюють з сумами атомних радіусів компонентів і узгоджуються з міжатомними віддалями у структурах бінарних алюмінідів і ґерманідів цирконію. Найкоротшими віддалями у структурі є віддалі між атомами Zr1 і Al (2,5151(8) Å), значення яких є меншими за суми атомних радіусів Zr і Al. Іншою особливістю структури сполуки  $Zr_5AlGe_3$  є екстримально короткі віддалі Zr2-Zr2 (2,8270(8) Å), що вказує на сильну взаємодію між атомами цирконію.



Рис. 3.31. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>.

Таблиця 3.24

КЧ	$\delta$ , Å	Атоми	КЧ	$\delta$ , Å	Атоми
	2,5151(8)	Al – 6 Zr1		2,5151(8)	Zr1 - 2A1
14	2,8270(8)	– 2 Al		2,782(1)	– 2 Ge
	3,4616(9)	– 6 Ge	11	2,864(1)	– 1 Ge
	2,782(1)	Ge – 2 Zr1		3,0261(8)	– 2 Ge
	2,864(1)	– 2 Zr1		3,3702(9)	- 4 Zr2
12	2,8752(8)	-4 Zr2		2,8270(8)	Zr2 – 2 Zr2
15	3,0261(8)	– 1 Zr1	14	2,8752(8)	– 6 Ge
	3,3430(9)	– 2 Ge		3,3702(9)	- 6 Zr1
l	3,4616(9)	-2 Al			

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>

## 3.2.6. Сполуки Hf<sub>5</sub>Al<sub>3-x</sub> $M_x$ (M = Si, Ge, Sn, Sb) з структурою типу Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>

У системах Hf–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С на ізоконцентратах 62,5 ат.% Hf і при невеликому вмісті Si, Ge, Sn чи Sb (до 5 ат.%) існують тернарні сполуки Hf<sub>5</sub>Al<sub>3-x</sub> $M_x$  зі структурою типу Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (СП *hP*16, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*). Результати уточнення кристалічної структури приведено нижче на прикладі сполуки Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,49</sub>Sb<sub>0,51</sub>.

Кристалічну структуру тернарної сполуки  $Hf_5Al_{2,49}Sb_{0,51}$  уточнено методом Рітвельда за дифрактограмою двофазного зразка  $Hf_{60}Al_{35}Sb_5$ , який, крім основної фази, містив 12,4(5) мас.% бінарної сполуки  $Hf_4Al_3$ . Експериментальна, розрахована та різницева дифрактограми зразка складу  $Hf_{60}Al_{35}Sb_5$  представлені на рис. 3.32. Деталі експерименту та результати уточнення структури сполуки  $Hf_5Al_{2,48}Sb_{0,52}$  подано у табл. 3.25. Склад сполуки було підтверджено локальним рентгеноспектральним аналізом ( $Hf_{5,05(6)}Al_{2,52(6)}Sb_{0,48(6)}$ ).



Рис. 3.32. Експериментальна (точки), розрахована (лінія) та різницева (внизу рисунка) дифрактограми зразка Hf<sub>60</sub>Al<sub>35</sub>Sb<sub>5</sub> (проміння Fe Kα). Вертикальні риски вказують на положення відбиттів індивідуальних фаз.

Кристалічна структура тернарної сполуки з уточненим складом  $Hf_5Al_{2,49(6)}Sb_{0,51(6)}$  належить до структурного типу  $Mn_5Si_3$  (ПГ  $P6_3/mcm$ ) і характеризується невпорядкованим розташуванням атомів *p*-елементів: атоми Hf займають положення 6*g* і 4*d*, а статистична суміш атомів Al і Sb – положення 6*g*. Координати та ізотропні параметри зміщення атомів приведено у табл. 3.26.

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики індивідуальних фаз у

Склад сполуки	$Hf_5Al_{2,49}Sb_{0,51}$	Hf <sub>4</sub> Al <sub>3</sub>		
Вміст, мас.%	87,6(7)	12,4(5)		
СТ	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	Zr <sub>4</sub> Al <sub>3</sub>		
СП	<i>hP</i> 16	hP7		
ПГ	P6 <sub>3</sub> /mcm	P6/mmm		
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , Å <i>c</i> , Å	8,0934(5) 5,6560(5)	5,335(2) 5,428(2)		
Об'єм елементарної комірки V, Å <sup>3</sup>	320,85(4)	133,8(3)		
Кількість формульних одиниць Z	2	1		
Густина $D_{\rm X}$ , г см <sup>-3</sup>	10,580	9,869		
Параметр текстури / [напрям]	0,873(11) / [110]	_		
Фактор розбіжності <i>R</i> <sub>В</sub>	0,0682	_		
Параметри профілю: U V W	0,23 0,05 0,02	0,231(4) 0,056(8) 0,021(3)		
Параметр змішування η	0,82	26(4)		
Фактори розбіжності: $R_{p}$ $R_{wp}$ $\chi^{2}$	0,0 0,0 1,	0,0509 0,0574 1,18		

зразку  $Hf_{60}Al_{35}Sb_5$  (дифрактометр ДРОН-2.0М, проміння Fe  $K\alpha$ )

## Таблиця 3.26

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки  $Hf_5Al_{2,49}Sb_{0,51}$  (СТ  $Mn_5Si_3$ , СП *hP*16, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*, *a* = 8,0934(5), *c* = 5,6560(5) Å)

Атом	ПСТ	x	У	Z	$B_{ m i30}$ , Å <sup>2</sup>
Hf1	6g	0,2413(2)	0	1/4	0,49(8)
Hf2	4 <i>d</i>	1/3	2/3	0	0,53(8)
$M^1$	6g	0,6157(3)	0	1/4	0,94(9)

Примітка:  $^{1} M = 0,83(2)$ Al+0,17(2)Sb.

Вміст елементарної комірки та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,49</sub>Sb<sub>0,51</sub> зображено на рис. 3.33. Координаційними многогранниками атомів Hfl є 15-вершинники <u>Hfl</u>M<sub>5</sub>Hf<sub>10</sub>, які можна описати як пентагональні призми складу Hf<sub>10</sub> з п'ятьма додатковими атомами статистичної суміші *M*. Навколо атомів Hf2 формуються 14-вершинники, які можна описати як деформовані гексагональні призми складу Hf<sub>6</sub>M<sub>6</sub> з двома додатковими атомами Hf навпроти шестикутних граней. Координаційними многогранниками атомів статистичної суміші *M* є дефектні ікосаедри складу M<sub>2</sub>Hf<sub>9</sub>. Їх також можна описати як тришапкові тригональні призми складу Hf<sub>9</sub> з двома додатковими атомами. Міжатомні віддалі у структурі сполуки Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,49</sub>Sb<sub>0,51</sub> приведено у табл. 3.27. Найкоротшими віддалями у структурі є віддалі між атомами Hfl і статистичною сумішшю атомів *M* ( $\delta_{Hfl-M} = 2,723(2)$  Å), а також між атомами Hf ( $\delta_{Hf2-Hf2} = 2,8270(8)$  Å), що вказує на сильну взаємодію. Значення інших міжатомних віддалей корелюють з відповідними сумами атомних радіусів компонентів.



Рис. 3.33. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,49</sub>Sb<sub>0,51</sub>.

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки

A	гоми	$\delta$ , Å	КЧ
Hf1	$-2 M^{1}$	2,723(2)	
	$- 1 M^{1}$	3,030(3)	
	$-2 M^{1}$	3,056(1)	15
	– 2 Hfl	3,383(2)	15
	– 4 Hfl	3,437(1)	
	– 4 Hf2	3,441(1)	
Hf2	– 2 Hf2	2,828(1)	
	$- 6 M^{1}$	2,887(1)	14
	– 6 Hfl	3,441(1)	

Hf <sub>5</sub> Al <sub>2,49</sub> Sb <sub>0,51</sub> КЧ Атоми		
КЧ	Атоми	

A	Атоми	$\delta$ , Å	КЧ
$M^{1}$	– 2 Hf1	2,723(2)	
	– 4 Hf2	2,887(1)	
	– 1 Hf1	3,030(3)	11
	– 2 Hf1	3,056(1)	
	$-2 M^{1}$	3,392(2)	

Примітка:  $^{1} M = 0,83(2)$ Al+0,17(2)Sb.

Кристалічні структури ізоструктурних сполук  $Hf_5Al_{2,54}Si_{0,46}$  (a = 8,0321(3), c = 5,6247(2) Å),  $Hf_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$  (a = 8,0880(3), c = 5,6511(2) Å) і  $Hf_5Al_{2,70}Sn_{0,30}$  (a = 8,0910(4), c = 5,6515(4) Å) характеризуються подібним розташуванням атомів у ПСТ просторової групи  $P6_3/mcm$ , і подібними координаційними многогранниками атомів.

Згідно з систематикою структурних типів П.І. Крип'якевича, структурний тип Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> слід віднести до структур з тригонально-призматичною координацією атомів малого розміру.

# 3.2.7. Сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>3-x</sub> $M_x$ (M = Si, Ge, Sn, Sb) i Hf<sub>5</sub>Al<sub>3-x</sub> $M_x$ (M = Sn, Sb) з структурою типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>

У системах Zr–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С на ізоконцентратах 62,5 ат.% Zr і при невеликому вмісті Si, Ge, Sn чи Sb (до 7 ат.%) існують тернарні сполуки постійного складу  $Zr_5Al_{2,44}Si_{0,56}$ ,  $Zr_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$ ,  $Zr_5Al_{2,71}Sn_{0,29}$  і  $Zr_5Al_{2,55}Sb_{0,45}$  зі структурою типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> (СП *tI*32, ПГ *I*4/*mcm*).

Кристалічну тернарної сполуки  $Zr_5Al_{2.70}Ge_{0.30}$ визначено структуру рентгенівським дифракційним методом порошку за дифрактограмою зразка Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>35</sub>Ge<sub>2,5</sub> (дифрактометр STOE Stadi P, проміння Cu  $K\alpha_1$ , інтервал 6°  $\leq 2\theta \leq$ 110°, крок сканування 0,015°) [149,150]. Положення та інтенсивності відбиттів основної фази засвідчили реалізацію структурного типу W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, чи його похідного. Уточнення кристалографічних параметрів тернарної фази Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.70</sub>Ge<sub>0.30</sub> провели методом Рітвельда, виходячи з координат атомів високотемпературної модифікації сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub> (СТ W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, СП *tI*32, ПГ *I*4/*mcm*, *a* = 11,049, *c* = 5,396 Å [17]), які було взято за початкову модель. Крім основної фази, зразок містив 4,3(2) мас.% алюмініду Zr<sub>2</sub>Al та 4,0(2) мас.% алюмоґерманіду Zr<sub>5</sub>Al<sub>0.8</sub>Ge<sub>2.2</sub>, склад якого відповідає граничному складу твердого розчину заміщення на основі ґерманіду Zr<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub>. Склад тернарної сполуки (Zr<sub>4.96(8)</sub>Al<sub>2.72(8)</sub>Ge<sub>0.32(8)</sub>) попередньо було визначено локальним енергодисперсійним рентгенівським спектральним аналізом (рис. 3.34).



Рис. 3.34. Зображення поверхні шліфа зразка Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>35</sub>Ge<sub>2,5</sub> у вторинних електронах (електронний мікроскоп PEMMA-102-02). Основна фаза – тернарна сполука Zr<sub>4,96(8)</sub>Al<sub>2,72(8)</sub>Ge<sub>0,32(8)</sub>, темні ділянки – пори у зразку.

Експериментальна, розрахована та різницева дифрактограми зразка складу Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>35</sub>Ge<sub>2,5</sub> зображені на рис. 3.35. Деталі експерименту та результати уточнення структури сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> наведено у табл. 3.28.

119

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики індивідуальних фаз у

Фаза	$Zr_5Al_{2,70(2)}Ge_{0,30(2)}$	Zr <sub>2</sub> Al	Zr <sub>5</sub> Al <sub>0,8</sub> Ge <sub>2,2</sub>			
Вміст фази, мас.%	91,7(6)	4,3(2)	4,0(2)			
СТ	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	Co <sub>1,75</sub> Ge	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>			
СП	<i>tI</i> 32	hP6	<i>hP</i> 16			
ПГ	I4/mcm	$P6_3/mmc$	P6 <sub>3</sub> /mcm			
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , Å <i>c</i> , Å	11,0145(7) 5,3921(4)	4,8936(5) 5,9284(9)	8,1561(11) 5,6841(10)			
Об'єм комірки <i>V</i> , Å <sup>3</sup>	654,17(8)	122,95(3)	327,46(9)			
Кількість формульних одиниць Z	4	2	2			
Густина <i>D</i> <sub>X</sub> , г·см <sup>-3</sup>	5,591	5,657	6,696			
Параметр текстури G [напрям]	0,885(2) [001]	_	_			
Фактор розбіжності <i>R</i> <sub>В</sub>	0,0603	0,0901	0,0986			
Параметри профілю: U V W	0,095(9) 0,029(9) 0,0075(19)					
Параметр змішування		0,908(9)				
Параметри асиметрії Р1, Р2	0,015(6), -0,0048(13)					
Фактори розбіжності: $R_{\rm p}$ $R_{\rm wp}$ $\chi^2$		0,0369 0,0401 1,82				

зразку  $Zr_{62,5}Al_{35}Ge_{2,5}$  (дифрактометр STOE Stadi P, проміння Cu  $K\alpha_1$ )

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки  $ZrAl_{2,70}Ge_{0,30}$  наведено у табл. 3.29. Кристалічна структура сполуки  $Zr_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$  (ПГ *I4/mcm*) характеризуються двома ПСТ, зайнятими атомами Zr, та двома ПСТ, зайнятими атомами *p*-елементів, причому положення 4*a* зайняте виключно атомами Al, тоді як положення 8*h* – статистичною сумішшю атомів Al і Ge. Часткове впорядкування атомів *p*-елементів зумовлює утворення тернарної надструктури до бінарного структурного типу  $W_5Si_3$  – CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>. Вміст

елементарної комірки та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> зображено на рис. 3.36.



Рис. 3.35. Експериментальна (точки), розрахована (лінія) та різницева (внизу рисунка) дифрактограми зразка Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>35</sub>Ge<sub>2,5</sub> (проміння Cu Kα<sub>1</sub>). Вертикальні риски вказують на положення відбиттів індивідуальних фаз.

Таблиця 3.29

Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки

Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70(2)</sub>Ge<sub>0,30(2)</sub> (CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, CΠ *tI*32, ΠΓ *I*4/*mcm*,

a = 11,0145(7), c = 5,3921(4) Å)

Атом	ПСТ	x	У	Z	$B_{i30}$ , Å <sup>2</sup>
Zr1	16 <i>k</i>	0,08050(12)	0,21911(13)	0	0,61(3)
Zr2	4 <i>b</i>	0	1/2	1/4	0,49(7)
$M^1$	8 <i>h</i>	0,1663(3)	0,6663(3)	0	1,28(19)
Al	4 <i>a</i>	0	0	1/4	1,01(7)

Примітка:  $^{1}M = 0.851(8)Al + 0.149(8)Ge$ .



Рис. 3.36. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub>.

У структурі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> атоми Zr оточені 15 і 14 атомами, які формують 15- та 14-вершинники Франка-Каспера <u>Zr1</u>Al<sub>2</sub>M<sub>4</sub>Zr<sub>9</sub> і <u>Zr2</u>M<sub>4</sub>Zr<sub>10</sub>, відповідно. Атоми статистичної суміші *M* оточені десятьма атомами Zr, які утворюють поліедри <u>M</u>Zr<sub>10</sub>, які можна описати як дефектний ікосаедр. Навколо атомів Al утворюється двошапкова тетрагональна антипризма. Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> наведено у табл. 3.30. Міжатомні віддалі корелюють з сумами атомних і металічних радіусів компонентів і відповідними віддалями у структурах бінарних алюмінідів і германідів цирконію. Особливістю структури є коротка віддаль між атомами Zr ( $\delta_{Zr2-Zr2} = 2,6961(2)$  Å), засвідчуючи сильну взаємодію між ними.

Кристалічні структури ізоструктурних сполук  $Zr_5Al_{2,44}Si_{0,56}$  (a = 11,0454(4), c = 5,3942(2) Å),  $Zr_5Al_{2,71}Sn_{0,29}$  (a = 11,0530(9), c = 5,4071(5) Å) i  $Zr_5Al_{2,55}Sb_{0,45}$ (a = 11,0120(9), c = 5,3913(5) Å) характеризуються подібним розташуванням атомів у ПСТ просторової групи *I4/mcm* і подібними координаційними многогранниками атомів. Отже, кристалічна структура сполук  $Zr_5Al_{2,44}Si_{0,56}$ ,  $Zr_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$ ,  $Zr_5Al_{2,71}Sn_{0,29}$  і  $Zr_5Al_{2,55}Sb_{0,45}$  належить до типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, що є тернарним впорядкованим варіантом бінарного структурного типу  $W_5Si_3$ . Оскільки, згідно з літературними відомостями, бінарний алюмінід  $Zr_5Al_3$  з цією структурою стабільний за вищих температур, і, згідно з результатами нашого дослідження, він не існує при 600°С, ці фази можна вважати індивідуальними тернарними сполуками при 600°С, що, можливо, утворюються шляхом стабілізації атомами Si, Ge, Sn чи Sb твердих розчинів заміщення на основі  $Zr_5Al_3$  до нижчих температур.

#### Таблиця 3.30

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки

Атоми	$\delta$ , Å	КЧ	A	гоми	$\delta$ , Å	ΚĽ
$Zr1 - 1 M^1$	2,849(5)		Zr2 –	- 2 Zr2	2,6961(2)	
- 2 Al	2,9031(13)			$-4 M^{1}$	2,920(4)	14
$-1 M^{1}$	2,997(5)			- 8 Zr1	3,4893(13)	
- 1 Zr1	3,121(2)		$M^1$ –	- 2 Zr1	2,849(5)	
$-2 M^{1}$	3,123(2)	15		- 2 Zr2	2,920(4)	10
- 2 Zr1	3,2270(11)		-	– 2 Zr1	2,997(5)	10
- 2 Zr1	3,4540(13)		-	-4 Zr1	3,123(2)	
-2 Zr <sup>2</sup>	2 3,4893(13)			– 2 Al	2,6961(2)	10
– 2 Zr1	3,636(2)		Al .	– 8 Zr1	2,9031(13)	

 $Zr_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$ 

Примітка:  $^{1}M = 0,851(8)A1 + 0,149(8)Ge$ .

Якщо у системах Zr–Al–{Si,Ge} вищеописані тернарні сполуки зі структурою типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> є єдиними тернарними сполуками, що існують на ізоконцентратах 62,5 ат.% Zr, то у системах Zr–Al–{Sn,Sb}, окрім таких сполук, при меншому вмісті Al існує ще по одній тернарній сполуці з такою ж кристалічною структурою – Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>Sn<sub>1,32-2,60</sub> і Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,55-0,65</sub>Sb<sub>1,45-2,35</sub>, відповідно. Ізоструктурні тернарні сполуки також були знайдені у системах з Hf: Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,33-0,78</sub>Sn<sub>1,67-2,22</sub> і Hf<sub>5</sub>Al<sub>1,52-0,74</sub>Sb<sub>1,48-2,26</sub>. Нижче приведено результати детального визначення кристалічних структур тернарних сполук системи Zr–Al–Sn, що існують на ізоконцентраті 62,5 ат.% Zr при 600°C [136,141,151].

Кристалічні структури тернарних сполук Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,71</sub>Sn<sub>0,29</sub> і Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>Sn<sub>1,32-2,60</sub> визначено рентгенівським дифракційним методом порошку за масивами даних, отриманих на дифрактометрі STOE Stadi P від зразків Zr<sub>62.5</sub>Al<sub>32.5</sub>Sn<sub>5</sub> i Zr<sub>62.5</sub>Al<sub>5</sub>Sn<sub>32.5</sub>. Сплав Zr<sub>62.5</sub>Al<sub>32.5</sub>Sn<sub>5</sub> містив три фази: дві тернарні фази, Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.71</sub>Sn<sub>0.29</sub> і Zr<sub>5</sub>Al<sub>1.68</sub>Sn<sub>1.32</sub> (багатий на алюміній граничний склад області гомогенності тернарної сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>Sn<sub>1,32-2,60</sub>) зі структурами, похідними від СТ W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, і бінарний алюмінід Zr<sub>2</sub>Al (СТ Со<sub>1,75</sub>Ge). Однофазний зразок Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>5</sub>Sn<sub>32,5</sub> містив тернарну фазу Zr<sub>5</sub>Al<sub>0.40</sub>Sn<sub>2.60</sub> (багатий на олово граничний склад області гомогенності тернарної сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>1.68-0.40</sub>Sn<sub>1.32-2.60</sub>). Таким чином було визначено параметри структури для тернарної сполуки постійного складу Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.71</sub>Sn<sub>0.29</sub> і для граничних складів області гомогенності тернарної сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>1.68-0.40</sub>Sn<sub>1.32-2.60</sub>. Параметри профілів дифрактограм і структури індивідуальних фаз уточнено методом Рітвельда Деталі експерименту та результати (рис. 3.37). уточнення структури індивідуальних фаз у зразках Zr<sub>62.5</sub>Al<sub>32.5</sub>Sn<sub>5</sub> і Zr<sub>62.5</sub>Al<sub>5</sub>Sn<sub>32.5</sub> наведено у табл. 3.31. Склади тернарних фаз, визначені локальним енергодисперсійним рентгенівським  $(Zr_{5,01(4)}Al_{2,69(5)}Sn_{0,31(6)},$ спектральним аналізом  $Zr_{5,04(4)}Al_{1,66(6)}Sn_{1,37(6)}$ i Zr<sub>4.97(8)</sub>Al<sub>0.43(7)</sub>Sn<sub>2.60(9)</sub>) (рис. 3.38) узгоджуються зі складами, отриманими в результаті уточнення параметрів структур.

Кристалічні структури тернарних сполук  $Zr_5Al_{2,71}Sn_{0,29}$  і  $Zr_5Al_{1,68-0,40}Sn_{1,32-2,60}$ належать до тетрагонального структурного типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> (СП *tl*32, ПГ *l4/mcm*) і характеризуюються чотирма ПСТ (табл. 3.32). В обох структурах ПСТ 16*k* і 4*b* зайняті атомами Zr, тоді як заповнення ПСТ 8*h* і 4*a* атомами *p*-елементів є різним в залежності від складу фази. У структурі багатої на Al тернарної сполуки точкового складу  $Zr_5Al_{2,71}Sn_{0,29}$  ПСТ 8*h* зайнята статистичною сумішшю атомів Al і Sn, а ПСТ 4*a* — виключно атомами Al, подібно до структури тернарної сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub>, описаної вище. Розподіл атомів *p*-елементів у структурі тернарної сполуки з областю гомогенності Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68-0,40</sub>Sn<sub>1,32-2,60</sub> змінюється в залежності від вмісту Al і Sn: у структурі багатого на Al граничного складу області гомогенності сполуки обидві ПСТ 8*h* і 4*a* зайняті статистичними сумішами атомів Al і Sn, тоді як у структурі багатого на Sn граничного складу області гомогенності сполуки

ПСТ 8*h* зайнята виключно атомами Sn a ПСТ 4*a* – статистичною сумішшю атомів Al i Sn.



Рис. 3.37. Експериментальні (точки), розраховані (лінії) та різницеві (внизу рисунків) дифрактограми зразків Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>32,5</sub>Sn<sub>5</sub> (*a*) і Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>5</sub>Sn<sub>32,5</sub> (б) (проміння Cu Kα<sub>1</sub>). Вертикальні риски вказують на положення відбиттів індивідуальних фаз.

125

Деталі експерименту і кристалографічні характеристики індивідуальних фаз у

## зразках Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>32,5</sub>Sn<sub>5</sub> i Zr<sub>62,5</sub>Al<sub>5</sub>Sn<sub>32,5</sub>

## (дифрактометр STOE Stadi P, проміння Cu Ka1)

Склад зразка	2	$Zr_{62,5}Al_{32,5}Sn_5$		Zr <sub>62,5</sub> Al <sub>5</sub> Sn <sub>32,5</sub>
Уточнений склад фази	$Zr_5Al_{2,71(1)}Sn_{0,29(1)}$	$Zr_5Al_{1,68(3)}Sn_{1,32(3)}$	Zr <sub>2</sub> Al	$Zr_5Al_{0,40(1)}Sn_{2,60(1)}$
Вміст фази, мас.%	54,4(5)	38,5(6)	7,1(1)	100
СТ	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>	W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>	Co <sub>1,75</sub> Ge	Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub>
СП	<i>tI</i> 32	<i>tI</i> 32	hP6	<i>tI</i> 32
ПГ	I4/mcm	I4/mcm	P6 <sub>3</sub> /mmc	I4/mcm
Параметри елементарної комірки: <i>a</i> , Å <i>c</i> , Å	11,0530(9) 5,4071(5)	11,1005(9) 5,4537(5)	4,8842(8) 5,9186(10)	11,1829(12) 5,5449(6)
Об'єм комірки <i>V</i> , Å <sup>3</sup>	660,58(10)	672,01(10)	330,23(11)	693,43(13)
Кількість формульних одиниць Z	4	4	2	4
Густина <i>D</i> <sub>X</sub> , г · см - <sup>3</sup>	5,670	6,503	5,656	7,257
Параметр текстури <i>G</i> [напрям]	0,933(3) / [001]	0,888(4) / [110]	_	0,971(3) / [110]
Фактор розбіжності <i>R</i> в	0,0500	0,0362	_	0,0581
Параметри профілю: U V W		$0,253(17) \\ 0,055(14) \\ 0,007(3)$		
Параметр змішування η		0,727(10)		0,742(11)
Параметри асиметрії: P1 P2	0,056(10) 0,008(3)			0,022(8) 0,0037(18)
		0,0314 0,0416 1,53		0,0366 0,0421 1,62



Рис. 3.38. Зображення поверхнонь шліфів зразків  $a - Zr_{62,5}Al_{32,5}Sn_5$  (темна фаза –  $Zr_{5,01(4)}Al_{2,69(5)}Sn_{0,31(6)}$ , світла фаза –  $Zr_{5,04(4)}Al_{1,66(6)}Sn_{1,37(6)}$ ) і  $\delta - Zr_{62,5}Al_5Sn_{32,5}$  (світла фаза –  $Zr_{4,97(8)}Al_{0,43(7)}Sn_{2,60(9)}$ ) у вторинних електронах

(електронний мікроскоп TESCAN Vega 3 LMU).

Таблиця 3.32

### Координати та ізотропні параметри зміщення атомів

у структурах сполук Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,71(1)</sub>Sn<sub>0,29(1)</sub> i Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68(3)-0,40(1)</sub>Sn<sub>1,32(3)-2,60(1)</sub>

Атом	ПСТ	x	У	Z	$B_{i30}$ , Å <sup>2</sup>					
$Zr_5Al_{2,71(1)}Sn_{0,29(1)}$										
Zr1	16 <i>k</i>	0,08003(17)	0,21966(16)	0	0,59(5)					
Zr2	4 <i>b</i>	0	1/2	1/4	0,61(9)					
0,854(5)Al+0,146(5)Sn	8h	0,1666(4)	0,6666(4)	1/4	1,1(2)					
Al	4 <i>a</i>	0	0	1/4	0,9(3)					
	$Zr_{5}$	$Al_{1,68(3)}Sn_{1,32(3)}$								
Zr1	16 <i>k</i>	0,0792(2)	0,2172(3)	0	0,63(7)					
Zr2	4 <i>b</i>	0	1/2	1/4	0,45(12)					
0,427(16)Al + 0,573(16)Sn	8h	0,1643(3)	0,6643(3)	1/4	1,4(2)					
0,827(15)Al + 0,173(15)Sn	4 <i>a</i>	0	0	1/4	1,5(3)					
	$Zr_5Al_{0,40(1)}Sn_{2,60(1)}$									
Zr1	16 <i>k</i>	0,07826(19)	0,21869(18)	0	0,31(4)					
Zr2	4 <i>b</i>	0	1/2	1/4	0,54(9)					
Sn	8h	0,16467(14)	0,66467(14)	1/4	1,03(6)					
0,596(10)Al + 0,404(10)Sn	4 <i>a</i>	0	0	1/4	1,1(2)					

Координаційні многогранники у структрі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.71</sub>Sn<sub>0.29</sub> є подібними до поліедрів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2.70</sub>Ge<sub>0.30</sub> (див. рис. 3.36), тоді як у структурі  $Zr_5Al_{0.40}Sn_{2.60}$ , внаслідок перерозподілу атомів *p*-елеменів у ПСТ 8*h* і 4*a*, їхні склади зазнають змін (рис. 3.39). Міжатомні віддалі у структурі Zr<sub>5</sub>Al<sub>0.40</sub>Sn<sub>2.60</sub> приведено у табл. 3.33. Їхні значення корелюють з відповідними сумами атомних радіусів, за коротших віддалей між Zr винятком дещо атомами  $(\delta_{(Zr2-Zr2)})$ 2,772(1) Å), Zr i Sn ( $\delta_{(Zr1-Sn)} = 2,938(3)$  i 3,014(3),  $\delta_{(Zr2-Sn)} = 2,950(1)$  Å) i атомами статистичної суміші M ( $\delta_{(M-M)} = 2,772(1)$  Å), що вказує на значну взаємодію між відповідними атомами.

тернарні фази (CT  $Nb_5SiSn_2$ ) Чотири ізоструктурні v системах Zr,Hf-Al-Sn,Sbхарактеризуються областями гомогенності вздовж ізоконцентрат 62,5 ат.% Zr чи Hf. Їхні протяжності було встановлено за допомогою рентгенівського дифракційного (фазового та структурного) і рентгенівського спектрального аналізів. Параметри елементарної комірки в межах областей гомогенності тернарних сполук змінюються практично лінійно, відповідно до розмірів атомів *р*-елементів (табл. 3.34).



Рис. 3.39. Елементарна комірка та координаційні многогранники атомів у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>0.40</sub>Sn<sub>2.60</sub>.

Міжатомні віддалі та координаційні числа атомів у структурі сполуки

A	гоми	$\delta$ , Å	КЧ	ŀ	Атоми	$\delta$ , Å	КЧ
Zr1	- 1 Sn	2,938(3)		Zr2	- 2 Zr2	2,772(1)	
	$-2 M^{1}$	2,944(2)			-4 Sn	2,950(1)	14
	- 1 Sn	3,014(3)			– 8 Zr1	3,547(2)	-
	– 1 Zr1	3,211(3)		Sn	– 2 Zr1	2,938(3)	
	- 2 Sn	3,213(1)	15		– 2 Zr2	2,950(1)	10
	- 2 Zr1	3,279(2)			- 2 Zr1	3,014(3)	10
	-2 Zr1	3,547(2)			-4 Zr1	3,213(1)	
	- 2 Zr2	3,552(2)		<b>M</b> 1	$-2 M^{1}$	2,772(1)	10
	-2 Zr1	3,673(3)		IVI -	- 8 Zr1	2,944(2)	10

Zr<sub>5</sub>Al<sub>0,40</sub>Sn<sub>2,60</sub>

Примітка:  $^{1}M = 0,596(10)Al + 0,404(10)Sn.$ 

Таблиця 3.34

## Параметри елементарної комірки для сполук

 $T_5$ Al<sub>3-x</sub> $M_x$  (T = Zr, Hf; M = Sn, Sb, CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, CII *tI*32, III *I*4/*mcm*)

Склад	<i>a</i> , Å	<i>c</i> , Å	<i>V</i> , Å <sup>3</sup>
1	2	3	4
	Zr <sub>5</sub> Al <sub>1,68-0</sub> ,	$_{40}$ Sn <sub>1,32-2,60</sub>	
$Zr_5Al_{1,68}Sn_{1,32}$	11,1005(9)	5,4537(5)	672,01(10)
$Zr_5Al_{1,20}Sn_{1,80}$	11,1271(2)	5,4829(12)	678,9(3)
$Zr_5Al_{0,80}Sn_{2,20}$	11,1553(2)	5,5133(12)	686,1(3)
$Zr_5Al_{0,40}Sn_{2,60}$	11,1829(12)	5,5449(6)	693,43(13)
	$Hf_{5}Al_{1,33-0,3}$	$_{78}$ Sn <sub>1,67-2,22</sub>	
$Hf_{5}Al_{1,33}Sn_{1,67}$	10,9627(8)	5,4138(4)	650,63(9)
$Hf_5Al_{1,20}Sn_{1,80}$	10,9684(9)	5,4195(5)	652,00(11)
$Hf_{5}Al_{0,78}Sn_{2,22}$	11,0291(9)	5,4913(5)	667,98(10)

129

1	2	3	4							
Zr <sub>5</sub> Al <sub>1,55-0,65</sub> Sb <sub>1,45-2,35</sub>										
$Zr_5Al_{1,55}Sb_{1,45}$	10,9810(9)	5,4153(5)	652,99(10)							
$Zr_5Al_{1,20}Sb_{1,80}$	11,012(2)	5,4247(13)	657,8(3)							
$Zr_5Al_{0,80}Sb_{2,20}$	11,044(2)	5,4361(12)	663,0(3)							
Zr <sub>5</sub> Al <sub>0,65</sub> Sb <sub>2,35</sub>	11,0731(12)	5,4482(6)	668,02(12)							
	$Hf_5Al_{1,52-0}$	,74Sb1,48-2,26								
$Hf_5Al_{1,52}Sb_{1,48}$	10,8908(8)	5,5114(4)	653,70(9)							
$Hf_5Al_{1,20}Sb_{1,80}$	10,9081(19)	5,5243(12)	657,3(3)							
Hf <sub>5</sub> Al <sub>0,74</sub> Sb <sub>2,26</sub>	10,9344(9)	5,5403(5)	662,40(10)							

Згідно з систематикою структурних типів П.І. Крип'якевича, структурні типи W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> і Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> належать до структур з тетрагонально-антипризматичною координацією атомів малого розміру.

#### РОЗДІЛ 4

#### ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

# 4.1. Особливості взаємодії компонентів у системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}

Проведені нами дослідження взаємодії компонентів у потрійних системах  $\{Zr,Hf\}-Al-\{Si,Ge,Sn,Sb\}$  є частиною систематичних досліджень металічних систем за участю перехідних *d*-металів та *p*-елементів 13-15 груп періодичної системи, які здійснюють на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ізотермічні перерізи (600°С) діаграм стану потрійних систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} побудовано вперше. Лише для системи Zr-Al-Si у літературі є відомості про ізотермічні перерізи її діаграми стану при інших температурах – 700 і 1200°С [88]. Порівнюючи характер взаємодії компонентів у системі Zr-Al-Si при 600, 700 і 1200°С можна виділити як певні подібності, так і відмінності. Так, при всіх температурах встановлено існування тернарної сполуки ZrAl<sub>3-x</sub>Si<sub>x</sub> (ZrAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub> при 600°С, ZrAl<sub>2,7-2,4</sub>Si<sub>0,3-0,6</sub> при 1200°С) зі структурою типу TiAl<sub>3</sub>, яка перебуває у рівновазі з Al і бінарним цирконій триалюмінідом. Для тернарної сполуки на ізотермічному перерізі діаграми стану при 1200°С зображено невелику область гомогенності вздовж ізоконцентрати 25 ат.% Zr. При всіх зазначених температурах бінарні алюмініди цирконію не розчиняють помітної кількості Si, за винятком Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub> і Zr<sub>2</sub>Al при 1200°C, на основі яких утворюються протяжний обмежений твердий розчин заміщення  $Zr_5Al_{3-x}Si_x$  (x = 0.2,8) і HPTP  $Zr_2Al_{1-x}Si_x$ (x = 0-1). У літературі повідомлено, що бінарна сполука Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub> зі CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> утворюється при стабілізації домішками третього компонента і, згідно з результами нашого дослідження, при 600°С не існує. Натомість, при температурах, вищих за 1000°С існує бінарний алюмінід з такою стехіометрією, однак відмінною кристалічною структурою (СТ W5Si3). Утворення ж НРТР між бінарними

сполуками Zr<sub>2</sub>Al i Zr<sub>2</sub>Si при 1200°С зумовлено їхньою ізоструктурністю при цій температурі (CT Cu<sub>2</sub>Al), тоді як при 600 і 700°С для бінарного алюмініду Zr<sub>2</sub>Al характерною є модифікація зі CT Co<sub>1,75</sub>Ge. Подібність діаграм стану ситеми Zr–Al–Si при 600 і 700°С проявляється також в існуванні обмежених твердих розчинів заміщення на основі бінарних силіцидів ZrSi<sub>2</sub>, ZrSi, Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> i Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, однак протяжність цих твердих розчинів при різних температурах є різною. Діаграми стану відрізняються також за стехіометрією і кристалічною структурою деяких бінарних і тернарних сполук, що зумовлює відмінність у фазових рівновагах. Так, при 600°С на ізоконцентраті 33,3 ат.% Zr встановлено існування тернарної сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, тоді як при 700°С сполуку з подібною структурою (CT Zr<sub>0,75</sub>AlSi<sub>1,25</sub>) виявлено на ізоконцентраті 25 ат.% Zr. Крім того, лише при 1200°С встановлено існування тернарного алюмосиліциду ZrAl<sub>0,2</sub>Si<sub>0,8</sub> зі CT TII.

Однакова температура ізотермічних перерізів (600°С) діаграм стану потрійних систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} дозволяє провести пряме порівняння систем між собою і виділити певні особливості взаємодії компонентів. Усі системи (рис. 4.1 і 4.2) характеризуються доволі складним характером взаємодії компонентів, що проявляється в утворенні різної кількості тернарних сполук та різній розчинності третього компонента в бінарних сполуках. Загалом, у системах з Ge утворюється більша кількість тернарних сполук у порівнянні з системами з Si, а у системах зі Sb – більше тернарних сполук, порівняно з системами зі Sn. Спільним для усіх систем є існування тернарних сполук на ізоконцентратах 25 ат.% Zr чи Hf при великому вмісті Al. Іншою спільною ознакою усіх досліджених систем є відсутність розчинності третього компонента у бінарних алюмінідах цирконію і гафнію. Однак, для систем Hf-Al-{Si,Ge} характерним є утворення HPTP на ізоконцентратах 66,7 ат.% Нf, що зумовлено, першочергово, ізоструктурністю бінарних сполук Hf<sub>2</sub>Al, Hf<sub>2</sub>Si i Hf<sub>2</sub>Ge (CT CuAl<sub>2</sub>). Слід зазначити, що інших пар ізоструктурних бінарних сполук у досліджених системах немає. У всіх системах з Zr та у двох системах з Hf (Hf-Al-{Si,Ge}) на основі бінарних силіцидів, германідів, станідів чи антимонідів зі СТ Мп<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> утворюються тверді розчини заміщення вздовж ізоконцентрат 62,5 ат.% Zr чи Hf. Спостерігається тенденція до зменшення

протяжності твердих розчинів заміщення на Al у відповідних сполуках при переході від Si до Ge, Sn i Sb. У системі Hf–Al–Sn на основі бінарної сполуки Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>) при 600°C утворюється твердий розчин включення атомів Al, який простягається до складу Hf<sub>5</sub>AlSn<sub>3</sub>, тоді як кристалічна структура бінарного антимоніду Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> належить до іншого структурного типу (Y<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>). У всіх системах, за винятком систем з Si, для тернарних фаз реалізується CT Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>: для індивідуальних тернарних сполук Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> i Zr<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub>, для граничних складів твердих розчинів заміщення Zr<sub>5</sub>Al<sub>x</sub>Sn<sub>4-x</sub> i Zr<sub>5</sub>Al<sub>x</sub>Sb<sub>4-x</sub> (x = 0-1) і для граничного складу вищезгаданого твердого розчину включення Hf<sub>5</sub>Al<sub>x</sub>Sn<sub>3</sub> (x = 0-1).



Рис. 4.1. Ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge} при 600°С.



Рис. 4.2. Ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Zr,Hf}–Al–{Sn,Sb} при 600°С.

Загалом, можна зауважити спорідненість систем з тим самим *d*-елементом (Zr чи Hf), а також попарну спорідненість систем з Zr та Hf i одного *p*-елемента 14 чи 15 групи періодичної системи. Так, у системах з Zr на ізоконцентратах 62,5 ат.% Zr при невеликому вмісті Si, Ge, Sn чи Sb (до 7 ат.%) тернарні сполуки сталого складу зі CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> (тернарна надструктура до CT W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>), що, можливо, утворюються шляхом стабілізації атомами Si, Ge, Sn чи Sb твердих розчинів заміщення на основі Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>, яка існує при температурах вищих за 1000°C, до нижчих температур. У системах з Hf при подібних складах також існують тернарні сполуки точкового складу, однак з відмінною структурою – СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, до якої належить структура бінарного алюмініду Hf<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>, який, згідно з літературними відомостями, утворюється шляхом стабілізації третім компонентом і, згідно з результами нашого дослідження, при 600°С не існує.

Подібність систем Zr–Al–{Si,Ge} проявляється існуванні також В ізоструктурних тернарних сполук ZrAl<sub>0,33</sub>Si<sub>1,67</sub> і ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> на ізоконцентратах 33,3 ат.% Zr. Слід зазначити, що у відповідних системах з Нf тернарні сполуки на ізоконцентратах 33,3 ат.% Нf не утворюються. Особливістю пари систем Zr-Al-Ge i Hf–Al–Ge  $\epsilon$ , зокрема, існування тернарних сполук Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub> і Hf<sub>11</sub>Al<sub>3,50</sub>Ge<sub>6,50</sub> зі структурою, похідною бінарного типу Но11Ge10. Особливістю ж систем з важкими *p*-елементами Sn i Sb  $\epsilon$  iснування на iзоконцентратах 62,5 at.% Zr i Hf тернарних сполук зі структурою типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, що мають змінний склад. Слід зазначити, що області гомогенності тернарних сполук з цирконієм, Zr<sub>5</sub>Al<sub>1.68-</sub> 0.40Sn1.32-2.60 (16 ат.% Al/Sn) і Zr5Al1.55-0.65Sb1.45-2.35 (11,4 ат.% Al/Sb), є більшими за області гомогенності відповідних тернарних сполук з гафнієм – Hf<sub>5</sub>Al<sub>1.33-0.78</sub>Sn<sub>1.67-</sub> 2.22 (6,9 ат.% Al/Sn) і Hf<sub>5</sub>Al<sub>1.52-0.74</sub>Sb<sub>1.48-2.26</sub> (9,8 ат.% Al/Sb). Як наслідок, особливістю пари потрійних систем Zr-Al-Sn і Zr-Al-Sb  $\epsilon$  одночасне існуванання двох ізоструктурних тернарних сполук (CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>) на ізоконцентратах 62,5 ат.% Zr.

Порівнюючи системи  $\{Zr, Hf\}-Al-\{Si, Ge, Sn, Sb\}$  з відомими з літератури спорідненими системами також можна виділити певні подібності. У системах Ti-Al- $\{Si, Ge, Sn, Sb\}$  утворюється порівняно невелика кількість тернарних сполук (від 1 до 3) як постійного, так і змінного складу, причому, у системах з Si і Ge сполуки утворюються в областях систем з малим вмістом Ti, тоді як у системах зi Sn i Sb – в областях, багатих на Ti. Подібно до бінарних алюмінідів цирконію та гафнію, бінарні сполуки системи Ti-Al не розчиняють третій компонент, за винятком алюмініду TiAl<sub>3</sub>, який розчиняє до 15 ат.% Si (при 700 та 1200°C) [85] і до 15 ат.% Ge (при 400, 520 і 1000°C) [91]. У системах Ti-Al- $\{Si,Ge\}$  знайдено тернарні сполуки Ti<sub>0,87</sub>Al<sub>0,63</sub>Si<sub>1,5</sub> і TiAl<sub>0,29</sub>Ge<sub>1,71</sub> зі структурами, подібними до структури ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, описаної у цій дисертаційній роботі. Для систем Ti-Al- $\{Sn,Sb\}$  при 900 і 1100°C, відповідно, повідомлено про існування тернарних

сполук  $Ti_5AlSn_2$  i  $Ti_5Al_{1,3}Sb_{1,7}$  зі CT  $Nb_5SiSn_2$ , який також реалізується для тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-{Sn,Sb}.

Вплив заміни перехідних *d*-металів 4 групи на *d*-метали 5 групи періодичної системи можна проаналізувати на прикладі систем {Nb,Ta}–Al–Si, для яких побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану при 1400°C [118,120]. У системі з Nb встановлено утворення обмежених твердих розчинів заміщення на основі бінарних сполук Nb<sub>3</sub>Al i NbSi<sub>2</sub>, а також існування двох тернарних сполук, NbAl<sub>0,6</sub>Si<sub>1,4</sub> (CT TiSi<sub>2</sub>) i Nb<sub>5</sub>Al<sub>1,5</sub>Si<sub>1,5</sub> (CT W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>). У досліджених нами потрійних системах структурний тип TiSi<sub>2</sub> представлений бінарною сполукою ZrSn<sub>2</sub>, а структурний тип W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (або його тернарний варіант – CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>) реалізується для восьми тернарних сполук, і ізоструктурну тернарну фазу Nb<sub>5</sub>AlSn<sub>2</sub> [94] також було знайдено у системі Nb–Al–Sn.

Вплив на характер взаємодії компонентів при заміні Al на Ga можна проаналізувати на прикладі систем {Ti,Zr}–Ga–Si i Hf–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb}, для яких побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану.

У системі Ті–Gа–Si при 800°С існує одна тернарна сполука зі структурою типу ZrSi<sub>2</sub>, яка є спорідненою до структури типу ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, що реалізується для тернарних сполук систем Zr–Al–{Si,Ge} при 600°С. Крім того, при 800 і 1350°С встановлено утворення протяжного твердого розчину заміщення на основі бінарного силіциду Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> зі CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, подібно до розчинності Al у бінарних сполуках Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, Zr<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> і Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> у досліджених нами системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge} при 600°С. Система Zr–Ga–Si при 800°С відрізняється від системи Zr–Al–Si при 600°С як за протяжностями твердих розчинів на основі бінарних сполук, так і за стехіометрією та кристалічними структурами тернарних сполук. Структура єдиної тернарної сполуки змінного складу ZrGa<sub>0,90-0,66</sub>Si<sub>0,10-0,34</sub> належить до CT TII, який у досліджених нами системах реалізується лише для бінарних алюмінідів ZrAl i HfAl.

Ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних систем Hf–Ga–{Si,Ge,Sn,Sb} побудовано в повних концентраційних інтервалах при 600°С, як і для систем Hf–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, що дозволяє провести їхнє повноцінне порівняння.

У системах Hf-Ga-{Si,Ge} утворюється по одній тернарній сполуці та по два HPTP між ізоструктурними бінарними сполуками зі СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> та СТ CuAl<sub>2</sub> в обох системах. Утворення HPTP  $Hf_2Ga_{1-x}Si_x$  і  $Hf_2Ga_{1-x}Ge_x$  (x = 0-1) робить системи Hf-Ga-{Si,Ge} подібними до систем Hf-Al-{Si,Ge}, у яких також утворюються НРТР з цією структурою між відповідними бінарними сполуками зі СТ CuAl<sub>2</sub>. Подібність систем Hf-Ga-{Sn,Sb} до систем Hf-Al-{Sn,Sb} проявляється у багатих на Hf областях, де існують тернарні сполуки змінного складу зі структурою типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>. Кожна з цих систем характеризується реалізацією CT Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> для відповідних тернарних фаз: у системах зі станумом – Hf<sub>5</sub>AlSn<sub>3</sub> i Hf<sub>5</sub>GaSn<sub>3</sub> – граничні склади твердих розчинів включення на основі бінарного станіду Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub>, а у системах зі стибієм – Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> і Hf<sub>5</sub>GaSb<sub>3</sub> – склади індивідуальних тернарних антимонідів. Відмінність систем з Al від систем з Ga полягає у стехіометрії та кристалічній структурі деяких бінарних і тернарних сполук, а також розчинності третього компонента в окремих бінарних сполуках. Так, у системах з Al на ізоконцентратах 62,5 ат.% Нf існують тернарні сполуки зі CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, а бінарна сполука Hf<sub>5</sub>Al<sub>3</sub> за умовах дослідження не існує, тоді як у системах з Ga при 600°C стабільним є бінарний галід Hf<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub> з цією структурою, а на його основі у системах Hf-Ga-{Si,Ge} утворюються HPTP, а у системах Hf-Ga-{Sn,Sb} – обмежені тверді заміщення. Кристалічні розчини структури тернарних сполук систем  $Hf-Ga-{Si,Ge}$ відрізняються від структур тернарних сполук систем Hf-Al-{Si,Ge}. Відомості про типи структур тернарних сполук систем {Ti,Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} i {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb} узагальнено у табл. 4.1 i 4.2, відповідно.

Таблиця 4.1

## Структурні типи тернарних сполук у системах

## $\{Ti,Zr,Hf\}\text{-}Al\text{-}\{Si,Ge,Sn,Sb\}$

(виділено сполуки, існування яких встановлено нами при 600°С)

Структурний тип (СП, ПГ)		Ti–	Al–		Zr–Al–				Hf–Al–			
	Si	Ge	Sn	Sb	Si	Ge	Sn	Sb	Si	Ge	Sn	Sb
TiAl <sub>3</sub> Ge ( <i>tP</i> 10, <i>P</i> 4/ <i>nmm</i> )		+										
TiAl <sub>3</sub> ( <i>tI</i> 8, <i>I</i> 4/ <i>mmm</i> )					+	+	+	+	+	+	+	+
$ZrSi_2$ (oS12, Cmcm)	+									+		
ScCo <sub>0,25</sub> Si <sub>1,75</sub> ( <i>oS</i> 12, <i>Cmcm</i> )												
ZrAl <sub>0,23</sub> Ge <sub>1,77</sub> ( <i>tI</i> 32, <i>I</i> 4 <sub>1</sub> / <i>amd</i> )		+			+	+						
TiAl <sub>0,29</sub> Ge <sub>1,71</sub> ( <i>tI</i> 24, <i>I</i> 4 <sub>1</sub> / <i>amd</i> )	+	+										
Zr <sub>0,75</sub> AlSi <sub>1,25</sub> ( <i>tI</i> 24, <i>I</i> 4 <sub>1</sub> / <i>amd</i> )	+				+							
$Zr_2CuSb_3$ ( <i>tP</i> 6, <i>P</i> -4 <i>m</i> 2)								+				+
TlI (oS8, Cmcm)					+				+			
Ho <sub>11</sub> Ge <sub>10</sub> ( <i>tI</i> 84, <i>I</i> 4/ <i>mmm</i> )						+				+		
Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub> ( <i>hP</i> 18, <i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i> )						+				+		+
$Mn_5Si_3$ ( <i>hP</i> 16, <i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i> )									+	+	+	+
Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub> ( $tI32$ , $I4/mcm$ )			+	+	+	+	++	++			+	+

### Таблиця 4.2

Структурні типи тернарних сполук у системах {Ti,Zr,Hf}-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb}

Структурний тип (СП, ПГ)	Ti–Ga–			Zr–Ga–				Hf–Ga–				
	Si	Ge	Sn	Sb	Si	Ge	Sn	Sb	Si	Ge	Sn	Sb
$ZrSi_2$ (oS12, Cmcm)	+	+								+		
$Zr_2CuSb_3$ ( <i>tP</i> 6, <i>P</i> -4 <i>m</i> 2)												+
TlI (oS8, Cmcm)					+	+			+			
$FeSi (cP8, P2_13)$												+
Hf <sub>5</sub> CuSn <sub>3</sub> ( <i>hP</i> 18, <i>P</i> 6 <sub>3</sub> / <i>mcm</i> )												+
Nb <sub>5</sub> SiSn <sub>2</sub> ( $tI32$ , $I4/mcm$ )				+			+	+			+	+

# 4.2. Кристалохімічні закономірності тернарних фаз систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}

У потрійних системах {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С встановлено існування 29 тернарних сполук. Їхні склади охоплюють широкий концентраційний інтервал – 25-62,5 ат.% Zr чи Hf, а їхні кристалічні структури належать до семи структурних типів. Слід зазначити, що для тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} характерною є реалізація бінарних структурних типів, чи їхніх тернарних впорядкованих похідних (надструктур). Найменшою кількістю тернарних сполук (2) характеризується система Hf-Al-Si, а найбільшою (по 5) системи Zr-Al-Ge i Hf-Al-Sb. При переході від систем з Si до систем з Ge спостерігається ускладнення характеру взаємодії компонентів, що проявляється у збільшенні кількості тернарних сполук від 5 (сумарно) у системах {Zr,Hf}-Al-Si до 9 у системах {Zr,Hf}-Al-Ge. При переході до систем зі Sn кількість тернарних сполук зменшується до 6, а заміна Sn на Sb приводить до збільшення кількості тернарних інтерметалідів до 9. Збільшення вмісту Zr чи Hf у сполуках (зменшення вмісту *p*-елементів) змінює координаційне оточення атомів *p*-елементів: від кубооктаедричного (25 ат.% Zr(Hf): ZrAl<sub>2.55</sub>Si<sub>0.45</sub>, HfAl<sub>2.55</sub>Si<sub>0.45</sub>, ZrAl<sub>2.52</sub>Ge<sub>0.48</sub>, ZrAl<sub>2,68</sub>Sn<sub>0,32</sub>, HfAl<sub>2,64</sub>Sn<sub>0,36</sub>, ZrAl<sub>2,65</sub>Sb<sub>0,35</sub> i HfAl<sub>2,67</sub>Sb<sub>0,33</sub>) до  $HfAl_{2.40}Ge_{0.60}$ , тригонально-призматичного і тетраедричного (33,3 ат.% Zr(Hf): ZrAl<sub>0,33</sub>Si<sub>1,67</sub>, ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub>, Zr<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> i Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>), тригонально-призматичного i тетрагональноантипризматичного (52,4 ат.% Zr(Hf):  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{63,66}$  i  $Hf_{11}Al_{3,50}Ge_{6,50}$ ), тригонально-призматичного i октаедричного (55,5 ат.% Zr(Hf): Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub>), ікосаедричного (62,5 ат.% Hf: i Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.54</sub>Si<sub>0.46</sub>, Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.70</sub>Ge<sub>0.30</sub>, i  $Hf_5Al_{2,49}Sb_{0,51}$ ) i тетрагонально-антипризматичного  $Hf_5Al_{2.70}Sn_{0.30}$ та ікосаедричного (62,5 ат.% Zr(Hf): Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,44</sub>Si<sub>0,56</sub>, Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub>, Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,71</sub>Sn<sub>0,29</sub>,  $Zr_5Al_{1,68-0,40}Sn_{1,32-2,60}$ ,  $Hf_5Al_{1,33-0,78}Sn_{1,67-2,22}$ ,  $Zr_5Al_{2,55}Sb_{0,45}$ ,  $Zr_5Al_{1,55-0,65}Sb_{1,45-2,35}$  i Hf<sub>5</sub>Al<sub>1.52-0.74</sub>Sb<sub>1.48-2.26</sub>). Кристалічні структури тернарних сполук систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} належать виключно до тетрагональної чи гексагональної сингонії, і для більшості з них простежується тенденція до впорядкування атомів.

### 4.2.1. Найщільніші упаковки атомів

У кожній з досліджених систем  $\{Zr, Hf\}$ -Al- $\{Si, Ge, Sn, Sb\}$  на ізоконцентратах 25 ат.% Zr чи Hf при 600°C існують тернарні сполуки зі структурою типу TiAl<sub>3</sub> (ZrAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub>, HfAl<sub>2,55</sub>Si<sub>0,45</sub>, ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub>, HfAl<sub>2,40</sub>Ge<sub>0,60</sub>) чи її тернарного варіанту – CT UCuAl<sub>2</sub> (ZrAl<sub>2.68</sub>Sn<sub>0.32</sub>, HfAl<sub>2.64</sub>Sn<sub>0.36</sub>, ZrAl<sub>2.65</sub>Sb<sub>0.35</sub>, HfAl<sub>2.67</sub>Sb<sub>0.33</sub>). Ці структурні типи, як і структура бінарних сполук ZrAl<sub>3</sub> і HfAl<sub>3</sub> (CT ZrAl<sub>3</sub>) належать до кубічних найщільніших упаковок атомів, які є похідними структурного типу Cu (CП cF4, ПГ Fm-3m) і побудовані з щільноупакованих шарів атомів виключно у кубічній Відповідно, координаційними многогранниками ycix укладці. атомів € кубооктаедри різного складу і з певним ступенем деформації. На рис. 4.3 зображено укладку кубооктаедрів навколо атомів Al у структурі Al і навколо атомів Zr у структурах сполук ZrAl<sub>3</sub> i ZrAl<sub>2.52</sub>Ge<sub>0.48</sub>.



Al (CT Cu, *cF*4, *Fm*-3*m*)

**ZrAl**<sub>3</sub> (CT **ZrAl**<sub>3</sub>, *t*/16, *I*4/*mmm*)

ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub> (CT TiAl<sub>3</sub>, *tI*8, *I*4/*mmm*)

Рис. 4.3. Укладка кубооктаедрів у структурах Al, ZrAl<sub>3</sub> i ZrAl<sub>2,52</sub>Ge<sub>0,48</sub>.

Слід зазначити, що три зазначені фази – тернарні сполуки зі CT TiAl<sub>3</sub> (UCuAl<sub>2</sub>), бінарні сполуки зі CT ZrAl<sub>3</sub> і проста речовина Al – у всіх досліджених нами потрійних системах перебувають у рівновазі при 600°С.

Для структур Al (CT Cu), бінарних алюмінідів ZrAl<sub>3</sub> і HfAl<sub>3</sub> (CT ZrAl<sub>3</sub>) та тернарних сполук зі структурами типів TiAl<sub>3</sub> і UCuAl<sub>2</sub> у системах {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} розраховано компактність структури (співвідношення V<sub>атомів</sub>/V<sub>комірки</sub>) і рентгенівську густину (табл. 4.3). Для АІ значення компактності структури 73,7 % (ідеальне значення 74 %) відповідає значенню компактності для кубічної щільноупакованої структури, сформованої сферичними атомами одного розміру. Компактність структур бінарних і тернарних сполук є більшою, ніж компактність структури Al, що можна пояснити присутністю у структурах атомів різних розмірів. Найвищим значенням цього параметра (79,5 %) характеризується тернарний алюмоантимонід цирконію ZrAl<sub>2.65</sub>Sb<sub>0.35</sub>. Значення розрахованої густини  $D_{\rm X}$ закономірно збільшується при переході від простої речовини Al  $(D_X = 2,698 \ \Gamma \cdot \text{см}^{-3})$  до фаз з Zr  $(D_X = 4,118-4,961 \ \Gamma \cdot \text{см}^{-3})$  і до фаз з Hf  $(D_X = 6,332-$ 6,988 г.см-3). Нелінійність зміни густини і компактності структур при заміні *p*-елементів 14 і 15 груп періодичної системи пояснюється, в певній мірі, різною стехіометрією відповідних тернарних фаз. Враховуючи те, що бінарні алюмініди ZrAl<sub>3</sub> i HfAl<sub>3</sub>, а також тернарні сполуки зі СТ TiAl<sub>3</sub> (UCuAl<sub>2</sub>) перебувають у рівновазі з Al, їх можна рекомендувати для подальшого дослідження властивостей, зокрема механічних, для подальшого практичного застосування. Такі сполуки можна використовувати як легуючі домішки під час створення нових функціональних матеріалів на основі Al, зокрема конструкційних, для підвищення їхніх функціональних характеристик (міцності, твердості тощо), зокрема шляхом створення внутрішнього хімічного тиску в металічній матриці Al – так зване дисперсійне твердіння.

Співмірність міжатомних віддалей у структурах бінарних алюмінідів ZrAl<sub>3</sub> і HfAl<sub>3</sub> (CT ZrAl<sub>3</sub>) та тернарних сполук зі структурами типів TiAl<sub>3</sub> і UCuAl<sub>2</sub>, що існують у системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb}, з сумами атомних і металічних радіусів відповідних елементів вказує на металічний тип зв'язку. Відповідно, можна зробити висновок про те, що важливим чинником формування структур з кубічними найщільнішими упаковками атомів є розмірний фактор.

141

Рентгенівська густина і компактність структур Al та сполук

Речовина/сполука	Вміст Аl, ат.%	СТ	Густина <i>D</i> <sub>X</sub> , г·см <sup>-3</sup>	Компак- тність, %
Al	100	Cu	2,698	73,7
ZrAl <sub>3</sub>	75,0	ZrAl <sub>3</sub>	4,118	77,7
ZrAl <sub>2,55</sub> Si <sub>0,45</sub>	63,8	TiAl <sub>3</sub>	4,172	76,6
ZrAl <sub>2,52</sub> Ge <sub>0,48</sub>	63,0	TiAl <sub>3</sub>	4,628	76,3
$ZrAl_{2,68}Sn_{0,32}$	67,0	UCuAl <sub>2</sub>	4,426	75,7
$ZrAl_{2,65}Sb_{0,35}$	66,3	UCuAl <sub>2</sub>	4,961	79,5
HfAl <sub>3</sub>	75,0	ZrAl <sub>3</sub>	6,332	77,5
$HfAl_{2,55}Si_{0,45}$	63,8	TiAl <sub>3</sub>	6,372	75,7
HfAl <sub>2,40</sub> Ge <sub>0,60</sub>	60,0	TiAl <sub>3</sub>	6,988	75,9
HfAl <sub>2,64</sub> Sn <sub>0,36</sub>	66,0	UCuAl <sub>2</sub>	6,947	76,6
HfAl <sub>2,67</sub> Sb <sub>0,33</sub>	66,8	UCuAl <sub>2</sub>	6,978	76,7

на ізоконцентратах 25 ат.% Zr та Hf систем {Zr,Hf}-Al-{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С

### 4.2.2. Представники серій лінійних неоднорідних структур

У системах Zr–Al–{Si,Ge} на ізоконцентратах 33,3 ат.% Zr існують тернарні сполуки ZrAl<sub>0,33</sub>Si<sub>1,67</sub> і ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>. Параметри їхньої кристалічної структури прецизійно визначено на прикладі алюмогерманіду у просторовій групі *I*4<sub>1</sub>/*amd*. Встановлено, що структура сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> є близькоспорідненою зі структурними типами TiAl<sub>0,29</sub>Ge<sub>1,71</sub> і Zr<sub>0,75</sub>AlSi<sub>1,25</sub>, а її особливістю є позиційне невпорядкування атомів Ge, яке було змодельовано розщепленням однієї ПСТ 8*e* (Ge1) у CT TiAl<sub>0,29</sub>Ge<sub>1,71</sub> на дві ПСТ 8*e* (Ge1A і Ge1B) у структурі ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>. Атоми положень Ge1A і Ge1B розташовані в тригональних призмах Zr<sub>6</sub>, а значення відповідних віддалей між ними ( $\delta_{Ge1A-Ge1A} = 2,528(2), \delta_{Ge1A-Ge1B} = 2,703(2), \delta_{Ge1B-Ge1B} = 2,889(3)$ Å) вказують на сильну взаємодію між атомами Ge – присутність ковалентної складової зв'язку (рис. 4.4*a*,*б*). Слід зазначити, що контакти Ge-Ge є єдиними гомоатомними контактами у структурі ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>. Ці атоми утворюють нескінченні зигзагоподібні ланцюги вздовж кристалографічних напрямів [100] і [010], а найкоротша можлива віддаль між атомами Ge ( $\delta_{Ge1A-Ge1A}$ ) є лише дещо більшою за віддаль між атомами Ge у структурі простої речовини ( $\delta_{Ge-Ge} = 2,450$  Å [13]). Атоми положення Ge2 і атоми статистичної суміші M (0,461(9)A1 + 0,539(9)Ge) формують плоскі сітки з квадратів у площині (001) з міжатомними віддалями  $\delta_{Ge2-M} = 2,688(1)$  Å, співмірними з віддалями  $\delta_{Ge1A-Ge1B}$  (рис. 4.4*e*).



Рис. 4.4. – Проекція структури ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> на площину (010) з виділеними зигзагоподібними ланцюгами з атомів Ge і сіток з квадратів, утворених атомами Al i Ge (*a*), збільшена проекція зигзагоподібного ланцюга з атомів Ge на площину (010) (*б*) і проекція сітки з квадратів, утворених атомами Al i Ge на площину (001) (*в*).

Структурні типи ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>, TiAl<sub>0,29</sub>Ge<sub>1,71</sub> і Zr<sub>0,75</sub>AlSi<sub>1,25</sub> належать до структур зрощення, а саме серії лінійних неоднорідних структур, побудованих зрощенням фрагментів структурних типів AlB<sub>2</sub> та CaF<sub>2</sub> вздовж одного напряму [135]. Фрагменти CT AlB<sub>2</sub> представлені шарами тригональних призм Zr<sub>6</sub>, центрованих атомами Ge, а фрагменти CT CaF<sub>2</sub> – шарами пустих "пів-октаедрів", утворених атомами Ge і атомами статистичної суміші *M*. У структурі ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> шари тригональних призм (фрагмент CT AlB<sub>2</sub>) чергуються з двома шарами пустих

"пів-октаедрів" (фрагмент СТ CaF<sub>2</sub>) вздовж кристалографічного напряму [001] (рис. 4.5). Кожен шар тригональних призм розвернутий на 90° навколо [001] відносно поперднього та наступного, тоді як шари "пів-октаедрів" у здвоєних шарах фрагментів СТ CaF<sub>2</sub> зміщені один відносно другого у площині (001), що приводить до появи площини ковзного відбиття.



Рис. 4.5. Зрощення фрагментів структуних типів AlB<sub>2</sub> і CaF<sub>2</sub> у структурі ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> вздовж кристалографічного напряму [001].

Кристалічні структури тернарних антимонідів Zr<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> і Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> належать до СТ Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub> і характеризуються впорядкованим розташуванням атомів у чотирьох ПСТ прострової групи P-4m2. Структурний тип Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub> є тернарним впорядкованим варіантом CT UAs<sub>2</sub>. Правильна система точок 2a у структурі типу UAs<sub>2</sub> (ПГ P4/nmm) розділяється на дві ПСТ 1b і 1a у СТ Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub> (ПГ P-4m2), які у структурах сполук Zr<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> і Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> зайняті атомами Al та Sb, відповідно. При відбувається симетрії тетрагональної від цьому пониження структури центросиметричної Перехід група-підгрупа до нецентросиметричної. для відповідних просторових груп має вигляд [133]:

P4/nmm (**a**, **b**, **c**)  $\xrightarrow{I}$  P-4m2 (**a**, **b**, **c**).



Рис. 4.6. Проекція структури сполуки  $Hf_2AlSb_3$  вздовж [010], а також сіток з атомів Hf (**A** при z = 0,2636), Sb (**Б** при z = 0,3843) та Al i Sb (**В** при z = 0) вздовж [001].

Кристалохімічною особливістю структур сполук Zr<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> і Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> є відсутність у них гомоатомних контактів у найближчому координаційному оточенні атомів. Атоми одного сорту утворюють нескінченні гомоатомні ряди -Zr-Zr- (-Hf-Hf-), -Al-Al- і -Sb-Sb- вздовж кристалографічних напрямів [100] та
[010] з міжатомними віддалями 3,9826(2) і 3,9021(2) Å, що відповідають величинам параметра *a* елементарних комірок для Zr<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> і Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>, відповідно. На прикладі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> показано (рис. 4.6), що її структуру можна також розглядати як укладку сіток з атомів одного сорту Hf (**A**) та Sb (**B**), а також сіток з атомів Al та Sb (**B**) перпендикулярно до кристалографічного напряму [001]. Дві постіловні сітки з атомів Sb (**B**) ( $z \sim 0,38 \ z \sim 0,62$ ) оточені сітками з атомів Hf (**A**) при  $z \sim 0,26$  і  $z \sim 0,74$ . Ці чотири сітки знаходяться між сітками з атомів Al i Sb (**B**), розташованих при z = 0 і z = 1.

Структурний тип Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub> належить до серії лінійних неоднорідних структур, побудованих зрощенням фрагментів структурних типів BaAl<sub>4</sub> та W [135]. Фрагменти CT BaAl<sub>4</sub> представлені шарами тетрагональних антипризм Al<sub>2</sub>Sb<sub>6</sub>, центрованих атомами Hf, а фрагменти CT W – шарами пустих "пів-октаедрів", утворених атомами Sb. У структурі Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> (CT Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>) здвоєні шари тетрагональних антипризм (фрагмент CT BaAl<sub>4</sub>) чергуються з шарами пустих "пів-октаедрів" (фрагмент CT W) вздовж кристалографічного напряму [001] (рис. 4.7).



Рис. 4.7. Зрощення фрагментів структурних типів BaAl<sub>4</sub> і W у структурі сполуки Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> вздовж кристалографічного напряму [001].

## 4.2.3. Впорядкування атомів у структурах сполук Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub> і

## Hf11Al3,50Ge6,50

Кристалічна структура тернарних сполук  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  і  $Hf_{11}Al_{3,50}Ge_{6,50}$  є частково впорядкованою похідною структурного типу  $Ho_{11}Ge_{10}$  (СП t/84, ПГ I4/mmn, a = 10,79, c = 16,23 Å) [146]. На сьогодні відомо кілька впорядкованих надструктур до типу  $Ho_{11}Ge_{10}$ , що характеризуються аналогічною просторовою групою і співмірними елементарними комірками (табл. 4.4): Sc<sub>11</sub>Al<sub>2</sub>Ge<sub>8</sub> (a = 10,419, c = 14,974 Å) [152], Sm<sub>11</sub>Ga<sub>2,3</sub>Sn<sub>7,7</sub> (a = 11,5876, c = 17,3089 Å) [153], Sm<sub>11</sub>In<sub>6</sub>Ge<sub>4</sub> (a = 11,540, c = 16,325 Å) [154] і Sc<sub>7</sub>Cr<sub>4,8</sub>Si<sub>9,2</sub> (a = 9,757, c = 13,884 Å) [155].

## Таблиця 4.4

# Розподіл атомів у правильних системах точок просторової групи I4/mmm у структурах типів Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub>, Sc<sub>11</sub>Al<sub>2</sub>Ge<sub>8</sub>, Sm<sub>11</sub>Ga<sub>2,3</sub>Sn<sub>7,7</sub>, Sm<sub>11</sub>In<sub>6</sub>Ge<sub>4</sub>,

ПСТ	Структурний тип					
	Ho <sub>11</sub> Ge <sub>10</sub>	$Sc_{11}Al_2Ge_8$	Sm11Ga2,3Sn7,7	Sm11In6Ge4	Sc7Cr4,8Si9,2	Zr <sub>11</sub> Al <sub>3,34</sub> Ge <sub>6,66</sub>
$ \begin{array}{c} 16n \\ (0 \ y \ z) \end{array} $	Ho y = 0,2518 z = 0,3103	Sc y = 0,2507 z = 0,3102	<b>Sm</b> y = 0,2512 z = 0,3109	<b>Sm</b> y = 0,2516 z = 0,3110	<b>Sc</b> y = 0,2536 z = 0,3117	<b>Zr</b> y = 0,2512 z = 0,3131
$ \begin{array}{c} 16n \\ (0 \ y \ z) \end{array} $	<b>Ho</b> y = 0,3241 z = 0,1025	Sc y = 0,3356 z = 0,1024	Sm y = 0,3244 z = 0,0993	<b>Sm</b> y = 0,3418 z = 0,1003	<b>Cr</b> y = 0,3231 z = 0,1005	<b>Zr</b> y = 0,3374 z = 0,1008
$ \begin{array}{c} 16m \\ (x  x  z) \end{array} $	Ge x = 0,2097 z = 0,1814	<b>Ge</b> x = 0,2047 z = 0,1711	<b>Sn</b> x = 0,2076 z = 0,1795	In x = 0,2071 z = 0,1708	Si x = 0,2062 z = 0,1672	<b>Al/Ge</b> x = 0,2098 z = 0,1786
$ \begin{array}{c} 8j \\ (x \frac{1}{2} 0) \end{array} $	<b>Ge</b> $x = 0,1370$	<b>Ge</b> $x = 0,1470$	Ga/Sn $x = 0,1380$	<b>Ge</b> $x = 0,1519$	$\mathbf{Si}$ x = 0,1214	Al/Ge $x = 0,144$
$ \begin{array}{c} 8h\\ (xx0) \end{array} $	<b>Ge</b> $x = 0,1197$	$\mathbf{Al} \\ x = 0,1270$	Ga/Sn $x = 0,1202$	<b>In</b> $x = 0,1272$	<b>Si/Cr</b> $x = 0,1221$	$\mathbf{Al} \\ x = 0,147$
$ \begin{array}{c} 8h\\ (xx0) \end{array} $	<b>Ho</b> $x = 0,3214$	$\mathbf{Sc} \\ x = 0,3272$	$\mathbf{Sm}$ x = 0,3174	<b>Sm</b> $x = 0,3305$	<b>Sc</b> $x = 0,3212$	$\mathbf{Zr}$ x = 0,3181
$ \begin{array}{c} 4e \\ (0 \ 0 \ z) \end{array} $	<b>Ho</b> z = 0,1606	$\mathbf{Sc}$ z = 0,1688	$\mathbf{Sm}$ z = 0,1598	<b>Sm</b> $z = 0,1643$	<b>Sc</b> $z = 0,1625$	$\mathbf{Zr}$ z = 0,1701
$ \begin{array}{c} \overline{4e} \\ (0 \ 0 \ z) \end{array} $	Ge z = 0,3871	<b>Ge</b> z = 0,3815	Ga z = 0,3940	$\overline{\mathbf{Ge}}$ $z = 0,3797$	Siz = 0,3920	Al/Ge z = 0,3873
$ \begin{array}{c c} 4d \\ (0 \frac{1}{2} \frac{1}{4}) \end{array} $	Ge	Ge	Ga	Ge	Si	Ge

Sc<sub>7</sub>Cr<sub>4,8</sub>Si<sub>9,2</sub> i Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub>

Розташування атомів у структурі сполуки  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  є оригінальним. Найбільш подібним до структури  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  є СТ  $Sc_{11}Al_2Ge_8$ , однак для нього положення 16*m*, 8*j* і 4*e* зайняті виключно атомами Ge, тоді як у структурі  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  у цих положеннях спостерігається часткове заміщення атомів Ge на атоми Al. Не виключена можливість реалізації нових впорядкованих похідних до бінарного структурного типу Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub>.

Кристалохімічною особливістю структурних типів Sc<sub>11</sub>Al<sub>2</sub>Ge<sub>8</sub>, Sm<sub>11</sub>Ga<sub>2,3</sub>Sn<sub>7,7</sub>, Sm<sub>11</sub>In<sub>6</sub>Ge<sub>4</sub> є те, що атоми *p*-елементів 13 групи (Al, Ga, In) займають положення у ПСТ 8*h*, яке формує ізольовані квадрати навколо початку системи координат тетрагональної об'ємноцентрованої елементарної комірки:  $\delta_{Al-Al} = 2,647$  Å у Sc<sub>11</sub>Al<sub>2</sub>Ge<sub>8</sub>,  $\delta_{M2-M2} = 2,786$  Å у Sm<sub>11</sub>Ga<sub>2,3</sub>Sn<sub>7,7</sub>,  $\delta_{In-In} = 2,936$  Å у Sm<sub>11</sub>In<sub>6</sub>Ge<sub>4</sub>, а атоми, що займають положення у ПСТ 16*m* утворюють пари:  $\delta_{Ge-Ge} =$ 2,714 Å у Sc<sub>11</sub>Al<sub>2</sub>Ge<sub>8</sub>,  $\delta_{Sn1-Sn1} = 2,920$  Å у Sm<sub>11</sub>Ga<sub>2,3</sub>Sn<sub>7,7</sub>,  $\delta_{In-In} = 2,941$  Å у Sm<sub>11</sub>In<sub>6</sub>Ge<sub>4</sub>. У структурі тернарної сполуки Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub> ПСТ 8*h* зайняте атомами Al, які формують ізольовані квадрати ( $\delta_{Al-Al} = 3,05(4)$  Å), ПСТ 16*m* зайняте статистичною сумішшю атомів Al і Ge (*M*1 = 0,19(2)Al + 0,81(2)Ge), які утворюють пари ( $\delta_{M2-M2} =$ 2,43(4) Å).



Рис. 4.8. Шари з тригональних призм навколо атомів положення M2 (8*j*) у структурі сполуки Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub> (*a*) та один шар призм при z = 1/2 (*б*).



Рис. 4.9. Ізольовані групи поліедрів з чотирьох тетрагональних антипризм навколо атомів Al (*a*), ізольовані пари тетрагональних антипризм навколо положення *M*3 (*б*) та ізольовані тетрагональні антипризми навколо атомів Ge (*в*), каркас з попарно з'єднаних тетрагональних антипризм навколо положення *M*1 (*г*) у структурі сполуки Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub>.

У структурі сполуки  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  атоми *p*-елементів характеризуються тригонально-призматичною та тетрагонально-антипризматичною координацією атомів. Тригональні призми з атомів Zr навколо положення *M*2 зрощені попарно через прямокутні грані (осі призм паралельні), і ці пари призм, з'єднуючись через вершини, утворюють шари при z = 0 і 1/2 (рис. 4.8). Чотири тетрагональні антипризми складу  $Zr_6Al_2$  навколо атомів Al (ПСТ 8*h*) утворюють ізольовані

групи (рис. 4.9*a*). Розташування тетрагональних антипризм з атомів Zr навколо атомів Ge і статистичних сумішей атомів Al і Ge зображено на рис. 4.9*6-г*. Антипризми навколо положення *M*3 (ПСТ 4*e*) зрощені попарно квадратними гранями, утворюючи ізольовані сильно деформовані кубооктаедри (рис. 4.9*б*). Навколо атомів Ge (ПСТ 4*d*) формуються деформовані ізольовані тетрагональні антипризми (рис. 4.9*в*). Навколо положення статистичної суміші атомів *M*1 (ПСТ 16*m*) антипризми зрощені попарно через квадратні грані. Зрощені антипризми з'єднуюються вершинами, утворюючи каркас (рис. 4.9*г*).

## 4.2.4. Тернарні фази Новотного

Фази Новотного – представники структурного типу Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (СП *hP*16, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*) і його похідних – реалізуються в усіх потрійних системах {Zr,Hf}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С. Кристалічні структури бінарних сполук  $T_5M_3$  (T = Zr, Hf; M = Si, Ge, Sn, Sb), за винятком антимоніду Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> належать до СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. До цього ж типу належать структури чотирьох тернарних сполук, що існують у системах Hf–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} на ізоконцентратах 62,5 ат.% Hf при невеликому вмісті Si, Ge, Sn i Sb. Крім цього, у досліджених потрійних системах реалізуються структурні типи Ti<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub> i Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> (СП *hP*18, ПГ *P*6<sub>3</sub>/*mcm*), які є похідними СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Тип Ti<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub> характерний для бінарних сполук Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> i Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub>, а СТ Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> – для тернарних сполук Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>, Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> i Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub>. Більше того, встановлено утворення твердих розчинів заміщення на основі Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> i Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub> (CT Ti<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub>), а також твердого розчину включення на основі Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> (СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>) протяжністю до 11,1 ат.% Al. Кристалічні структури граничних складів цих твердих розчинів, Zr<sub>5</sub>AlSn<sub>3</sub>, Zr<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub> i Hf<sub>5</sub>AlSn<sub>3</sub>, також належать до СТ Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>.

Структурний тип Ti<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub> є бінарною похідною включення до CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Він формується шляхом включення додаткових однойменних атомів *p*-елемента в октаедричні пустоти CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (ПСТ 2*b* просторової групи *P*6<sub>3</sub>/*mcm*). Структурний тип Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> є тернарним впорядкованим варіантом CT Ti<sub>5</sub>Ga<sub>4</sub>, і, відповідно, тернарною надструктурою включення до CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Тернарні фази зі CT Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> у потрійних системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°C формуються у три способи: як індивідуальні тернарні сполуки постійного складу у системах  $\{Zr,Hf\}$ –Al–Ge і Hf–Al–Sb, заміщенням атомів Sn і Sb у ПСТ 2*b* на атоми Al в межах твердих розчинів заміщення на основі бінарних сполук Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> і Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub> у системах Zr–Al–{Sn,Sb}, і включенням атомів Al в октаедричні пустоти (ПСТ 2*b*) структури бінарного антимоніду Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> зі структурою типу Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> в межах відповідного твердого розчину включення у системі Hf–Al–Sn.

Кристалохімічно, структурні типи Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> і Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub> є близькоспорідненими і відрізняються лише додатковою ПСТ 2b у початку системи координат гексагональної елементарної комірки (ПГ Р63/тст). Атоми характризуються подібним координаційним оточенням, однак деякі поліедри зазнають змін при переході від СТ Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> до СТ Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>. Так, у структурі тернарної сполуки  $Hf_5Al_{2,49}Sb_{0,51}$  (CT Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>) координаційним многогранником для атомів в положенні Hfl  $\epsilon$  15-вершинник Hfl $M_5$ Hf<sub>10</sub> (деформована пентагональна призма складу Hf<sub>10</sub> з п'ятьма додатковими атомами статистичної суміші М навпроти двох базових і трьох бокових граней), тоді як у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> поліедром навколо тотожного атома Zr1 є 11-вершинник Zr1Al<sub>2</sub>Ge<sub>5</sub>Zr<sub>4</sub>, який можна описати як деформовану пентагональну дипіраміду складу Ge<sub>5</sub>Al<sub>2</sub> з чотирма додатковими атомами Zr, або як тригональну призму складу Zr<sub>4</sub>Al<sub>2</sub> з усіма гранями, центрованими атомами Ge (рис. 4.10а,б). Також змінюється координаційний многогранник атомів *p*-елементів у ПСТ 6*g*: від дефектного ікосаедра складу  $M_2$ Hf<sub>9</sub> для атомів статистичної суміші M у структурі сполуки  $Hf_5Al_{2,49}Sb_{0,51}$  до 13-вершинника Франка-Каспера, або тришапкової тригональної призми Zr<sub>9</sub> з сотирма додатковими атомами GeAl<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>Zr<sub>9</sub> для атомів Ge у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (рис. 4.10*в*,*г*). Координаційні числа та многогранники для атомів Hf2 і Zr2 в обох структурах є однаковими.

Структуру сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> можна також описати як укладку двох типів моноатомних сіток: **A** при z = 0 і z = 1/2 і **Б** (**Б**<sup>°</sup>) при z = 1/4 і z = 3/4, які чергуються вздовж кристалографічного напряму [001] з послідовністю **AБAБ**<sup>°</sup> (рис. 4.11). Слід зазначити, що сітки **Б** та **Б**<sup>°</sup> складу Zr<sub>3</sub>Ge<sub>3</sub> є ідентичними, однак сітка **Б**<sup>°</sup> повернута на 60° (гвинтова вісь 6<sub>3</sub>) у площині (001) відносно сітки **Б**. Атоми Zr у сітці **A**  (складу Zr<sub>2</sub>Al) утворюють правильні шестикутники, центри яких зайняті атомами Al (символ сітки: 3<sup>6</sup>). Сітка Б побудована з деформованих шестикутників з атомів Zr і Ge (символ сітки: 6<sup>3</sup>). Атоми сіток Б та Б` утворюють октаедри навколо атомів сітки А: деформовані октаедри ZrGe<sub>6</sub>, з'єднуючись ребрами, утворюють канали [001]. розміщені октаедри AlZr<sub>6</sub> 4.12). вздовж в яких (рис. Вздовж кристалографічного напряму [001] октаедри ZrGe<sub>6</sub>, як і октаедри AlZr<sub>6</sub>, з'єднані між собою спільними гранями та утворюють тривимірний каркас та одновимірні колони, відповідно. Слід зазначити, що у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> атоми d-елемента (Zr) центрують октаедри, утворені атомами p-елемента 14 групи (Ge), а атоми *p*-елемента 13 групи (Al) центрують октаедри, утворені атомами *d*-елемента (Zr).



Рис. 4.10. Координаційний многогранники атомів Hf1 і M у структурі сполуки Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,49</sub>Sb<sub>0,51</sub> (*a*,*в*) та Zr1 і Ge у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (*б*,*г*).

Кристалічну структуру сполуки  $Hf_5Al_{2,49}Sb_{0,51}$  (СТ  $Mn_5Si_3$ ), як і ізоструктурних до неї сполук, також можна описати укладкою моноатомних сіток, подібних до сіток атомів у структурі сполуки  $Zr_5AlGe_3$  (СТ  $Hf_5CuSn_3$ ). Відмінність

полягає у складі сіток **A** (у структурі Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,49</sub>Sb<sub>0,51</sub> сітки **A** побудовані з незаповнених гексагонів), і, відповідно, октаедри з атомів *d*-елементів навколо вузлів елементарної комірки є незаповненими.



Рис. 4.11. Проекція структури сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> вздовж кристалографічного напряму [100] (*a*) і моноатомних шарів **A** (б) та **Б** (в) вздовж кристалографічного напряму [001].



Рис. 4.12. Проекція структури сполуки Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> вздовж кристалографічного напряму [001] (*a*) і колона октаедрів <u>Al</u>Zr<sub>6</sub> вздовж [001] (*б*).

## 4.3.5. Тетрагонально-антипризматична координація атомів Al/M у структурах тернарних сполук *T*<sub>5</sub>(Al,*M*)<sub>3</sub>

У потрійних системах Zr–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С на ізоконцентратах 62,5 ат.% Zr при невеликому вмісті Si, Ge, Sn i Sb існують тернарні сполуки постійного складу з загальною стехіометрією Zr<sub>5</sub>(Al<sub>1-x</sub> $M_x$ )<sub>3</sub> (M - p-елементи 14 i 15 групи). Їхня кристалічна структура належить до CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> (CП *t1*32, ПГ *I4/mcm*) – тернарного впорядкованого варіанту CT W<sub>5</sub>Si (CП *t1*32, ПГ *I4/mcm*). Встановлено, що у структурах сполук Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub>, Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,71</sub>Sn<sub>0,29</sub> i Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,55</sub>Sb<sub>0,45</sub> атоми *p*-елементів частково впорядковано займають дві ПСТ (8*h* i 4*a*): атоми Al – повністю займають ПСТ 4*a*, а статистичні суміші атомів M – ПСТ 8*h*. Якщо припустити, що згадані тернарні фази, які при 600°С є індивідуальними тернарними сполуками, є частинами твердих розчинів заміщення на основі високотемпературного бінарного алюмініду зі СТ W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (існує в інтервалі 1000-1395°С), стабілізованими при 600°С, тоді можна зробити висновок, що атоми *p*-елементів 14 і 15 груп періодичної системи елементів (Ge, Sn i Sb) заміщуують атоми Al лише в положенні 8*h*. Це приводить до часткового впорядкування атомів i, відповідно, реалізації тернарної надструктури. Крім цього, у потрійних системах  $\{Zr,Hf\}-Al-\{Sn,Sb\}$  встановлено існування ще чотирьох тернарних сполук при відносно великому вмісті Sn чи Sb. Їхні кристалічні структури також належать до CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>. Цікавим є співіснування у системах  $Zr-Al-\{Sn,Sb\}$  двох тернарних сполук з однаковими кристалічними структурами, які при 600°C перебувають у рівновазі. На прикладі сполуки змінного складу  $Zr_5Al_{1,68-0,40}Sn_{1,32-2,60}$  показано, що часткове впорядкування атомів Al i Sn відбувається в такий спосіб: при складі  $Zr_5Al_{0,40}Sn_{2,60}$  ПСТ 8*h* зайнята виключно атомами Sn, тоді як ПСТ 4*a* – статистичною сумішшю атомів Al i Sn, а при складі  $Zr_5Al_{1,68}Sn_{1,32}$  – обидва положення зайняті статистичними сумішами в різних співвідношеннях: 8*h* – 43 % Al / 57 % Sn, 4*a* – 83 % Al / 17 % Sn. Крім того, можна вважати, що тип структури змінюється в межах області гомогенності сполуки від CT W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> при складі Zr<sub>5</sub>Al<sub>1,68</sub>Sn<sub>1,32</sub> до CT Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub> при складі Zr<sub>5</sub>Al<sub>0,40</sub>Sn<sub>2,60</sub>.

Кристалохімічний аналіз цих структур здійснено на прикладі структури тернарного алюмогерманіду  $Zr_5Al_{2,70}Ge_{0,30}$  [149]. Її можна описати як укладку двох типів моноатомних шарів: **A** і **A**` при z = 0 і z = 1/2, **Б** при z = 1/4 і z = 3/4, які чергуються вздовж кристалографічного напряму [001] з послідовністю **AБA`Б** (рис. 4.13). Шари **A** та **A**` є ідентичними, однак шар **A**` зміщена у площині (001) відносно сітки **A** (площина ковзного відбиття *n*). Атоми Zr та статистичної суміші атомів Zr і Al у шарі **A** утворюють плоску сітку з трикутників, квадратів і гексагонів (символ сітки:  $3^2$ .4.3.6 для вузла Zr,  $3^3$ .6 для вузла *M*). Шар **Б** утворений атомами Zr і Al, що чергуються вздовж кристалографічних напрямів [100] і [010], формуючи плоску сітку з квадратів (символ сітки:  $4^4$  вузлів Zr і Al). Атоми шарів **A** та **A**` утворюють тетрагональні антипризми Zr<sub>8</sub>, у центрах яких знаходяться атоми Al з шару **Б** і гексагональні антипризми  $M_4Zr_8$ , у центрах яких знаходяться атоми Zr з шару **Б**.



Рис. 4.13. Проекції структури сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> вздовж кристалографічного напряму [010] (*a*) і моноатомних шарів **A** (б) та **Б** (в) вздовж кристалографічного напряму [001].

Віднімаючи від гексагональних антипризм <u>Zr</u> $M_4$ Zr<sub>8</sub> атоми Zr можна виділити тетраедри з атомів статистичної суміші M, у центрах яких знаходяться атоми Zr. Таким чином структура сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> побудована з двох типів ізольованих колон, що простягаються нескінченно вздовж кристалографічного напряму [001] (рис. 4.14). Колони побудовано з центрованих тетрагональних антипризм <u>Al</u>Zr<sub>8</sub> (атоми Zr з ПСТ 16*k*) та тетраедрів <u>Zr</u> $M_4$  (атоми Zr з ПСТ 4*b*). Тетрагональні антипризми з'єднані між собою квадратними гранями, тоді як тетраедри – ребрами.



Рис. 4.14. Укладка тетрагональних антипризм <u>Al</u>Zr<sub>8</sub> і тетраедрів <u>Zr</u>M<sub>4</sub> у структурі сполуки Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> вздовж кристалографічного напряму [001].

Таким чином, структури тернарних сполук систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} належать виключно до гексагональної та тетрагональної сингоній. Атоми *p*-елементів характеризуються шістьма типами координаційних многогранників:

- кубооктаедрами,
- тетраедрами,
- тригональними призмами,
- тригональними антипризмами (октаедрами),
- тетрагональними антипризмами,
- ікосаедрами.

Кубооктаедри формуються в структурах сполук із вмістом 25 ат.% Zr(Hf), тетраедри (gyrobifastigium) – 33,3 ат.% Zr(Hf), тригональні призми – 33,3 і 52,4 ат.% Zr(Hf), октаедри – 55,5 ат.% Zr(Hf), тетрагональні антипризми – 52,4 і 62,5 ат.% Zr(Hf). ікосаедри – 62,5 ат.% Zr(Hf), Залежно від співвідношення компонентів у системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} можна цілеспрямовано змінювати координаційне оточення атомів і вимірність будови структури від 3D (кубічні найщільніші упаковки) до 1D (структури з ізольованими колонами многогранників). Керування анізотропією кристалічної структури має визначальний вплив на оптимізацію фізичних властивостей.

#### ВИСНОВКИ

Методами рентгенівської дифракції (порошку та монокристалу), скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії вперше визначено фазові рівноваги та параметри кристалічних структур сполук у потрійних системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С.

1. Побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Zr,Hf}–Al– {Si,Ge,Sn,Sb} при 600°С у повних концентраційних інтервалах. Встановлено існування 29 тернарних сполук, 22 з яких – відкриті вперше. Кристалічні структури синтезованих сполук належать до семи структурних типів, два з яких є новими: ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> (символ Пірсона *tI*32, просторова група *I*4<sub>1</sub>/*amd*, a = 3,8013(2), c =29,893(3) Å) і Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub> (*tI*84, *I*4/*mmm*, a = 10,3679(9), c = 14,8529(18) Å). Системи {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} подібні попарно. У системах з Ge утворюється більша кількість тернарних сполук (9) у порівнянні з системами з Si (5), а у системах зі Sb – більше тернарних сполук (9), порівняно з системами зi Sn (6).

2. У системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge} бінарні силіциди і германіди розчиняють Al з утворенням твердих розчинів заміщення; розчинність Al (ат.%) становить у: Zr<sub>2</sub>Si – 9, Zr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> – 15, Zr<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> – 7,5, Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> – 6, ZrSi – 9,5, ZrSi<sub>2</sub> – 12, ZrGe<sub>2</sub> – 4, Zr<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> – 10, Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> – 13,5, Hf<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> – 7, Hf<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> – 5,5, HfSi – 2,5, HfSi<sub>2</sub> – 8, HfGe<sub>2</sub> – 9, Hf<sub>3</sub>Ge<sub>2</sub> – 2,5, Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> – 5. Більшість бінарних алюмінідів Zr i Hf не розчиняють третій компонент. У системах Hf–Al–{Si,Ge} існують неперервні ряди твердих розчинів Hf<sub>2</sub>Al–Hf<sub>2</sub>Si i Hf<sub>2</sub>Al–Hf<sub>2</sub>Ge (структурний тип CuAl<sub>2</sub>, *tl*12, *l*4/*mcm*). Спільним для систем {Zr,Hf}– Al–{Si,Ge} є існування тернарних сполук на ізоконцентратах 25 ат.% Zr(Hf) зі структурою типу TiAl<sub>3</sub> (*tl*8, *l*4/*mmm*). У системах Zr–Al–{Si,Ge} також існують дві пари ізоструктурних тернарних сполук: ZrAl<sub>0,33</sub>Si<sub>1,67</sub> i ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub> (тип ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>) та Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,44</sub>Si<sub>0,56</sub> i Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> (Mb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>, *tl*32, *l*4/*mcm*). У системах {*T*,Hf}–Al–{Si,Ge} – Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,54</sub>Si<sub>0,46</sub> i Hf<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub> (Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, *h*P16, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*). У системах {*Z*r,Hf}–Al–Ge утворюються ще дві пари ізоструктурних сполук: Zr<sub>1</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub> i Hf<sub>11</sub>Al<sub>3,50</sub>Ge<sub>6,50</sub> (тип Zr<sub>11</sub>Al<sub>3,34</sub>Ge<sub>6,66</sub>) та Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> i Hf<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub> (Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>, *h*P18, *P*6<sub>3</sub>/*mcm*). Тернарні сполуки систем {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge} характеризуються точковими складами.

3. У системах {Zr,Hf}-Al-{Sn,Sb} обмежені тверді розчини заміщенння утворюються на основі бінарних сполук Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> (11,1 ат.% Al), Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> (2,5 ат.% Al), Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub> (11,1 at.% Al), Zr<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> (2,5 at.% Al) i Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> (3 at.% Al). Ha ochobi Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub> утворюється твердий розчин включення протяжністю до 11,1 ат.% Al. Інші бінарні сполуки не розчиняють третій компонент. Спільним для систем {Zr,Hf}-Al-{Sn,Sb} є існування тернарних сполук постійного складу на ізоконцентратах 25 ат.% Zr(Hf) зі структурою типу UCuAl<sub>2</sub> (tI8, I4/mmm) і сполук змінного складу на ізоконцентратах 62,5 ат.% Zr(Hf) зі структурою типу Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>. Крім того, у системах  $Zr-Al-{Sn,Sb}$ існують ізоструктурні сполуки  $Zr_5Al_{2.71}Sn_{0.29}$  i  $Zr_5Al_{2.55}Sb_{0.45}$  (Nb<sub>5</sub>SiSn<sub>2</sub>), a y системах Hf–Al–{Sn,Sb} – Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.70</sub>Sn<sub>0.30</sub> i Hf<sub>5</sub>Al<sub>2.49</sub>Sb<sub>0.51</sub> (Mn<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>). У системах {Zr,Hf}-Al-Sb утворюються ізоструктурні тернарні сполуки  $Zr_2AlSb_3$  i Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub> (тип Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub>, *tP*6, *P*-4*m*2). У всіх системах {Zr,Hf}-Al-{Sn,Sb} реалізується структурний тип Hf<sub>5</sub>CuSn<sub>3</sub>: для тернарної сполуки Hf<sub>5</sub>AlSb<sub>3</sub>, для граничних складів твердих розчинів заміщення на основі Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> і Zr<sub>5</sub>Sb<sub>4</sub> і для граничного складу твердого розчину включення на основі Hf<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub>.

4. Структурні типи, що реалізуються у системах {Zr,Hf}–Al–{Si,Ge,Sn,Sb} на ізоконцентратах 25 ат.% Zr(Hf) належать до кубічних найщільніших упаковок атомів. Розрахована компактність структур для бінарних і тернарних сполук є більшою, ніж компактність структури Al; найбільше значення компактності (79,5 %) має ZrAl<sub>2,65</sub>Sb<sub>0,35</sub>.

5. Новий структурний тип  $ZrAl_{0,23}Ge_{1,77}$  характеризується частковим впорядкуванням атомів Al і Ge, а також позиційним невпорядкуванням атомів Ge. Він належить серії лінійних неоднорідних структур, побудованих зрощенням фрагментів структурних типів AlB<sub>2</sub> та CaF<sub>2</sub>. Новий тип  $Zr_{11}Al_{3,34}Ge_{6,66}$  є тетрарним варіантом структурного типу Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub>, і також характеризується частковим впорядкуванням атомів Al і Ge. Структура побудована укладкою тригональних призм і тетрагональних антипризм, центрованих атомами *p*-елементів. 6. Збільшення вмісту Zr чи Hf у сполуках (зменшення вмісту *p*-елементів) змінює координаційне оточення атомів *p*-елементів: від кубооктаедричного (25 ат.% Zr(Hf)) до тетраедричного і тригонально-призматичного (33,3 ат.% Zr(Hf)), тригонально-призматичного і тетрагонально-антипризматичного (52,4 ат.% Zr(Hf)), тригонально-призматичного і октаедричного (55,5 ат.% Zr(Hf)) і тетрагонально-антипризматичного та ікосаедричного (62,5 ат.% Zr(Hf)). Залежно від співвідношення компонентів можна цілеспрямовано змінювати координаційне оточення атомів і вимірність будови структури від тривимірної (кубічні найщільніші упаковки) до одновимірної (структури з ізольованими колонами многогранників).

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ASM Alloy Phase Diagram Database (Release 2006/2022); Villars, P.; Okamoto, H.; Savysyuk, I.; Cenzual. K., Eds. ASM International: Materials Park (Ohio), 2022.
- Pauling File. Binaries Edition; Villars, P.; Cenzual, K.; Daams, J. L. C.; Hulliger, F.; Massalski, T. B.; Okamoto, H.; Osaki, K.; Prince, A., Eds. ASM International: Materials Park (Ohio), 2002.
- Binary Alloy Phase Diagrams, 2<sup>nd</sup> edition. CD version 1.0; Massalski, T. B., Ed. ASM International: Materials Park (Ohio), 1996.
- Pearson's Crystal Data: Crystal Structure Database for Inorganic Compounds (on DVD), Release 2022/23; Villars, P.; Cenzual. K., Eds. ASM International: Materials Park (Ohio), 2023.
- Villars, P.; Cenzual, K.; Gladyshevskii, R. *Handbook of Inorganic Substances 2017*, Walter de Gruyter: Berlin, 2017, 1955 p.
- 6. Emsley, J. The Elements, 2nd ed.; Clarendon Press: Oxford, 1991; 251 p.
- Гладишевський, Р. Є.; Пукас, С. Я. Прикладна Кристалохімія. Практикум. Видання четверте, доповнене; Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка: Львів, 2022; 126 с.
- 8. Hull, A. W. Crystal structure of titanium, zirconium, cerium, thorium and osmium. *Phys. Rev.* 1921, *18*, 88–89.
- 9. Rogers, B. A.; Atkins, D. F. Zirconium-columbium diagram. *Trans. Am. Inst. Min., Metall. Pet. Eng.* 1955, 203, 1034–1041.
- Noethling, W.; Tolksdorf, S. Die kristallstruktur des hafniums. Z. Kristallogr. 1925, 62, 255–259.
- 11. Duwez, P. E. The allotropic transformation of hafnium. J. Appl. Phys. 1951, 22, 1174–1175.

- Weitzer, F.; Remschnig, K.; Schuster, J. C.; Rogl, P. Phase equilibria and structural chemistry in the ternary systems *M*–Si–N and *M*–B–N (*M* = Al, Cu, Zn, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Au,Tl, Pb, Bi). *J. Mater. Res.* 1990, *5*, 2152–2159.
- 13. Stadelmaier, H. H.; Hofer, G. Phasen mit diamant-unterstruktur in ternaren beryllium-legierungen. *Monatsh. Chem.* 1967, *98*, 45–48.
- Swanson, H. E.; Fuyat, R. K. Standard X-ray diffraction powder patterns: alpha-tin, α-Sn (cubic). *Natl. Bur. Stand. Circ. (U.S.)* 1953, *539*, *2*, 12–13.
- 15. Mark, H.; Polanyl, M. Die gitterstruktur, gleitrichtungen und gleitebenen des weissen zinns. Z. Phys. 1923, 18, 75–96.
- Barrett, C. S.; Cucka, P.; Haefner, K. The crystal structure of antimony at 4.2, 78 and 298 K. *Acta Crystallogr*. 1963, *16*, 451–453.
- Edshammar, L. E.; Andersson, S. Studies on the zirconium-aluminium and hafniumaluminium systems. *Acta Chem. Scand.* 1960, *14*, 223–224.
- Potzschke, M.; Schubert, K.; Zum aufbau einiger zu T<sup>4</sup>–B<sup>3</sup> homologer und quasihomologer systeme. II. Crystal structure of titanium titan–aluminium, zirkonium–aluminium, hafnium–aluminium, molybdan–aluminium und einige ternare systeme. Z. Metallkd. 1962, 53, 548–560.
- Nowotny, H.; Schob, O.; Benesovsky, F. Die kristallstruktur von Zr<sub>2</sub>Al und Hf<sub>2</sub>Al. *Monatsh. Chem.* 1961, *92*, 1300–1303.
- Schubert, K.; Anantharaman, T. R.; Ata, H. O. K.; Meissner, H. G.; Potzschke, M.; Rossteutscher, W.; Stolz, E. Einige strukturelle ergebnisse an metallischen phasen (6). *Naturwissenschaften* 1960, *47*, 512.
- 21. Wilson, C. G.; Sams, D.; Renouf, T. J. The crystal structure of Zr<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>. *Acta Crystallogr.* 1959, *12*, 947–948.
- 22. Boller, H.; Nowotny, H.; Wittmann, A. Die kristallstruktur einiger hafnium-haltiger Phasen. *Monatsh. Chem.* 1960, *91*, 1174–1184.
- 23. Meng, W. J.; Faber, J. Jr.; Okamoto, P. R.; Rehn, L. E.; Kestel, B. J.; Hitterman, R. L. Neutron diffraction and transmission electron microscopy study of

hydrogen-induced phase transformations in Zr<sub>3</sub>Al. J. Appl. Phys. 1990, 67, 1312–1319.

- Wilson, C. G.; Spooner, F. J. The crystal structure of Zr<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>. *Acta Crystallogr*. 1960, 13, 358–359.
- 25. Cenzual, K.; Gelato, L. M.; Penzo, M.; Parthe, E. Inorganic Structure Types with Revised Space Groups. I. *Acta Crystallogr. B* 1991, *47*, 433–439.
- 26. Nandedkar, R. V.; Delavignette, P. On the formation of a new superstructure in the zirconium–aluminium system. *Phys. Status Solidi A* 1982, *73*, K157–K160.
- 27. Wilson, C. G. The crystal structure of ZrAl<sub>2</sub>. Acta Crystallogr. 1959, 12, 660–662.
- Brauer G. Uber die kristallstruktur von TiAl<sub>3</sub>, NbAl<sub>3</sub>, TaAl<sub>3</sub> und ZrAl<sub>3</sub>. Z. Anorg. Allg. Chem. 1939, 242, 1–22.
- 29. Edshammar, L. E. The crystal structures of Hf<sub>3</sub>Al<sub>2</sub> and of Hf<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>x</sub>. *Acta Chem. Scand.* 1960, *14*, 1220.
- Edshammar, L. E. The crystal structure of HfAl. Acta Chem. Scand. 1961, 15, 403–406.
- Edshammar, L. E. The crystal structure of Hf<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>. Acta Chem. Scand. 1960, 14, 2244.
- 32. Schachner, H.; Nowotny, H.; Machenschalk, R. Zum aufbau des systems: zirkonium-silizium. *Monatsh. Chem.* 1953, *84*, 677–685.
- 33. Gokhale, A. B; Abbeschian, G. J. The Hf–Si (hafnium-silicon) system. *Bull. Alloy Phase Diagrams*, 1989, *10*, *4*, 390–393.
- Karpinskii, O. G; Evseyev, B. A. X-ray investigation of the Hf–Si system from 37 to 65 at.% Si. *Russ. Metall. (Engl. Transl.).* 1969, *3*, 128–130.
- Nowotny, H. A; Laube, E.; Kieffer, T.; Benesovsky, F. Contribution to the structure of refractory hafnium phases: HfC–UC, Hf<sub>2</sub>Si, HfSi, and Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(C.) *Monatsh. Chem.* 1958, *89*, 701–707.

- Brukl, E. Ternary phase equilibria in transition metal-B-C-S systems. Part I. Binary systems. The Zr-Si and Hf-Si systems. *Tech. Rep. AFML-TR-65-2, Air Force Materials Lab., WPAFB, OH.* 1968.
- Bewlay, B. P.; Sutliff, J. A.; Bishop, R. R. Evidence for the existence of Hf<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>.
   *Phase Equilib.* 1999, 20, 2, 109–112.
- Schubert, K.; Raman, A.; Rossteutscher, W. Einige Strukturdaten metallischer Phasen (10). *Naturwissenschaften* 1964, *51*, 506–507.
- 39. Boyko, M. O.; Muts, N. M.; Muts, I. R.; Gladyshevskii, R. E. Structure refinements of the compounds Pr<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> and Zr<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>. *Chem. Met. Alloys* 2014, *7*, 56–62.
- 40. Pfeifer, H. U.; Schubert, K. Kristallstruktur von Zr<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>. *Z. Metallkd*. 1966, *57*, 884–888.
- 41. Karpinskii, O. G.; Evseev, B. A. Crystal structure of the compound ZrSi. *Inorg. Mater.* 1965, *1*, 312–314.
- 42. Karpinskii, O. G.; Shamrai, V. F. The crystal structure of the compound ZrSi (type CrB). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Met.* 1969, *4*, 209–210.
- Naray Szabo, S.V. Die struktur des zirkoniumsilicids ZrSi<sub>2</sub>. Z. Kristallogr. 1937, 97, 223–228.
- Havinga, E. E.; Philips, N. V.; Damsma, H.; Hokkeling, P. Compounds and pseudobinary alloys with the CuAl<sub>2</sub>(C16)-type structure. I. Preparation and X-ray results. *Less-Common Met.* 1972, *27*, 169–186.
- 45. Carlson, O. N.; Armstrong, P. E.; Wilhelm, H. A. Zirconium-germanium alloy system. *Trans. Am. Soc. Met.* 1956, *48*, 843–854.
- Rossteutscher W.; Schubert, K. Strukturuntersuchungen in einigen T<sup>4...5</sup>–B<sup>4...5</sup>– systemen. Z. Metallkd. 1965, 56, 813–822.
- Parthé, E. The crystal structure of YSi and Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub>(C). *Acta. Crystallogr.* 1959, *12*, 559–560.
- 48. Nowotny, H.; Benesovsky, F.; Schob, O. A Contribution to the system hafniumgermanium. *Monatsch. Chem.* 1960, *91*, 270–275.

- 49. Gokhale, A. B.; Abbaschian, R. The Ge–Hf (germanium–hafnium) system. Bull. Alloy Phase Diagrams. 1990, 11, 3, 253–256.
- 50. Nowotny, H; Braun, H.; Benesovsky, F. On the binary systems with hafnium. *Radex Rundsch.* 1960, *6*, 367–372.
- 51. Schubert, K.; Meissner, H. G.; Raman, A.; Rossteutscher, W. Einige strukturdaten metallischer phasen (9). *Naturwissenschaften* 1964, *51*, 287.
- 52. Kotur, B. Y; The Sc-Hf-Ge phase diagram for 1070 K. Metall. 1991, 3, 211-214.
- 53. Seropegin, Y. D.; Rudometkina, M. V. Physicochemical study of hafniumvanadium-germanium alloys. *Chem. Bull.* 1999, *54*, *1*, 32–41.
- Jerlerud Perez, R.; Toffolon Masclet, C.; Joubert, J. M.; Sundman, B. The Zr–Sn binary system: New experimental results and thermodynamic assessment. *CALPHAD* 2008, *32*, 593–601.
- 55. Okamoto, H. The Hf-Sn (hafnium-tin) system. J. Phase Equilib. 1991, 12, 4, 472-474.
- Balinska, A.; Kordan, V.; Misztal, R.; Pavlyuk, V. Electrochemical and thermal insertion of lithium and magnesium into Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub>. *J. Solid State Electrochem*. 2015, 19, 2481–2499.
- 57. Kwon, Y. U.; Corbett, J. D. The zirconium–tin system, with particular attention to the Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub>-Zr<sub>5</sub>Sn<sub>4</sub> region and Zr<sub>4</sub>Sn. *Chem. Mater.* 1990, *2*, 27–33.
- Nowotny, H.; Schachner, H. Rontgenographische untersuchungen in den systemen: zirkonium–zinn und zirkonium–blei. *Monatsh. Chem.* 1953, *84*, 169–180.
- Romaka, L. P; Stadnyk, Yu. V.; Bodak, O. I. Ternary Hf–Co–Sn system. J. Alloys Compd. 2001, 317/318, 347–349.
- 60. Rieger, W.; Nowotny, H.; Benesovsky, F. Phasen mit oktaedrischen bauelementen des ubergangsmetalls. *Monatsh. Chem.* 1965, *96*, 232–241.
- 61. Schob, O.; Parthé, E. The structure of HfSn. Acta Crystallogr. 1964, 17, 452–453.
- 62. Schubert, K.; Meissner, H. G.; Pötzschke, M.; Rossteutscher, W.; Stolz, E. Einige strukturdaten metallischer phasen (7). *Naturwissenschaften*. 1962, *49*, 57.

- 63. Garcia E.; Corbett, J. D. A synthetic and structural study of the zirconium–antimony system. *J. Solid State Chem.* 1988, 73, 440–451.
- 64. Morozkin, A. V.; Sviridov, I. A.; Leonov, A. V. Phase equilibria in the Dy–Zr–Sb system at 1070 K. *J. Alloys Compd.* 2002, *335*, 139–141.
- Tkachuk, A. V.; Mar, A. Zr<sub>7</sub>Sb<sub>4</sub>: A New Binary Zirconium-Rich Antimonide. *Inorg. Chem.* 2004, 43, 4400–4405.
- 66. Boller, H.; Parthe, E. Die bildung von *D*8<sub>8</sub>-phasen zwischen 4*a*-metallen und Al, Ga, In und Sb. *Monatsh. Chem.* 1963, *94*, 225–226.
- Garcia, E.; Corbett, J. D. Chemistry of polar intermetallic compounds. Study of two Zr<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub> phases, hosts for a diverse interstitial chemistry. *Inorg. Chem.* 1988, *27*, 2353–2359.
- Kozlov, A. Y.; Pavlyuk, V. V. Solid solutions based on the M<sub>5</sub>X<sub>3</sub> binary compounds in the M–(Si,Ge)–Sb ternary systems (M = Ti, Zr, Y; X= Si, Ge, Sb). Pr. Nauk. -Wyzsza Szk. Pedagog. Czestochowa, Chem. Ochr. Srodowiska 2003, 8, 23–28.
- Garcia, E.; Corbett, J. D. Study of the crystal structures of ZrSb and β-ZrSb<sub>2</sub> and of the bonding in the two ZrSb<sub>2</sub> structures. *J. Solid State Chem.* 1988, *73*, 452–467.
- Elder, I.; Lee, C. S.; Kleinke, H. Zr<sub>11</sub>Sb<sub>18</sub>: A new binary antimonide exhibiting an unusual Sb atom network with nonclassical Sb-Sb bonding. *Inorg. Chem.* 2002, *41*, 538–545.
- 71. Eberle, D.; Schubert, K. Strukturuntersuchungen im system zirkonium-wismut und einigen quasihomologen legierungen. *Z. Metallkd.* 1968, *59*, 306–308.
- Willerström, J. O.; Rundqvist, S. Coordination and bonding in Fe<sub>3</sub>P–Ti<sub>3</sub>P–V<sub>3</sub>S– Ta<sub>3</sub>As-type compounds: the crystal structures of Hf<sub>3</sub>Sb and *h*-Ta<sub>3</sub>Ge. *J. Solid State Chem.* 1981, *39*, 128–132.
- Kleinke, H.; Felser, C. New binary antimonide Hf<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub>. Differences and similarities to the Zr antimonides. *J. Alloys Compd.* 1999, *291*, 73–79.
- 74. Haase, M. G.; Block, H.; Jeitschko, W. Preparation and crystal structures of some binary pnictides of scandium, zirconium, and hafnium: Sc<sub>5</sub>Bi<sub>3</sub>, ZrBi, α-HfBi, HfBi<sub>2</sub>,

and the compounds  $Zr_5Bi_3X_{1-x}$ , possibly stabilized by an impurity (*X*). *Z. Anorg. Allg. Chem.* 2001, *627*, 1941–1948.

- 75. Schubert, K.; Meissner, H. G.; Rossteutscher, W. Einige strukturdaten metallischer phasen (11). *Naturwissenschaften*. 1964, *51*, 507.
- 76. Assoud, A.; Kleinke, K. M.; Soheilnia, N.; Kleinke, H. *T*-shaped nets of antimony atoms in the binary antimonide Hf<sub>5</sub>Sb<sub>9</sub>. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2004, *43*, 5260–5262.
- Schubert K.; Frank, K.; Gohle, R.; Maldonado, A.; Meissner, H. G.; Raman, A.;
   Rossteutscher, W. Einige strukturdaten metallischer phasen (8).
   *Naturwissenschaften*. 1963, 50, 41.
- Kane, R. H.; Giessen, B. C.; Grant, N. J. New metastable phases in binary tin alloy systems. *Acta Metall.* 1966, *14*, 605–609.
- Vincent, R.; Exelby, D. R. Structure determination of a rhombohedral Al–Ge phase by CBED and X-ray powder diffraction. *Acta Crystallogr. A* 1995 *51*, 801–809.
- Vincent, R.; Exelby, D. R. Structure of a metastable Al–Ge phase determined from large angle CBED patterns. *Philos. Mag. B* 1993, 68, 513–528.
- Viennois, R.; Esmilaire, R.; Perriere, L.; Haidoux, A.; Alleno, E.; Beaudhuin, M. Crystal structure, stability, and physical properties of metastable electron-poor narrow-gap AlGe semiconductor. *Inorg. Chem.* 2017, *56*, 11591–11602.
- Hirano, H.; Uehara, S.; Mori, A.; Onodera, A.; Takemura, K.; Shimomura, O.; Akahama, Y.; Kawamura, H. High-pressure phase transitions in AlSb. *J. Phys. Chem. Solids* 2001, *62*, 941–949.
- Baublitz, M. Jr.; Ruoff, A. L. X-ray diffraction data from the high pressure phase of AlSb. J. Appl. Phys. 1983, 54, 2109–2110.
- 84. Goldschmidt, V. M. Untersuchungen uber bau und eigenschaften von krystallen. *Skr. Nor. Vidensk.-Akad., Kl. 1: Mat.-Naturvidensk. Kl.* 1926, *8*, 1–156.

- Perrot, P. Aluminium-silicon-titanium. Ternary Alloys. A Comprehensive Compendium of Evaluated Constitutional Data and Phase Diagrams, Petzow, G.; Effenberg, G. Eds. VCH Publishers: Weinheim, 1993, 8, 283–290.
- Liu, S.; Weitzer, F.; Schuster, J. C.; Krendelsberger, N.; Du, Y. On the reaction scheme and liquidus surface in the ternery system Al–Si–Ti. *Int. J. Mater. Res.* 2008, 99, 705-711.
- Guan, Z. Q.; Pfullmann, Th.; Oehring, M.; Bormann, R. Phase formation during ball milling and subsequent thermal decomposition of Ti–Al–Si powder blends. *J. Alloys Compd.* 1997, 252, 245–251.
- Harmelin, M.; Girgis, K.; Prince, A. Aluminium-silicon-zirconium. Ternary Alloys. A Comprehensive Compendium of Evaluated Constitutional Data and Phase Diagrams, Eds. G. Petzow, G. Effenberg. – VCH Publishers: Weinheim, 1993, 8, 354–358.
- Schob, O.; Nowotny, H.; Benesovsky, F. Strukturbestimmung an einigen phasen in den systemen Zr–Al–Si und Hf–Al–Si. *Monatsh. Chem.* 1961, *92*, 1218–1226.
- Raman, A.; Schubert, K. Über den Aufbau einiger zu TiAl<sub>3</sub> verwandter Legierungsreihen. II. Untersuchungen in einigen *T*–Al–Si- und *T*<sup>4...6</sup>–In–systemen. *Z. Metallkd.* 1965, *56*, 44–52.
- Bittner, W.; Gürth, M.; Duarte, I.; Leinenbach, C.; Effenberger, S.; Richter, W. Al–Ge–Ti: Phase equilibria and structural characterization of new ternary compounds. *Intermetallics*. 2014, 53, 157–168.
- Zhao, J. T.; Parthé, E. Aluminium substitution on specific germanium sites in HfGe<sub>2</sub> with ZrSi<sub>2</sub> type. *J. Less-Common Met.* 1990, *162*, L39–L43.
- 93. Pietzka, M. A.; Schuster, J. C. Phase equilibria of the quaternary system Ti-Al-Sn-N at 900°C. J. Alloys Compd. 1997, 247, 198–201.
- Pietzka, M. A.; Schuster, J. C. New ternary aluminides T<sub>5</sub>M<sub>2</sub>Al having W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>-type structure. J. Alloys Compd. 1995, 230, L10–L12.

- 95. Kwon, K.; Corbett, J. D. Chemistry in polar intermetallic compounds. The interstitial chemistry of zirconium-tin (Zr<sub>5</sub>Sn<sub>3</sub>). *Chem. Mater.* 1992, *4*, *6*, 1348–1355.
- Kimura, T.; Doi, H.; Hashimoto, K.; Abe, E.; Isoda, Y. Phase equilibria in the TiAlrich portion of Ti–Al–Sb system at 1373 and 1573 K. *J. Jpn. Inst. Metals.* 1997, *61*, *5*, 385–390.
- 97. Garcia, E.; Corbett, J. D. Chemistry in the polar intermetallic host Zr<sub>5</sub>Sb<sub>3</sub>. Fifteen interstitial compounds. *Inorg. Chem.* 1990, *29*, 3274–3282.
- 98. Козлов, А. Ю. Системи стибію з Зд-металами (Ті, Zr, Y) та силіцієм і германієм та деякі споріднені. Автореф. дис. ... канд. хім. наук, Львів. унів., Львів, 2004. 20 с.
- 99. Huang, W. H.; Chung, M. Y.; Lee, C. S. Syntheses, crystal structures, resistivities and electronic structures of Hf<sub>5</sub>Al<sub>3-x</sub>Sb<sub>x</sub> (x = 0.70, 1.44, 2.14). *J. Chin. Chem. Soc. (Taipei)* 2013, *60*, 942–948.
- 100. Schob, O.; Nowotny, H.; Benesovsky, F. Die dreistoffe (titan, tirkonium, hafnium)– aluminium–silizium. *Planseeber. Pulvermetall.* 1962, *10*, 65–71.
- 101. Boller, H; Parthé, E. On the possibility of forming "pseudosilicides". *Acta Crystallogr.* 1963, *16*, 830–833.
- 102. Заводяний, В. В. Кристалічна структура сплавів і характер взаємодії металів в системах {Ti,La,Ho}-Al-Ga, {Ti,Zr}-Si-Ga. : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук, Київ, 1997, 20 с.
- 103. Antonova, N. V.; Tretyachenko, L. A.; Galadzhy, O. Ph.; Velikanova, T. Ya. Isothermal section of the Ti–Si–Ga system in the Ti-rich corner at 1350°C. J. Alloys Compd. 1998, 267, 167–170.
- 104. Antonova, N. V.; Ban'kovsky, O. I.; Firstov, S. A.; Kulak, L. D.; Tretyachenko, L. A.; Velikanova, T. Ya. Structure and mechanical properties of the Ti–Si–Ga alloys in the Ti-rich corner. *J. Mater. Sci.* 1999, *34*, 3413–3416.

- 105. Tretyachenko, L. A.; Antonova, N. V.; Martsenyuk, P. S.; Velikanova, T. Ya. Phase equilibria in the Ti-rich corner of the Ti–Si–Ga system. *J. Phase Equilib.* 1999, 20, 6, 581–592.
- 106.Заводяний, В. В.; Марків, В. Я.; Бєлявіна, Н. М.; Макара, В. А. Фазові рівноваги в системі Zr–Si–Ga при 800°С. Доп. НАН України. 1997, 3, 122–126.
- 107. Tokaychuk, I.; Tokaychuk, Ya. O.; Gladyshevskii, R. E. The ternary system Hf-Ga-Si at 600 °C. *Chem. Met. Alloys* 2012, *5*, 84–89.
- 108. Возняк, І.; Токайчук, Я.; Глухий, В.; Фесслер, Т.; Гладишевський, Р. Тернарна сполука зі структурою типу CrB у системі Hf–Ga–Si. *Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.* 2011, *52*, 78–83.
- 109. Raman, A.; Schubert, K. Über den aufbau einiger zu TiAl<sub>3</sub> verwandter legierungsreihen. I. Untersuchungen in einigen T<sup>4</sup>–Zn–Al-, T<sup>4</sup>–Zn–Ga- und T<sup>4</sup>–Ga–Ge-systemen. Z. Metallkd. 1965, 56, 40–43.
- 110. Токайчук, І. В. Системи Нf-Ga-{Si,Ge,Sn,Sb}: фазові рівноваги та кристалічні структури сполук. Автореф. дис.... канд. хім. наук, Львів. унів., Львів, 2012. 20 с.
- 111. Возняк, І.; Токайчук, Я.; Демченко, П.; Гладишевський, Р. Системи Hf<sub>5</sub>Ga<sub>3</sub>-Hf<sub>5</sub>M<sub>3</sub> (M = Ge, Sn, Sb) при 600°С. Зб. наук. праць XIII Наукова конференція "Львівські хімічні читання – 2011", Львів, Україна, 28 травня – 1 червня 2011; с. H12.
- 112. Voznyak, I. V.; Tokaychuk, Y. O.; Gladyshevskii, R. E. W<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>-type compounds in the (Zr,Hf)-Ga-Sn systems. Coll. Abstr. 11th International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine, 2010, p. 135.
- 113. Voznyak, I.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. The system Hf–Ga–Sn at 600°C and the crystal structure of Hf<sub>5</sub>Ga<sub>1.24-0.52</sub>Sn<sub>1.76-2.48</sub>. *Chem. Met. Alloys.* 2011, *4* (3/4), 175–187.
- 114. Voznyak, I. V.; Tokaychuk, Ya.; Hlukhyy, V.; Fässler, T. F.; Gladyshevskii, R. Interstitial solid solution Hf<sub>5</sub>Ga<sub>x</sub>Sn<sub>3</sub> (x = 0-1). *J. Alloys Compd.* 2012, *512*, 246–251.

- 115. Tokaychuk, I.; Tokaychuk, Y. O.; Gladyshevskii, R. E. The ternary system Hf–Ga–Sb at 600 °C. *Chem. Met. Alloys* 2013, *6*, 75–80.
- 116. Voznyak, I. V.; Tokaychuk, Y. O.; Hlukhyy, V. H.; Fassler, T. F.; Gladyshevskii, R. E. Hf<sub>3</sub>Ga<sub>1.97(2)</sub>Sn<sub>1.03(2)</sub>, a ternary derivative of the ThIn type. *Chem. Met. Alloys* 2011, *4*, 166–174.
- 117. Tokaychuk, I. V.; Tokaychuk, Ya. O.; Gladyshevskii, R. E. Crystal structure of Hf<sub>2</sub>GaSb<sub>3</sub>. *Solid State Phenomena* 2012, *194*, 1–4.
- 118. Brukl, C. E.; Nowotny, H.; Benesovsky, F. Untersuchungen in den dreistoffsystemen: V–Al–Si, Nb–Al–Si, Cr–Al–Si, Mo–Al–Si bzw. Cr(Mo)–Al–Si. *Monatsh. Chem.* 1961, 92, 967–980.
- Nowotny, H.; Benesovsky, F.; Brukl, C. E. Der dreistoff: niob–aluminium–silicium. Monatsh. Chem. 1961, 92, 193–196.
- 120. Nowotny, H.; Brukl, C. E.; Benesovsky, F. Untersuchungen in den systemen tantal–aluminium–silicium und wolfram–aluminium–silicium. *Monatsh. Chem.* 1961, 92, 116–127.
- 121. Otto, G. Zur Supraleitung einiger mischsysteme von verbindungen mit *A*15-strucktur auf niobbasis. *Z. Phys.* 1968, *215*, 323–334.
- 122. Bachner, F. J.; Goodenough, J. B.; Gatos, H. C. Superconducting transition temperature and electronic structure in the pseudobinaries Nb<sub>3</sub>Al–Nb<sub>3</sub>Sn and Nb<sub>3</sub>Sn-Nb<sub>3</sub>Sb. *J. Phys. Chem. Solids* 1967, *28*, 889–895.
- 123. Muller, P. Supraleitung in quasibinaren legierungsreihen vom typ A<sub>3</sub>B–Nb<sub>3</sub>Si mit A15-struktur. Z. Metallkd. 1977, 68, 421–427.
- 124. http://matersciimc.lnu.edu.ua/equipment/x-ray-fluorescent-spectrometer/
- 125. Gladyshevskii, R. E. *Methods to Determine Crystal Structures*. *Textbook*, Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv: Lviv, 2015; 135 p.
- 126. STOE *WinXPow* (Version 2.21). STOE & CIE GmbH: Darmstadt, 2005.
- Akselrud, L.; Grin, Yu. WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4). J. Appl. Crystallogr. 2014, 47.

- 128. Pecharsky, V. K.; Zavalij, P. Y. Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Second Edition, Springer New York, 2008, 744 p.
- 129. Rietveld, H. M. A profile refinement method for nuclear and magnetic structures. *J. Appl. Crystallogr.* 1969, *2*, 65–71.
- 130. Rodriguez-Carvajal, J. Recent developments of the program *FULLPROF*. *Commission on Powder Diffraction (IUCr), Newsletter*. 2001, *26*, 12–19.
- 131. International Tables for Crystallography. Vol. C. Ed. T. Hahn, Dordrecht (The Netherlands): Kluwer, 2002.
- 132. Gelato, L. M.; Parthé, E. STRUCTURE TIDY a computer program to standardize crystal structure data. J. Appl. Crystallogr. 1987, 20, 139–143.
- 133. International Tables for Crystallography. Vol. A. Ed. T. Hahn, Dordrecht (The Netherlands): Kluwer, 2002.
- 134. Крип'якевич, П. І. Структурні типи інтерметалічних сполук. *Наука*, 1977, 290 с.
- 135. Parthé, E.; Gelato, L.; Chabot, B.; Penzo, M.; Cenzual, K.; Gladyshevskii, R. *TYPIX Standardized Data and Crystal Chemical Characterization of Inorganic Structure Types*, Springer-Verlag, Berlin, 1993.
- 136. Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. The ternary system Zr–Al–Sn: isothermal section of the phase diagram at 600°C and crystal structures of the compounds. *Chem. Met. Alloys* 2022, *15 (1/2)*, 1–7.
- 137 Maryskevych, D.; Tokaychuk, Y.; Gladyshevskii, R. Structural evolution in the systems TAl<sub>3-x</sub>Ge<sub>x</sub> (T= Zr, Hf). Solid State Phenom. 2019, 289, 71–76.
- 138. Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Structural evolution in the systems  $TAl_{3-x}Ge_x$  (T = Zr, Hf). Progr. Abstr. 21 International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Vienna, Austria, March 25–29, 2018; p. 24.
- 139. Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Кристалічна структура сполуки HfAl<sub>2,7</sub>Ge<sub>0,3</sub>. Зб. тез. допов. І Міжнародної (XI Української)

наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", м. Вінниця, Україна, 27–29 березня, 2018; с. 103.

- 140. Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Тернарні алюмогерманіди ZrAl<sub>2,5</sub>Ge<sub>0,5</sub> і HfAl<sub>2,4</sub>Ge<sub>0,6</sub>. Тези допов. Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2018", м. Харків, Україна, 23–25 квітня, 2018; с. 35–36.
- 141. Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Тернарні сполуки системи Zr–Al–Sn (600°С). Матер. VI Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи", м. Житомир, Україна, 5 жовтня, 2022; с. 87–88.
- 142. Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. The structure type ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub>. *Phys. Chem. Solid State* 2023, *24 (3)*, 448–452.
- 143. Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Аксельруд, Л.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>. Зб. наук. праць XVIII Наукової конференції "Львівські хімічні читання 2021", Львів, Україна, 31 травня 2 червня, 2021; с. НЗО.
- 144. Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of the ternary compounds HfAl<sub>2.67</sub>Sb<sub>0.33</sub> and Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>. Coll. Abstr. XV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine, September 25–27, 2023; p. 91.
- 145. Kobluyk, N. A.; Melnyk, G. A.; Romaka, L. P.; Bodak, O. I.; Fruchart, D. Crystal structure of Zr<sub>2</sub>CuSb<sub>3</sub> and related compounds. *J. Alloys Compd.* 2001, *317/318*, 284–286.
- 146. Smith, G. S.; Johnson, Q. C.; Tharp, A. G. The Crystal Structure of Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub>. Acta Crystallogr. 1967, 23, 640–644.
- 147. Maryskevych, D.; Tokaychuk; Ya., Prots, Yu.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>. *Chem. Met. Alloys* 2019, *12 (1/2)*, 39–43.

- 148. Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Prots, Yu.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of the compound Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>. Coll. Abstr. XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine, September 22–26, 2019; p. 106.
- 149. Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub>. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020, 61, 63–70.
- 150. Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,7</sub>Ge<sub>0,3</sub>. Зб. наук. праць XVII Наукової конференції "Львівські хімічні читання – 2019", м. Львів, Україна, 2–5 червня, 2019; с. НЗ9.
- 151. Maryskevych, D. T.; Tokaychuk, Ya. O.; Gladyshevskii, R. E. Crystal structure of the new ternary compound Zr<sub>5</sub>Al<sub>0.41</sub>Sn<sub>2.59</sub>. Зб. тез. допов. V Міжнародної (XV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", Вінниця, Україна, 22–24 березня, 2022; с. 51.
- 152. Zhao, J. T.; Parthé, E. Sc<sub>11</sub>Al<sub>2</sub>Ge<sub>8</sub>, a ternary substitution variant of the tetragonal Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub> type. *Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun.* 1991, 47, 4–6.
- 153. Tokaychuk Ya. The ternary system Sm–Ga–Sn: isothermal section of the phase diagram at 600°C and crystal structures of the compounds. *Chem. Met. Alloys* 2015, 8, 112–122.
- 154. Тиванчук, Ю. Б.; Міліянчук, Х. Ю.; Заремба, В. І.; Степень-Дамм, Ю.; Каличак, Я. М. Взаємодія компонентів в системах Sm-{Si, Ge}-In при 870 К. Укр. хім. журн. 2001, 67, 11, 15–18.
- 155. Kotur, B. Ya.; Bodak, O. I.; Zavodnik, V. E.; Kotur, B. Ya. The silicide  $Sc_7Cr_{4+x}Si_{10-x}$  (x = 0.8): the first representative of a superlattice structure of the Ho<sub>11</sub>Ge<sub>10</sub> type. *Crystallogr.* 1985, *30*, 521–523.

## **ДОДАТОК**

## Список публікацій та відомості про апробацію основних результатів дослідження здобувача за темою дисертаційної роботи

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

 Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Structural evolution in the systems TAl<sub>3-x</sub>Ge<sub>x</sub> (T = Zr, Hf). Solid State Phenom. 2019, 289, 71–76. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.289.71

Особистий внесок здобувача: аналіз літературних відомостей, синтез зразків, одержання масивів рентгенівських дифракційних даних, виготовлення шліфів, здійснення фазового аналізу і підготовка статті до друку.

 Maryskevych, D.; Tokaychuk; Ya., Prots, Yu.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>. *Chem. Met. Alloys* 2019, *12* (1/2), 39–43. https://doi.org/10.30970/cma12.0393

Особистий внесок здобувача: аналіз літературних відомостей, синтез зразка, пошук монокристала, уточнення кристалічної структури сполуки і підготовка статті до друку.

 Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,70</sub>Ge<sub>0,30</sub>. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020, 61, 63–70. https://doi.org/10.30970/vch.6101.063

Особистий внесок здобувача: аналіз літературних відомостей, синтез зразків, одержання масивів рентгенівських дифракційних даних, виготовлення шліфів, здійснення фазового аналізу, уточнення кристалічної структури сполуки і підготовка статті до друку.

 Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. The ternary system Zr–Al–Sn: isothermal section of the phase diagram at 600°C and crystal structures of the compounds. *Chem. Met. Alloys* 2022, *15* (1/2), 1–7. https://doi.org/10.30970/cma15.0421 Особистий внесок здобувача: аналіз літературних відомостей, синтез зразків, одержання масивів рентгенівських дифракційних даних, виготовлення шліфів, здійснення фазового аналізу, побудова ізотермічного перерізу діаграми стану, уточнення кристалічної структури сполук і підготовка статті до друку.

 Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. The structure type ZrAl<sub>0.23</sub>Ge<sub>1.77</sub>. *Phys. Chem. Solid State* 2023, *24* (3), 448–452. https://doi.org/10.15330/pcss.24.3.448-452

Особистий внесок здобувача: аналіз літературних відомостей, синтез зразка, пошук монокристала, уточнення кристалічної структури сполуки і підготовка статті до друку.

Апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо:

- 1. **Maryskevych, D.**; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Structural evolution in the systems  $TAl_{3-x}Ge_x$  (T = Zr, Hf). Progr. Abstr. 21 International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Vienna, Austria, March 25–29, 2018; p. 24 *(очна участь, стендова доповідь)*.
- Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Кристалічна структура сполуки HfAl<sub>2,7</sub>Ge<sub>0,3</sub>. Зб. тез. допов. І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", м. Вінниця, Україна, 27–29 березня, 2018; с. 103 (заочна участь).
- Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Тернарні алюмогерманіди ZrAl<sub>2,5</sub>Ge<sub>0,5</sub> і HfAl<sub>2,4</sub>Ge<sub>0,6</sub>. Тези допов. Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання – 2018", м. Харків, Україна, 23–25 квітня, 2018; с. 35–36 (заочна участь).

- Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr<sub>5</sub>Al<sub>2,7</sub>Ge<sub>0,3</sub>. Зб. наук. праць XVII Наукової конференції "Львівські хімічні читання – 2019", м. Львів, Україна, 2–5 червня, 2019; с. НЗ9 *(очна участь)*.
- Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Prots, Yu.; Akselrud, L.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of the compound Zr<sub>5</sub>AlGe<sub>3</sub>. Coll. Abstr. XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine, September 22–26, 2019; p. 106 (очна участь, стендова доповідь).
- Марискевич, Д.; Токайчук, Я.; Аксельруд, Л.; Гладишевський, Р. Кристалічна структура сполуки ZrAl<sub>0,23</sub>Ge<sub>1,77</sub>. Зб. наук. праць XVIII Наукової конференції "Львівські хімічні читання – 2021", м. Львів, Україна, 31 травня – 2 червня, 2021; с. НЗО (очна участь, стендова доповідь).
- Maryskevych, D. T.; Tokaychuk, Ya. O.; Gladyshevskii, R. E. Crystal structure of the new ternary compound Zr<sub>5</sub>Al<sub>0.41</sub>Sn<sub>2.59</sub>. Зб. тез. допов. V Міжнародної (XV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", Вінниця, Україна, 22–24 березня, 2022; с. 51 (дистанційна участь, стендова доповідь).
- Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Тернарні сполуки системи Zr–Al–Sn (600°С). Матер. VI Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи", м. Житомир, Україна, 5 жовтня, 2022; с. 87–88 (дистанційна участь, стендова доповідь).
- Maryskevych, D.; Tokaychuk, Ya.; Gladyshevskii, R. Crystal structure of the ternary compounds HfAl<sub>2.67</sub>Sb<sub>0.33</sub> and Hf<sub>2</sub>AlSb<sub>3</sub>. Coll. Abstr. XV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine, September 25–27, 2023; p. 91 (дистанційна участь, стендова доповідь).
- 10. **Марискевич,** Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Кристалічна структура тернарних сполук системи Zr–Al–Ge. Звітна наукова конференція співробітників Університету за 2019 рік (*очна участь, усна доповідь*).
- 11. Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Фазові рівноваги та кристалічна структура тернарних сполук у системі Zr–Al–Ge за 600°С.

Звітна наукова конференція співробітників Університету за 2020 рік (дистанційна участь, усна доповідь).

- Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Система Zr–Al–Sn за 600°С. Звітна наукова конференція співробітників Університету за 2021 рік (*дистанційна участь, усна доповідь*).
- 13. Марискевич, Д. Т.; Токайчук, Я. О.; Гладишевський, Р. Є. Система Hf–Al–Sb при 600°С. Звітна наукова конференція співробітників Університету за 2022 рік (очна участь, усна доповідь на пленарному засіданні).